

บรรณานุกรม

National Semiconductor, TTL DATA BOOK, Santo Clara, U.S.A., 1976

\_\_\_\_\_. CMOS Integrated Circuits, Santo Clara, U.S.A., 1975

Fairchild, TTL DATA BOOK, California, U.S.A., 1978

\_\_\_\_\_. CMOS DATA BOOK, California, U.S.A., 1977

\_\_\_\_\_. FULL LINE CONDENSED CATALOG, California, U.S.A., 1978

Signatrics, DIGITAL, LINEAR, CMOS DATA BOOK, California, U.S.A., 1974

Peter R.Rony, David G. Larsen, Jonothon A. Titus, THE 8080A BUGBOOK,

Howard W. Soms & Co., Ins, Indianapolis, Indiana, U.S.A., 1977

Intel, MCS - 80 USER'S MANUAL, Santa Clara, California, U.S.A., 1977



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

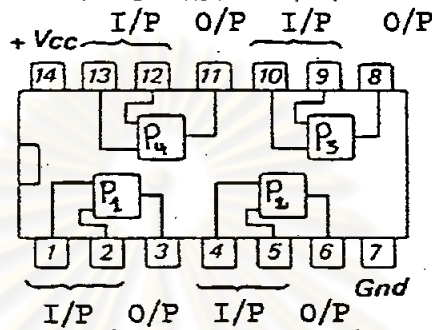


ภาคผนวก ก

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แสดงรายละเอียดและ FLOW CHART ในการทดสอบ IC ประเภทต่าง ๆ ซึ่ง  
แบ่งเป็นประเภท ๆ ดังนี้

ก. IC ประเภทที่ ๑ ใช้ SOCKET #1 (มี ๑๔ ขา  $V_{cc}$  อยู่ขา ๑๔  
และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๑



รูปที่ ก.๑ IC ประเภทที่ ๑

จากรูปที่ ก.๑ มีทั้งหมด 4 GATE ในที่นี้แบ่งเป็น ๔ ส่วน (PART)

ได้แก่  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$  และ  $P_4$

- $P_1$  มีขา ๑ และ ๒ เป็น INPUT/ ขา ๓ เป็น OUTPUT
- $P_2$  มีขา ๔ และ ๕ เป็น INPUT/ ขา ๖ เป็น OUTPUT
- $P_3$  มีขา ๙ และ ๑๐ เป็น INPUT/ ขา ๑๑ เป็น OUTPUT
- $P_4$  มีขา ๑๒ และ ๑๓ เป็น INPUT/ขา ๑๔ เป็น OUTPUT

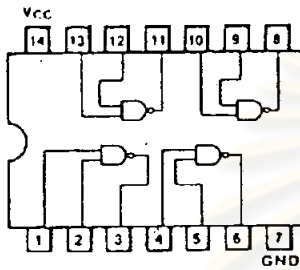
โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นโปรแกรมย่อยที่ สามารถใช้ได้กับ IC GATE  
ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน LOGIC OUTPUT TABLE  
ที่แตกต่างกันออกไปแทน ก็สามารถทดสอบ IC แต่ละชนิดได้

IC ประเภทที่ ๑ นี้ได้แก่

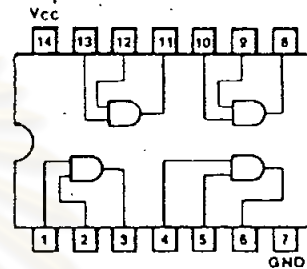
- 2 INPUT NAND GATE เช่น 7400, 7403, 7426, 7437, 7438, 74132,  
และ 74C00 เป็นต้น
- 2 INPUT AND GATE เช่น 7408, 74C09 และ 74C08
- 2 INPUT OR GATE เช่น 7432 และ 74C32
- 2 INPUT EXCLUSIVE - OR GATE เช่น 7486 และ 74C86
- TRI STATE เช่น 74125, 74126

ตัวอย่าง IC LOGIC DIAGRAM

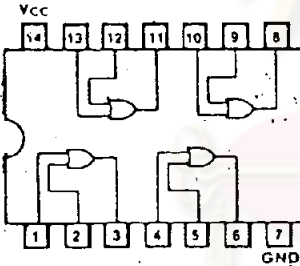
9002, 54/7400,  
54H/74H00, 54S/74S00,  
54LS/74LS00, 9012,  
54H/74H01, 54/7403,  
54S/74S03, 54LS/74LS03,  
7426, 54LS/74LS26  
54/7437, 54LS/74LS37,  
54/7438, 74LS38, 54/74132,  
54S/74S132, 74LS132



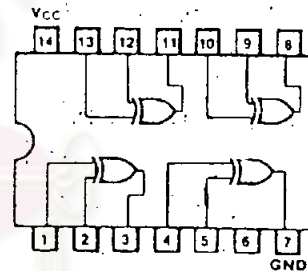
547408, 54H/74H08,  
54S/74S08, 54LS/74LS08  
54/7409, 54S/74S09,  
54LS/74LS09



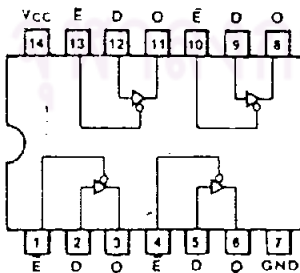
54/7432, 54S/74S32  
54LS/74LS32



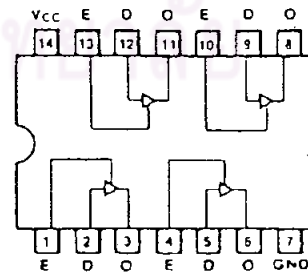
54/7486, 54S/74S86,  
54LS/74LS86, 54LS/74LS136



54/74125, 54LS/74LS125



54/74126, 54LS/74LS126



แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมเพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW

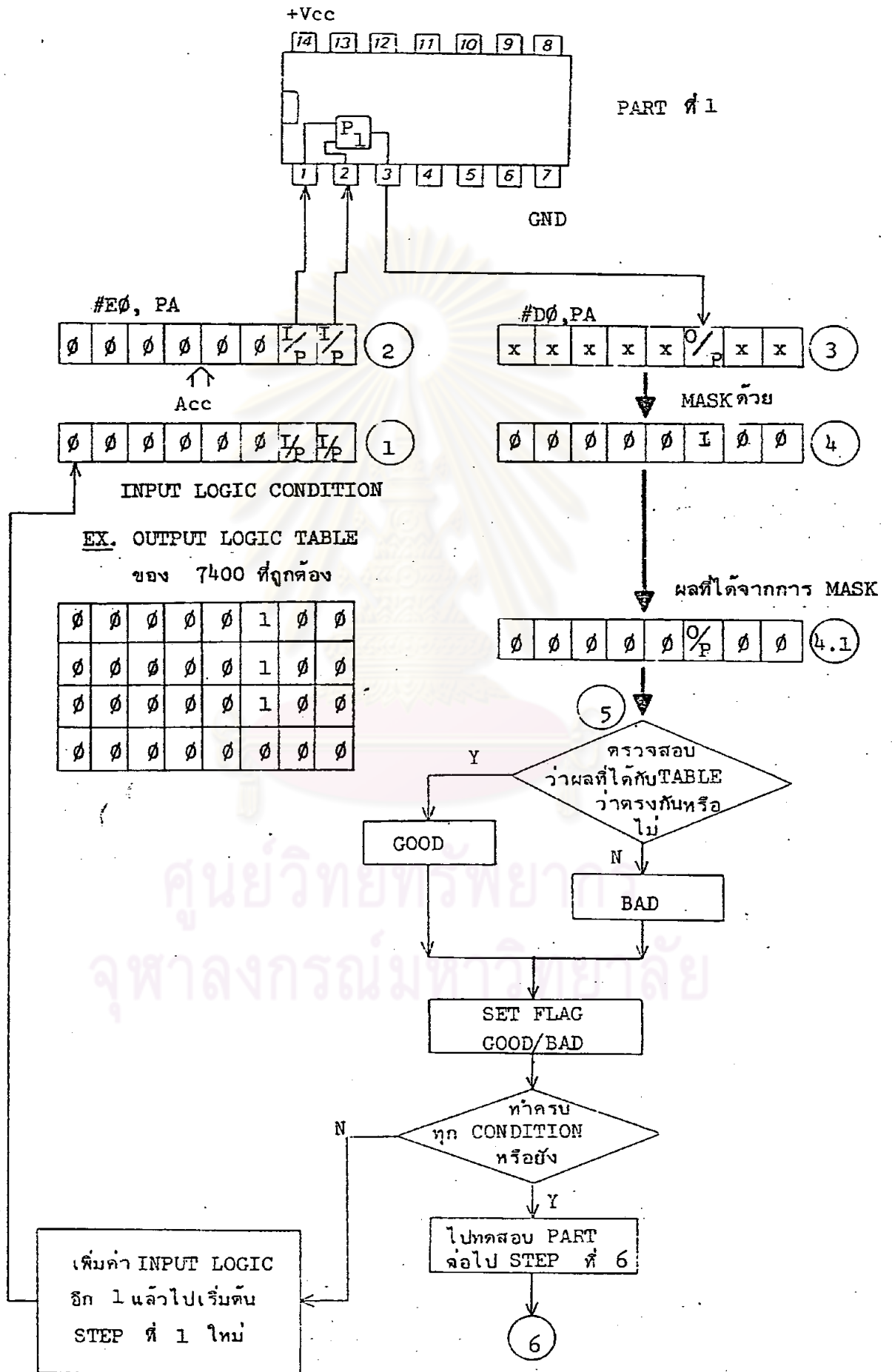
CHART ที่ ก.๑

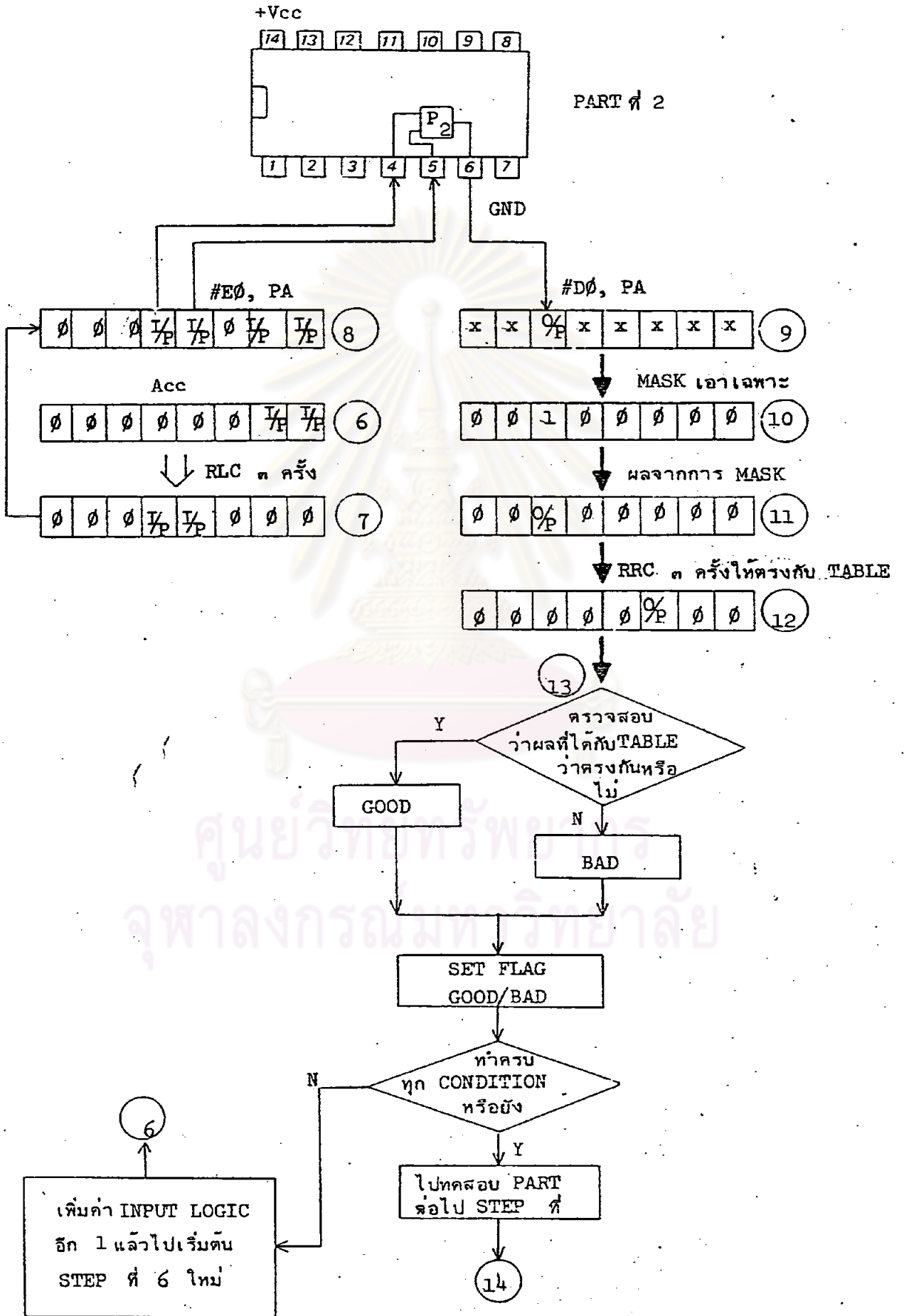
PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๑ ข้อมูลที่ SET  
ดังนี้ (จะต้อง SET ก่อนจะทดสอบ แล้วบอกผู้ใช้ว่า READY)

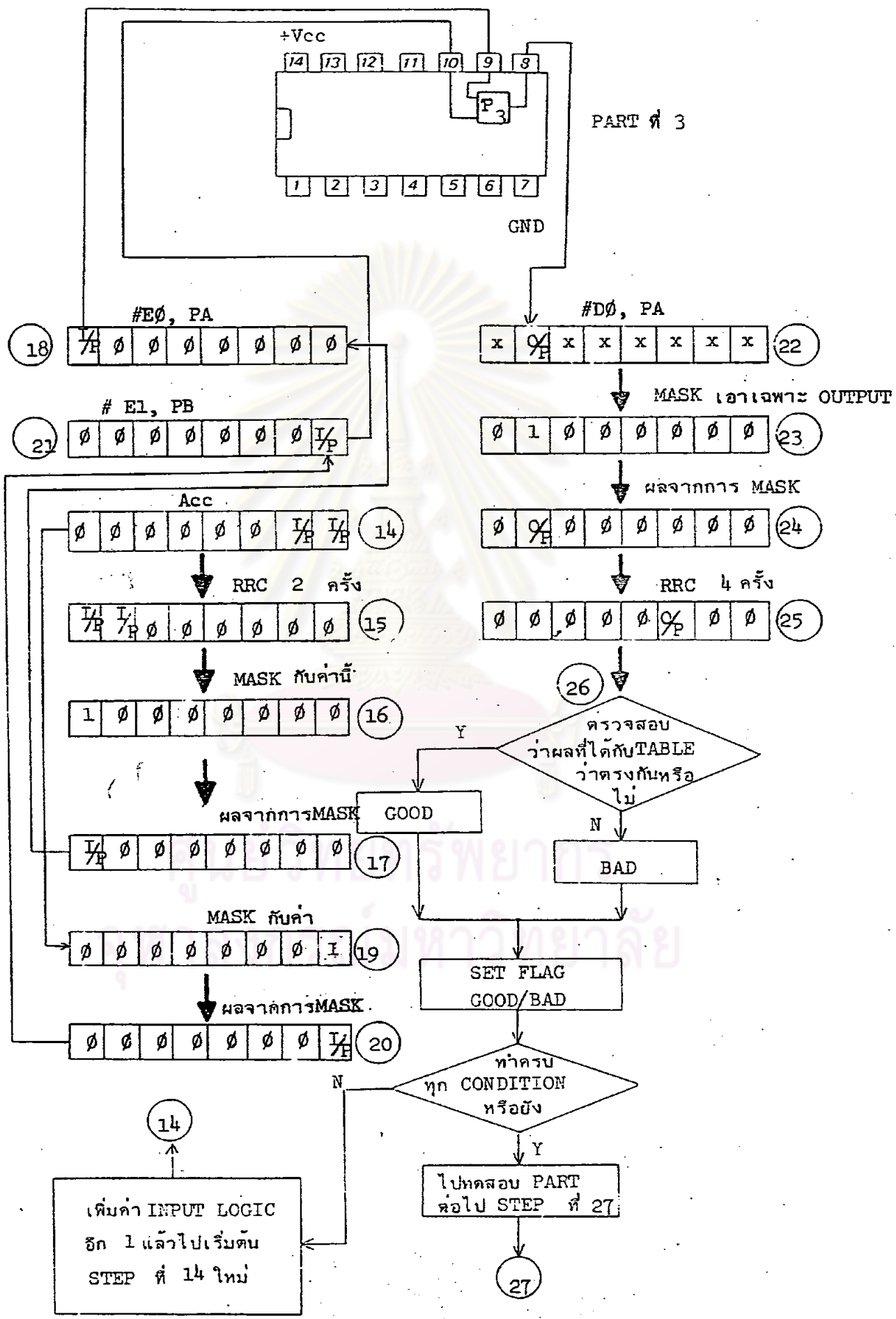
	# F1, PB	#F0, PA																	
X'02'	<table border="1"><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	0	0	0	0	0	0	1	0	<table border="1"><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	1	0	0	1	0	0	X'54'
0	0	0	0	0	0	1	0												
0	1	1	0	0	1	0	0												

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

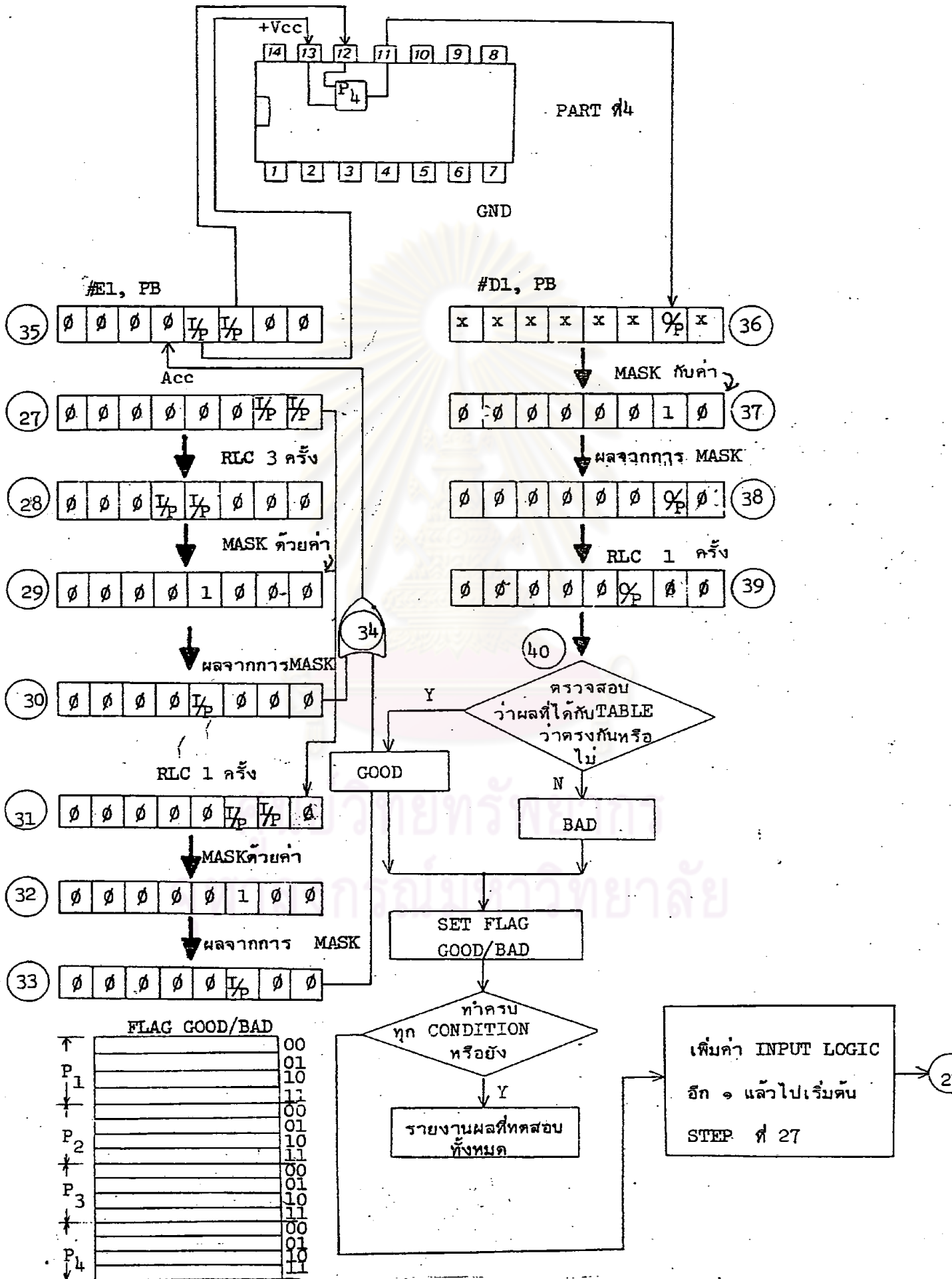
FLOW CHART ที่ ก.๑ เป็น FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ ๑



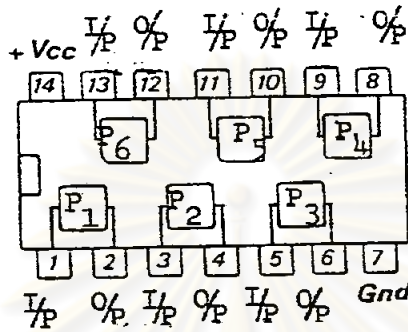








ข. IC ประเภทที่ ๒ ใช้ SOCKET #1 (มี ๑๔ ขา  $V_{cc}$  อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๒



รูปที่ ก.๒ IC ประเภทที่ ๒

จากรูปที่ ก.๒ มีทั้งหมดมี 6 GATE ในที่นี้แบ่งเป็น ๖ ส่วน (PART)

ได้แก่ P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>, P<sub>5</sub> และ P<sub>6</sub>

- P<sub>1</sub> มีขา ๑ เป็น INPUT/ ขา ๒ เป็น OUTPUT
- P<sub>2</sub> มีขา ๓ เป็น INPUT/ ขา ๔ เป็น OUTPUT
- P<sub>3</sub> มีขา ๕ เป็น INPUT/ ขา ๖ เป็น OUTPUT
- P<sub>4</sub> มีขา ๙ เป็น INPUT/ ขา ๘ เป็น OUTPUT
- P<sub>5</sub> มีขา ๑๑ เป็น INPUT/ ขา ๑๐ เป็น OUTPUT
- P<sub>6</sub> มีขา ๑๓ เป็น INPUT/ ขา ๑๒ เป็น OUTPUT

โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นโปรแกรมน้อยที่สามารถใช้ได้กับ IC GATE ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่ เปลี่ยน LOGIC OUTPUT TABLE ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้น ก็สามารถทดสอบ IC แต่ละชนิดได้

IC ประเภทที่ ๒ นี้ ได้แก่

- BUFFER เช่น 7407, 7417
- INVERTE เช่น 7404, 7414, 7416, 74C04, 74C14, 4069 และ 4004

แนวความคิดในการเขียนโปรแกรม เพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW CHART



PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๒ ข้อมูลที่ SET  
ดังนี้ (จะต้อง SET ก่อนจะทดสอบแล้วบอกผู้ใช้ว่า READY)

x'05'    

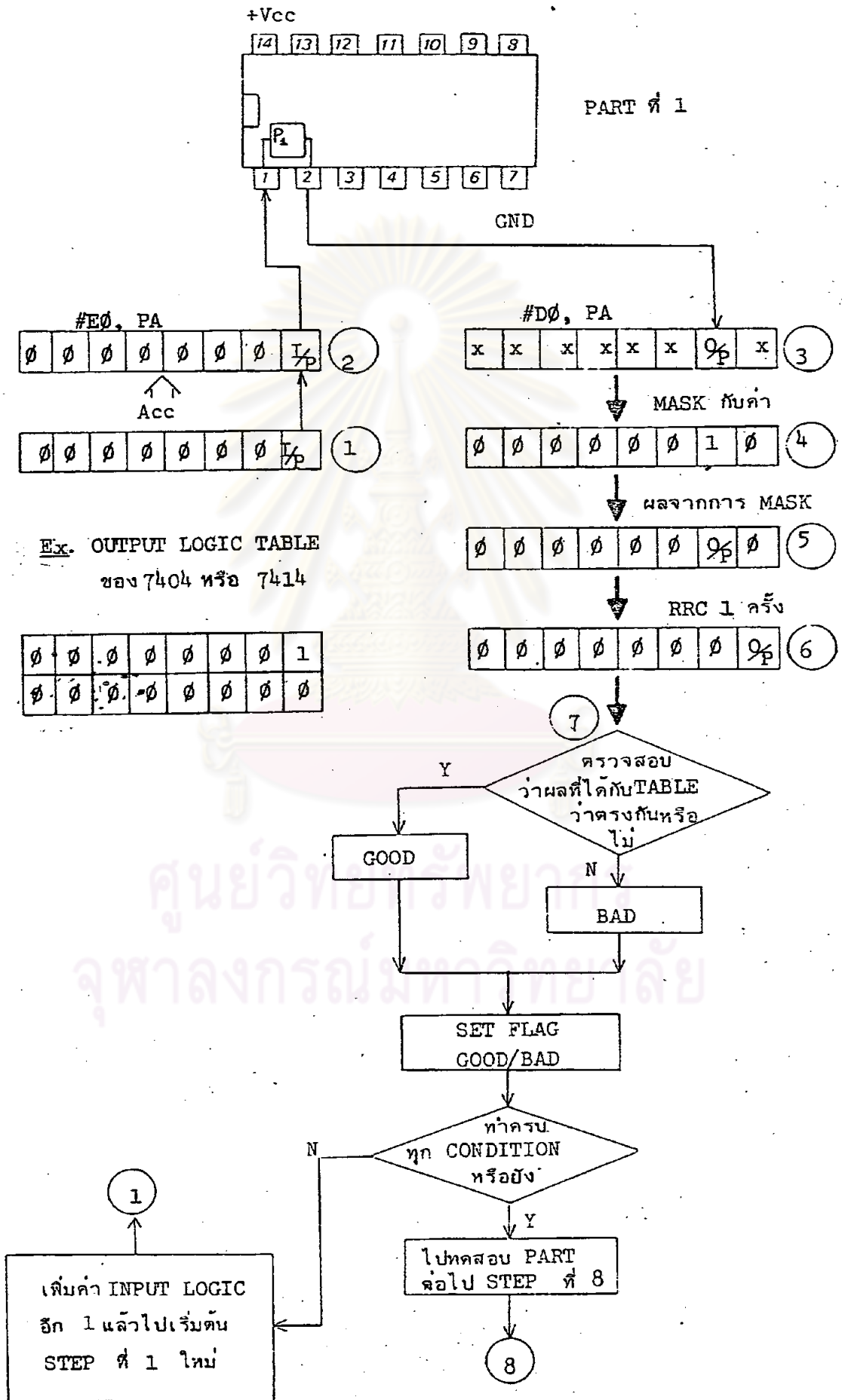
0	0	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

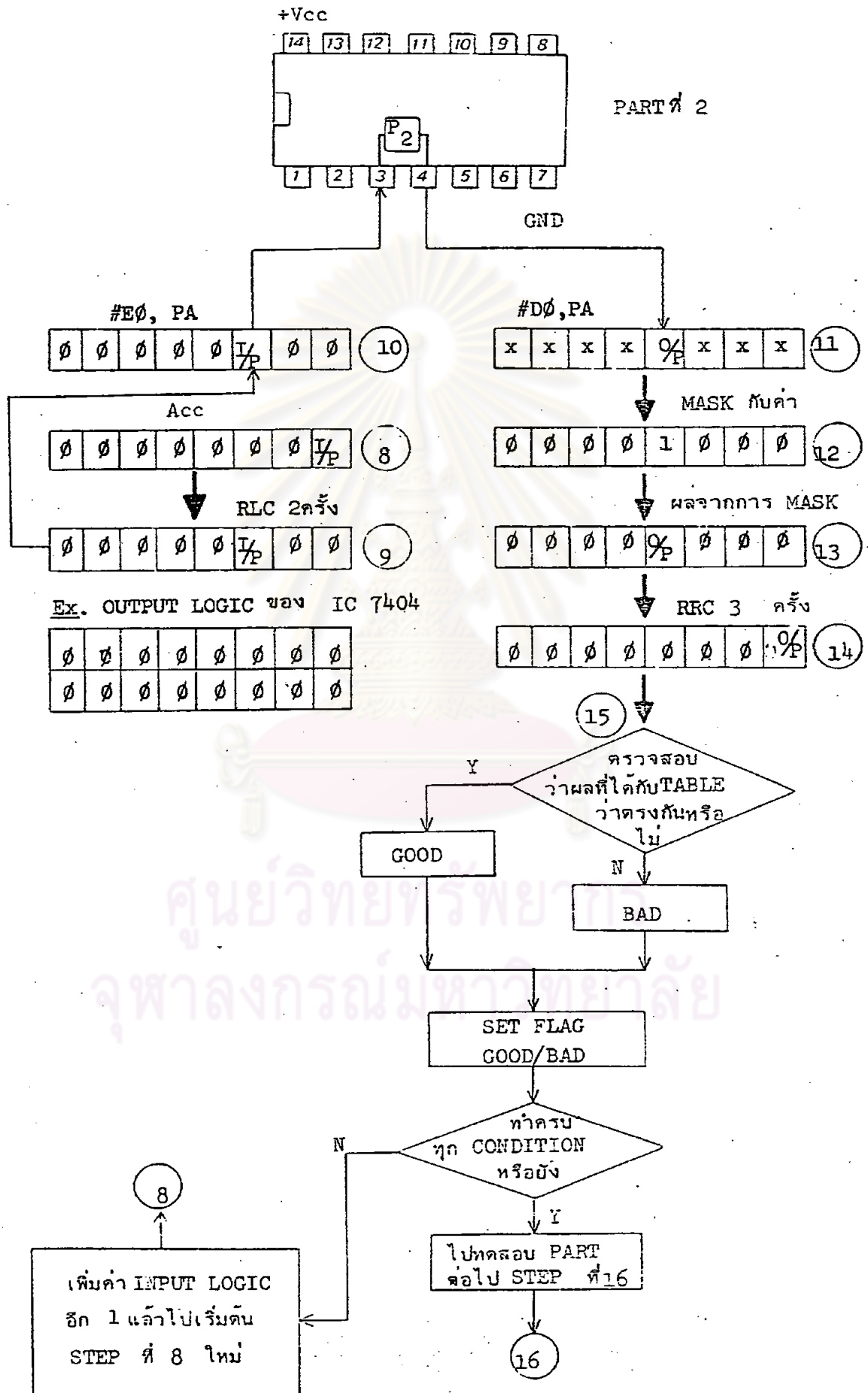
0	1	1	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

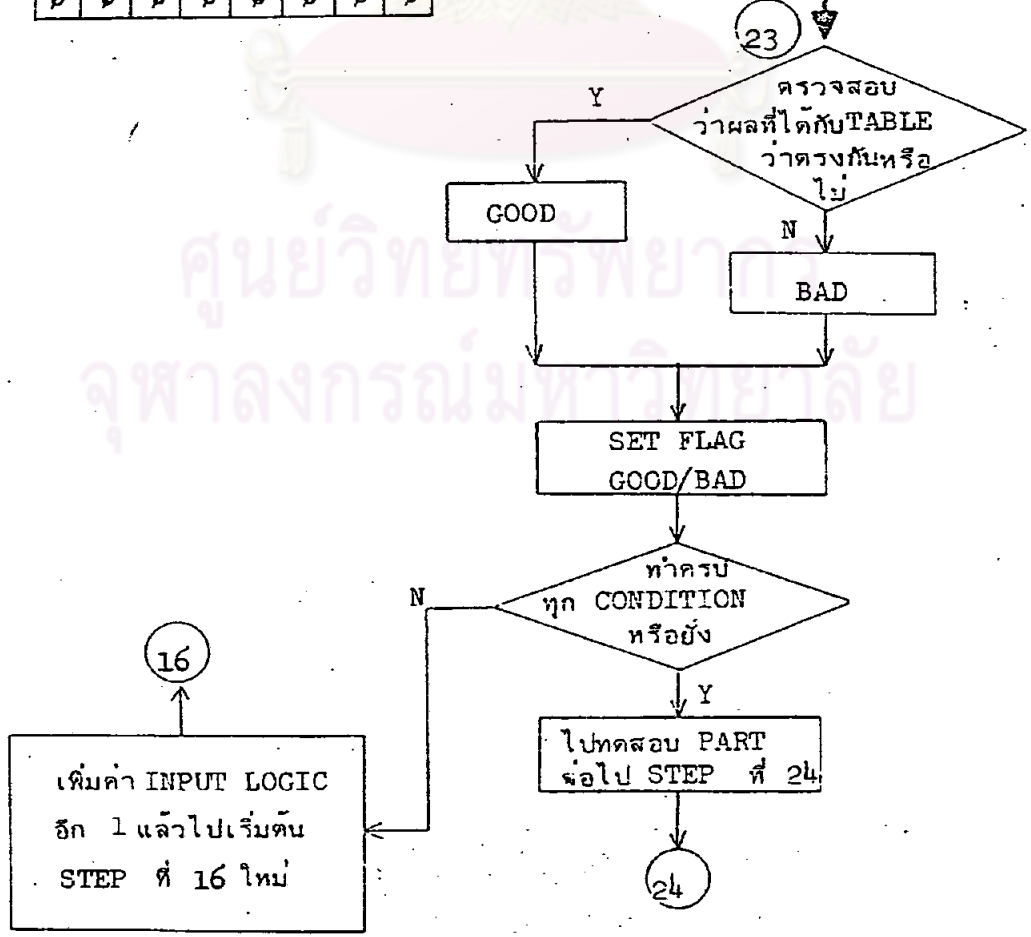
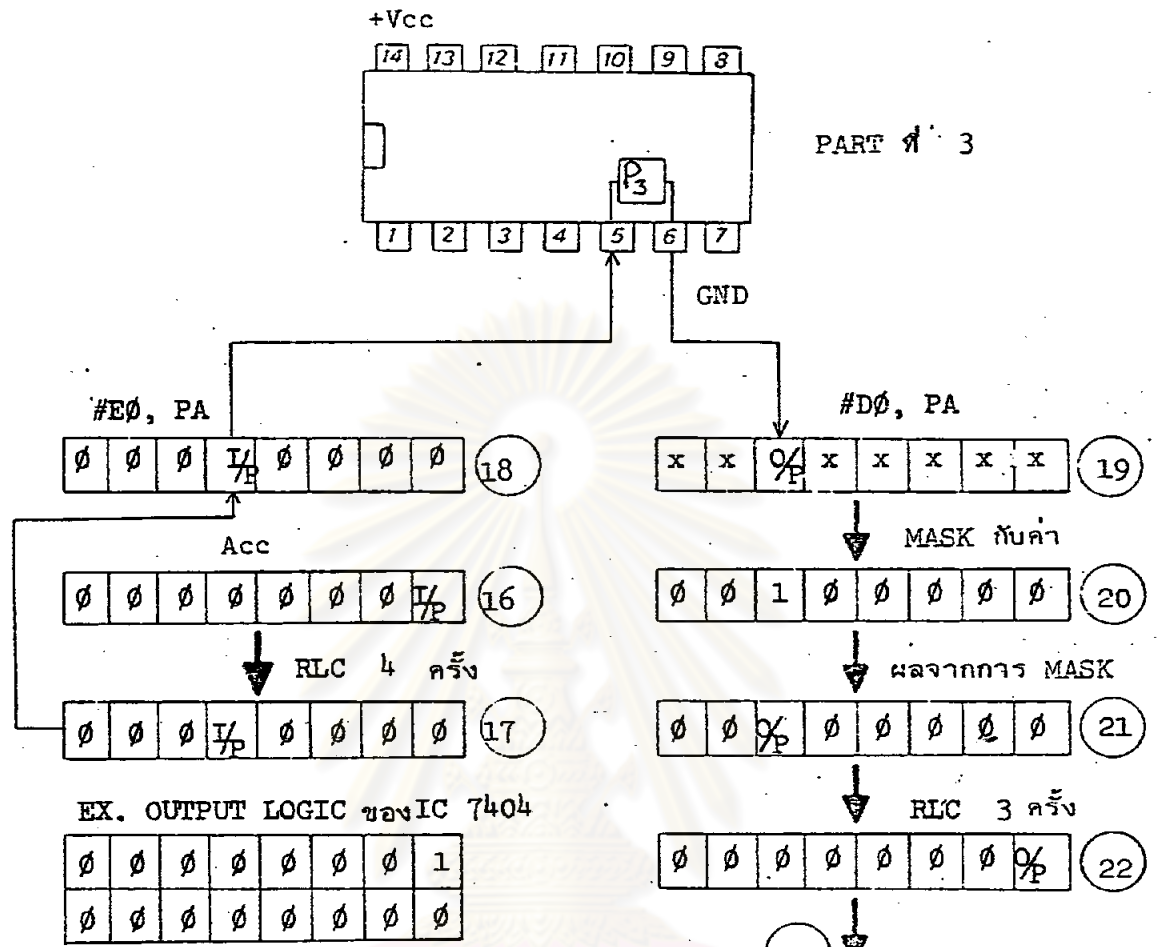
    x'6A'

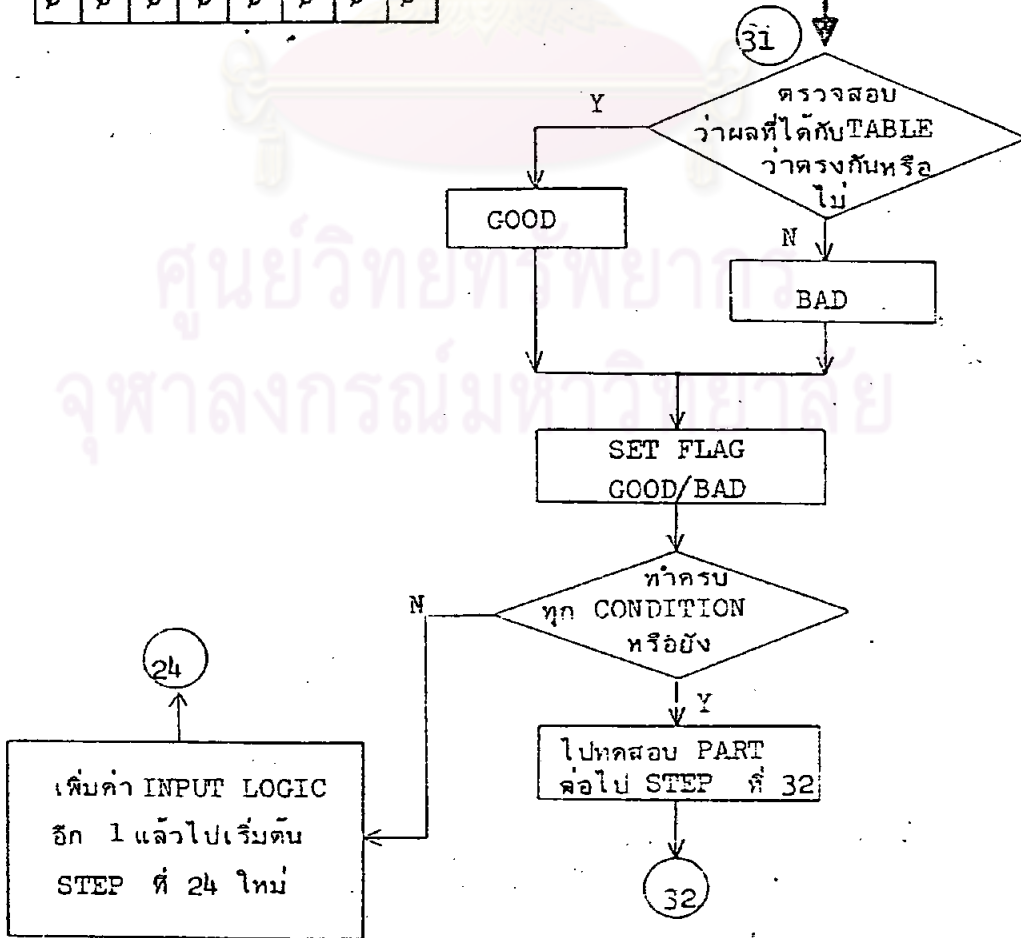
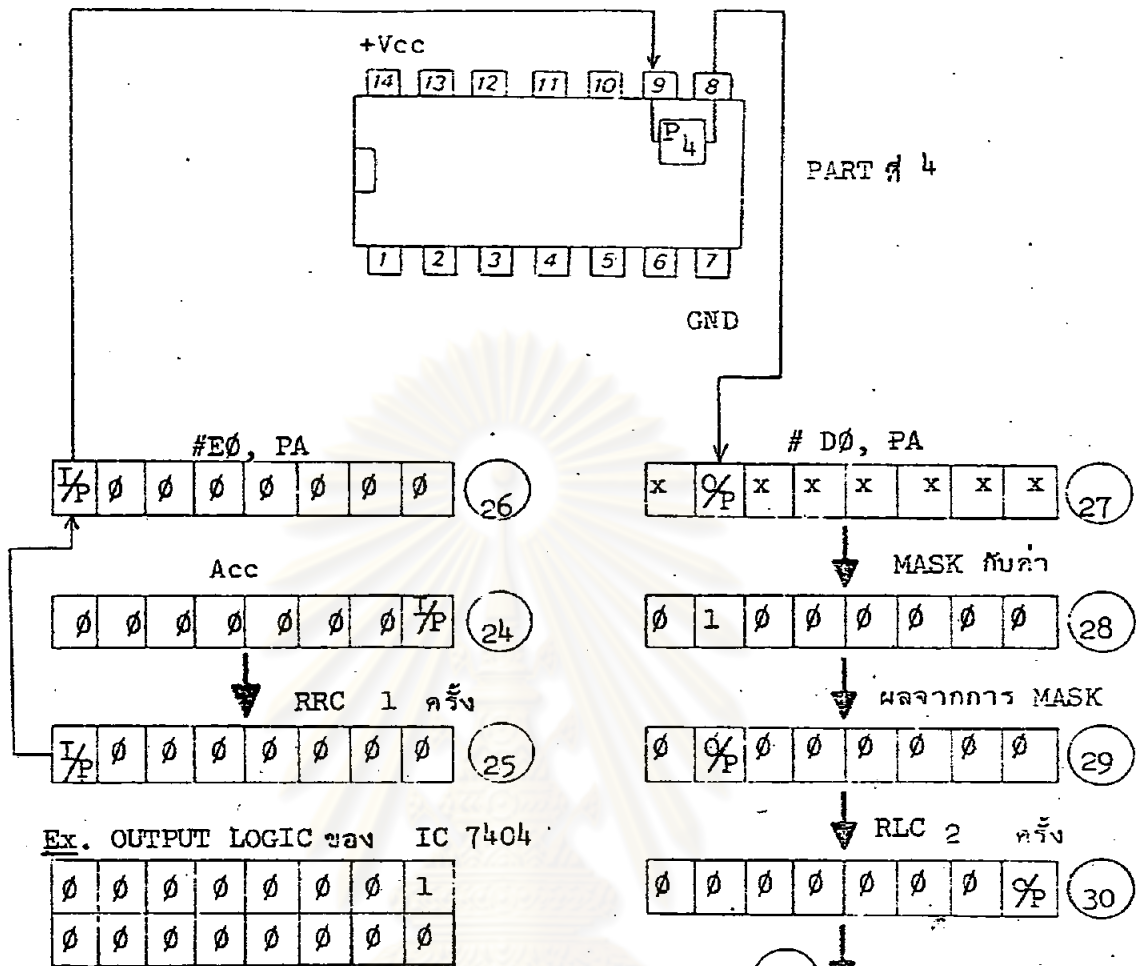
ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

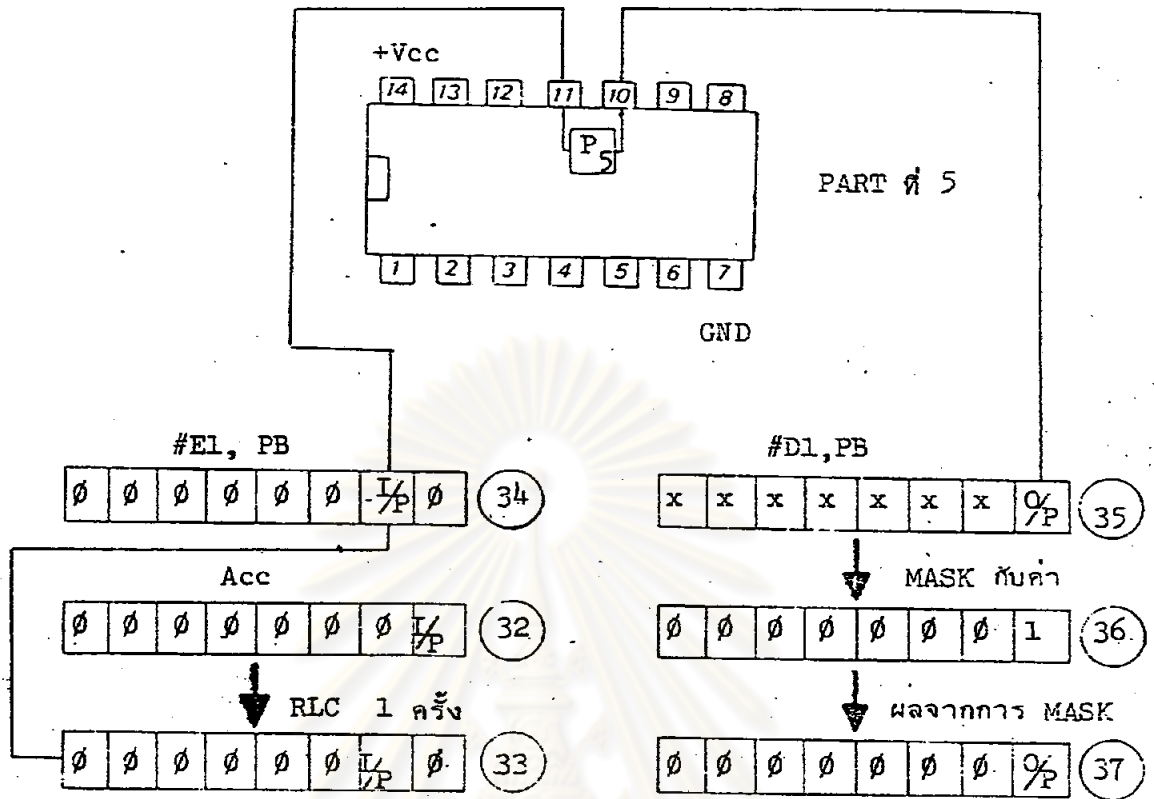
FLOW CHART ที่ ก.๒ FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภท ที่ ๒





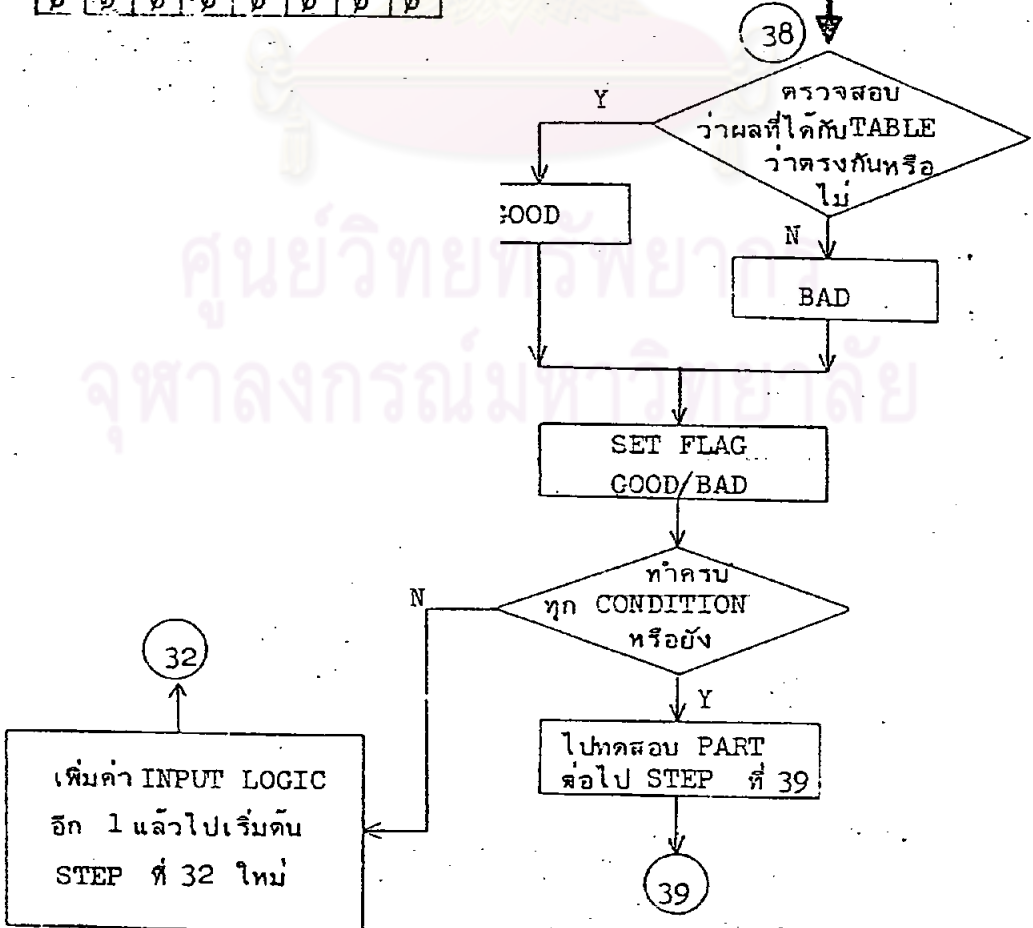




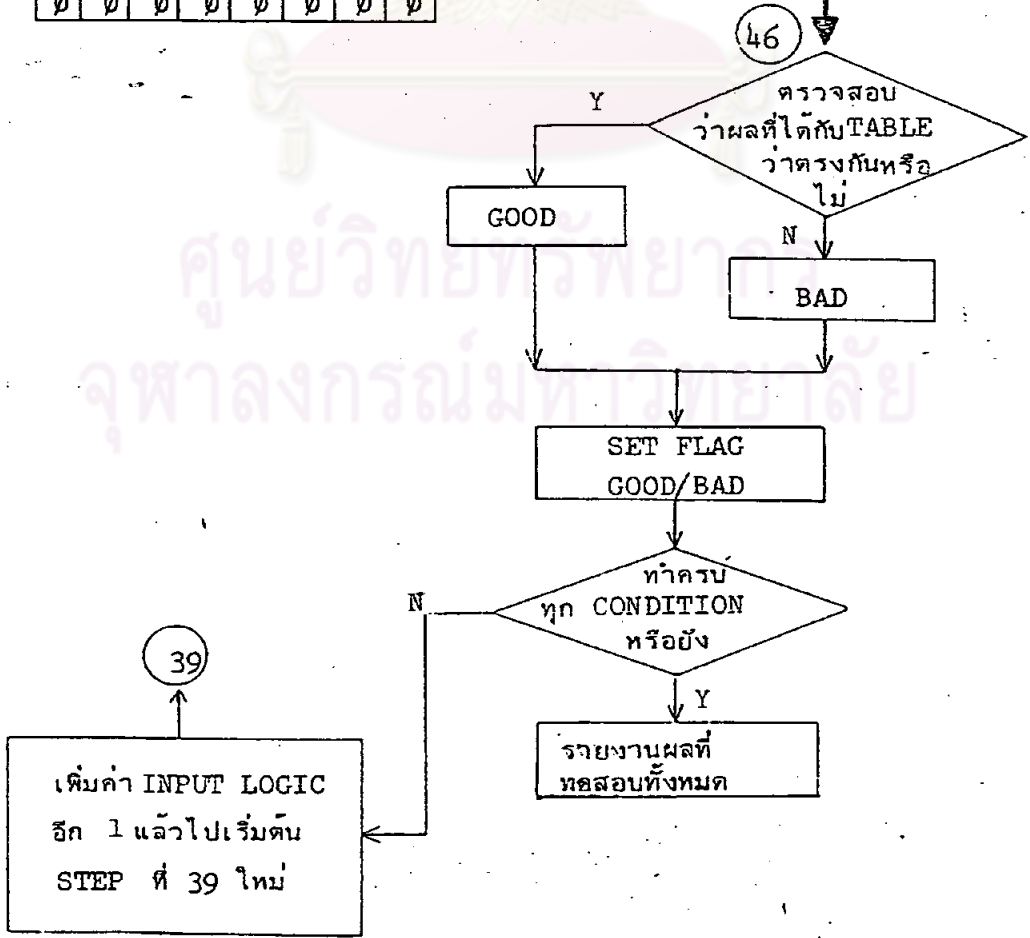
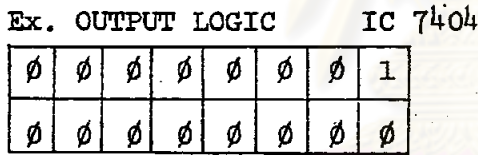
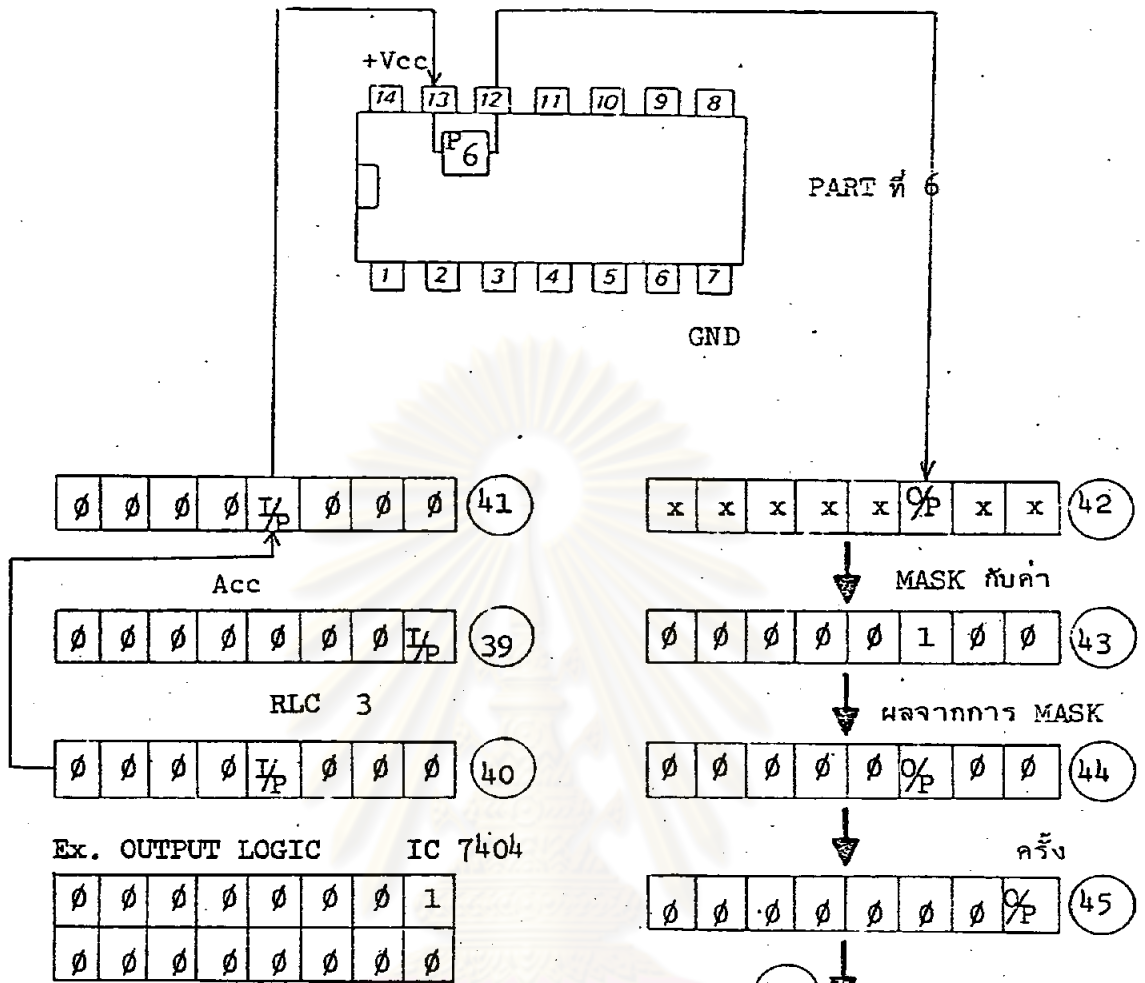


Ex. OUTPUT LOGIC ของ IC 7404

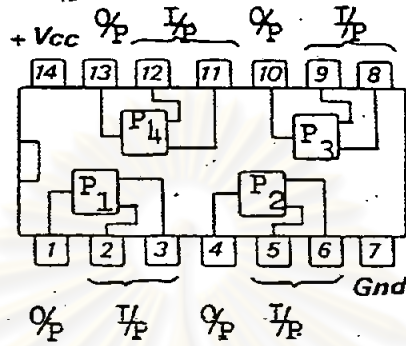
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	1
$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$







ค. IC ประเภทที่ ๓ ใช้ SOCKET #1 (มี ๑๔ ขา  $V_{CC}$  อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๓



รูปที่ ก.๓ IC ประเภทที่ ๓

จากรูป ก.๓ มีทั้งหมด 4 GATE ในที่นี้แบ่งเป็น ๔ ส่วน (PART)

ได้แก่ P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub> และ P<sub>4</sub>

- P<sub>1</sub> มีขา ๒ และ ๓ เป็น INPUT/ ขา ๑ เป็น OUTPUT
- P<sub>2</sub> มีขา ๔ และ ๖ เป็น INPUT/ ขา ๕ เป็น OUTPUT
- P<sub>3</sub> มีขา ๘ และ ๙ เป็น INPUT/ ขา ๑๐ เป็น OUTPUT
- P<sub>4</sub> มีขา ๑๑ และ ๑๒ เป็น INPUT /ขา ๑๓ เป็น OUTPUT

โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบ จะเป็นโปรแกรมย่อยที่สามารถใช้ได้กับ

IC GATE ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน LOGIC

OUTPUT TABLE ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นก็สามารถทดสอบ IC แต่ละชนิดได้

IC ประเภทที่ ๓ มีได้แก่

- 2 INPUT NAND GATE เช่น 7401
- 2 INPUT NOR GATE เช่น 7402, 7428 และ 7433

แนวความคิดในการเขียนโปรแกรม เพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW CHART

ที่ ก.๓

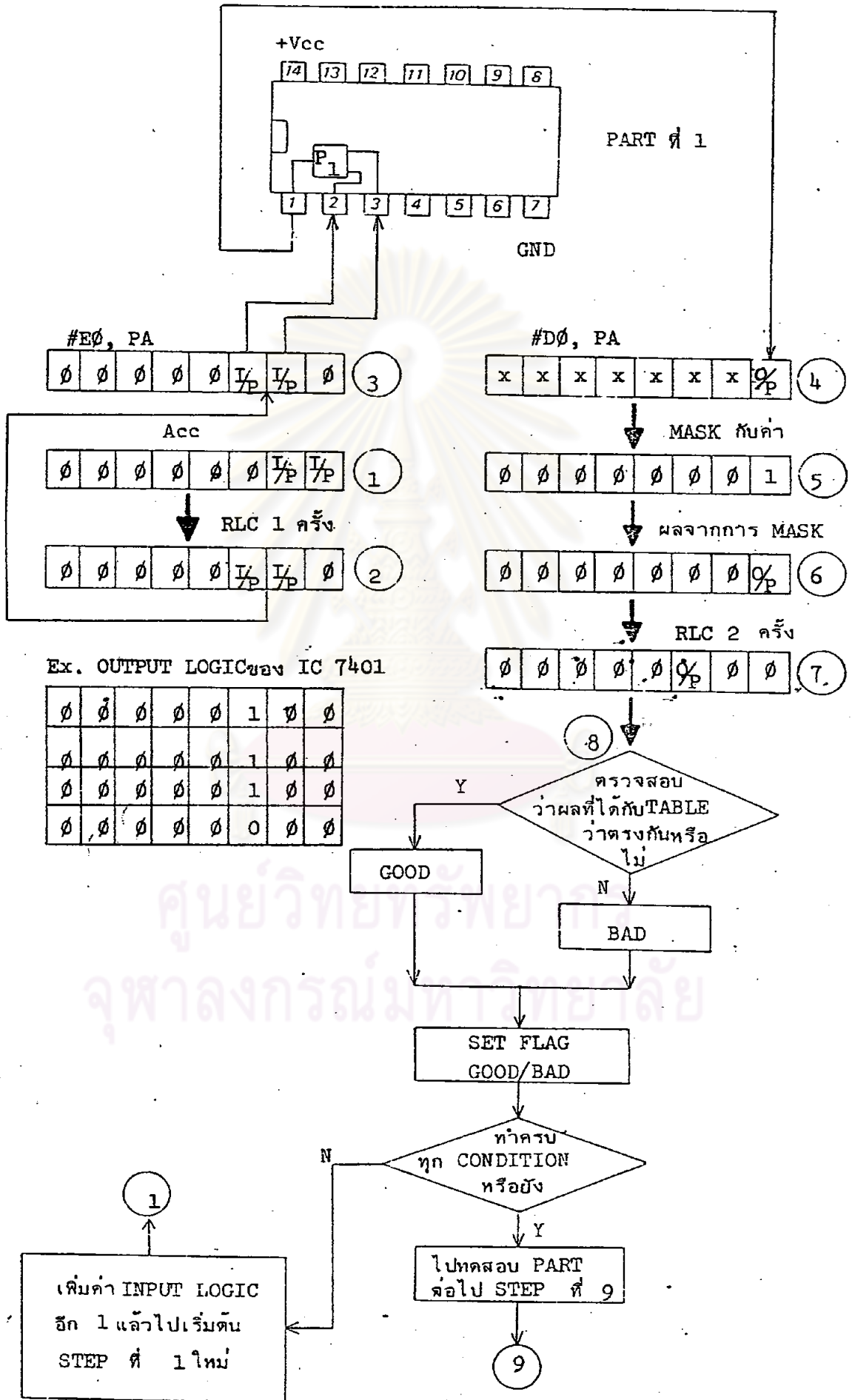
PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๓ ข้อมูลที่ SET ดังนี้  
(จะต้อง SET ก่อนจะทดสอบแล้วบอกผู้ใช้ว่า READY)

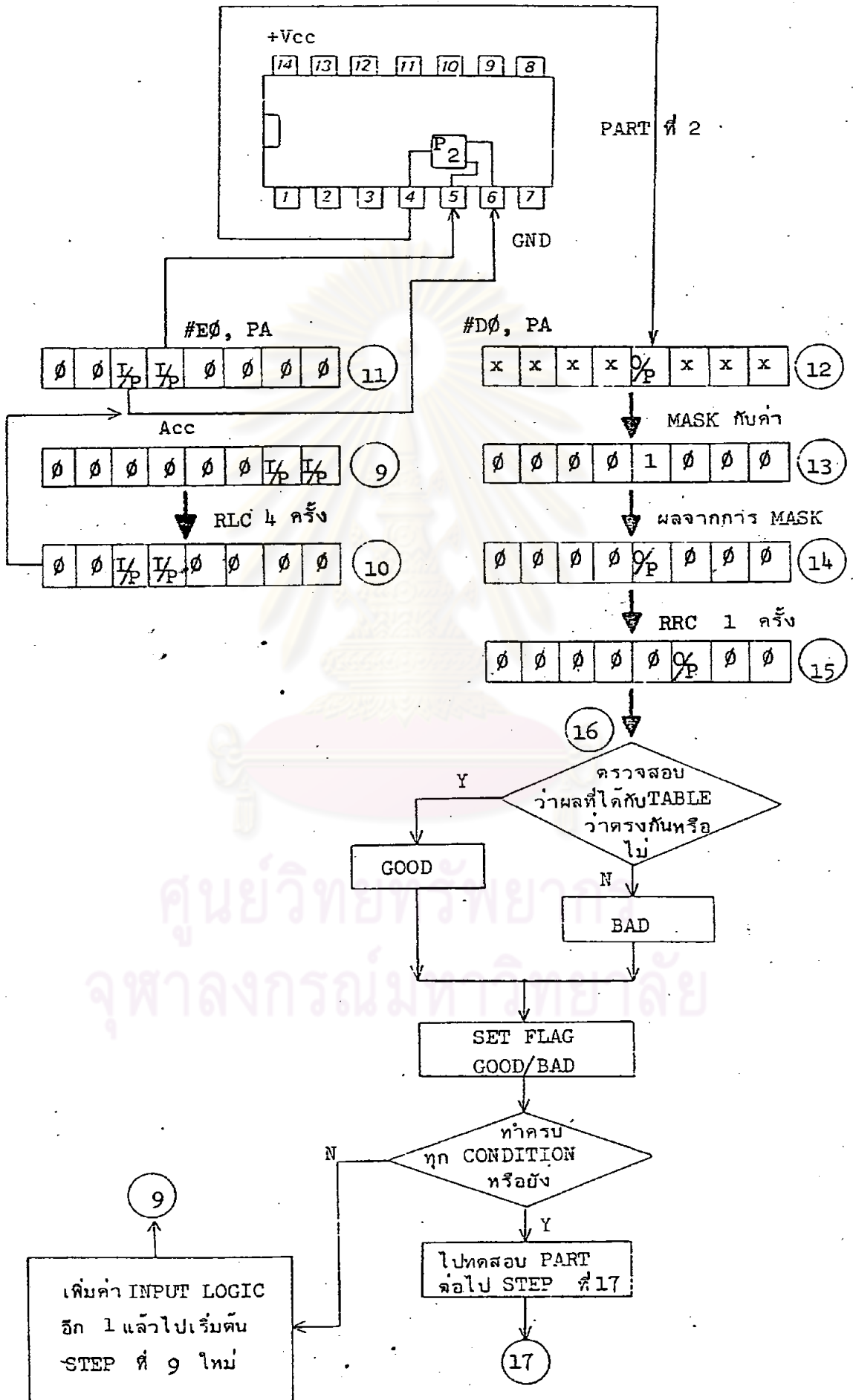
	#F1, PB								#F0, PA								
x'09'	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	x'09'

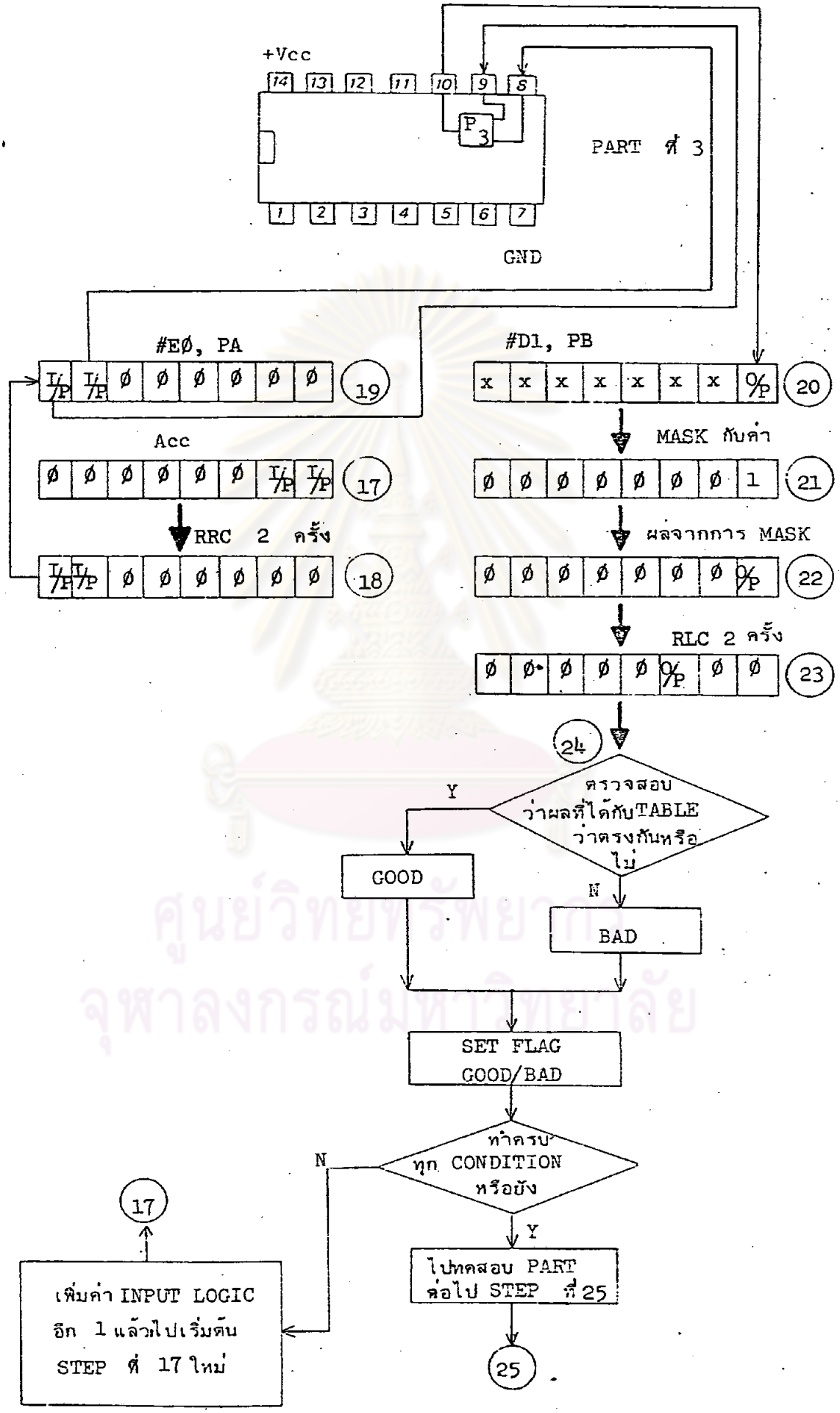


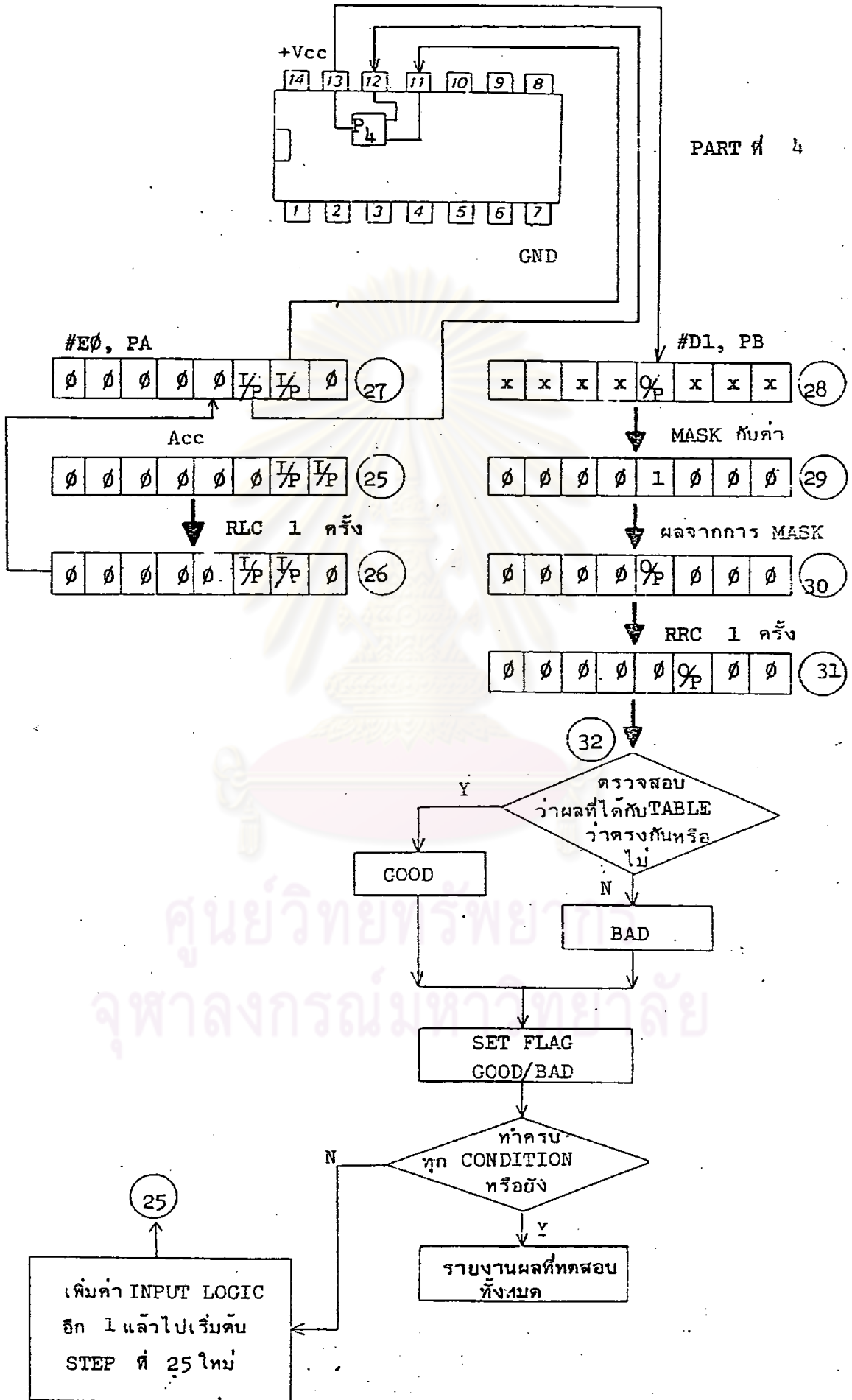
ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FLOW CHART ที่ ก.๓ FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ ๓

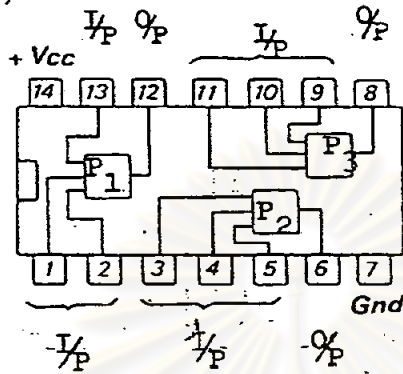








ง. IC ประเภทที่ ๔ ใช้ SOCKET #1 (มี ๑๔ ขา  $V_{cc}$  อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๔



รูปที่ ก.๔ : IC ประเภทที่ ๔

จากรูปที่ ก.๔ มีทั้งหมด 3 GATE ในที่นี้แบ่งเป็น ๓ ส่วน (PART)

ได้แก่  $P_1$ ,  $P_2$ , และ  $P_3$

- $P_1$  มีขา ๘, ๒ และ ๑๓ เป็น INPUT / ขา ๑๒ เป็น OUTPUT
- $P_2$  มีขา ๓, ๔ และ ๕ เป็น INPUT / ขา ๖ เป็น OUTPUT
- $P_3$  มีขา ๘, ๑๐ และ ๑๑ เป็น INPUT / ขา ๔ เป็น OUTPUT

โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นโปรแกรมย่อยที่สามารถใช้ได้กับ IC GATE

ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน LOGIC OUTPUT TABLE ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้น ก็สามารถทดสอบ IC แต่ละชนิดได้

IC ประเภทที่ ๔ นี้ได้แก่

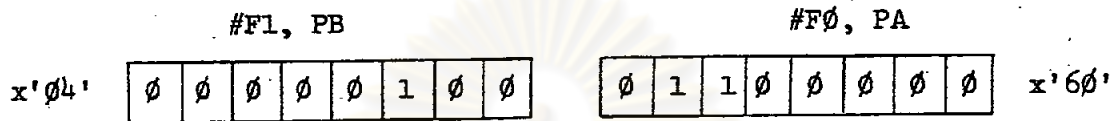
- 3 INPUT NAND GATE เช่น 7410, และ 7412
- 3 INPUT NOR GATE เช่น 7427
- 3 INPUT AND GATE เช่น 7411, และ 7415



แนวความคิดในการเขียนโปรแกรม เพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW CHART

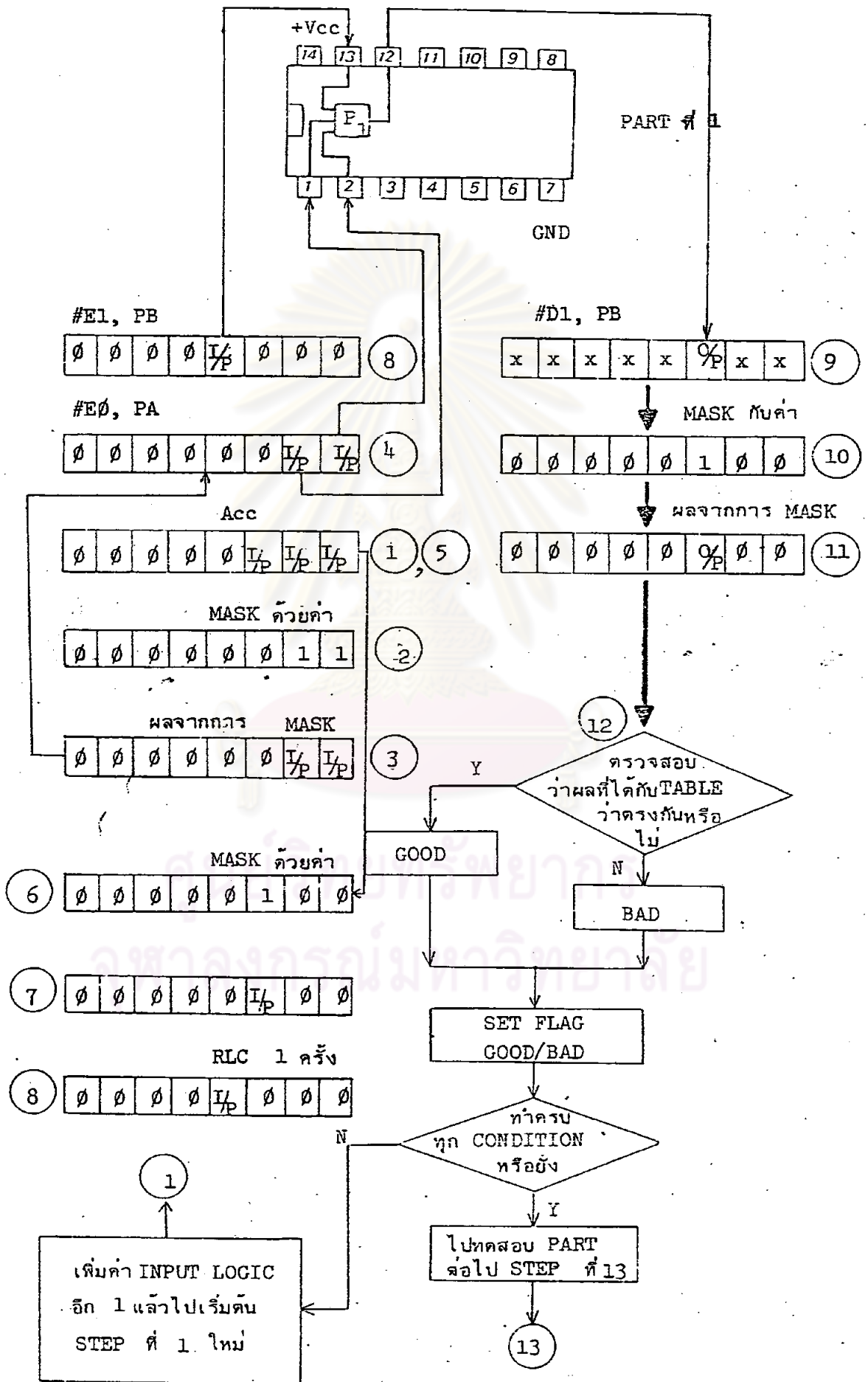
ที่ ก.๔

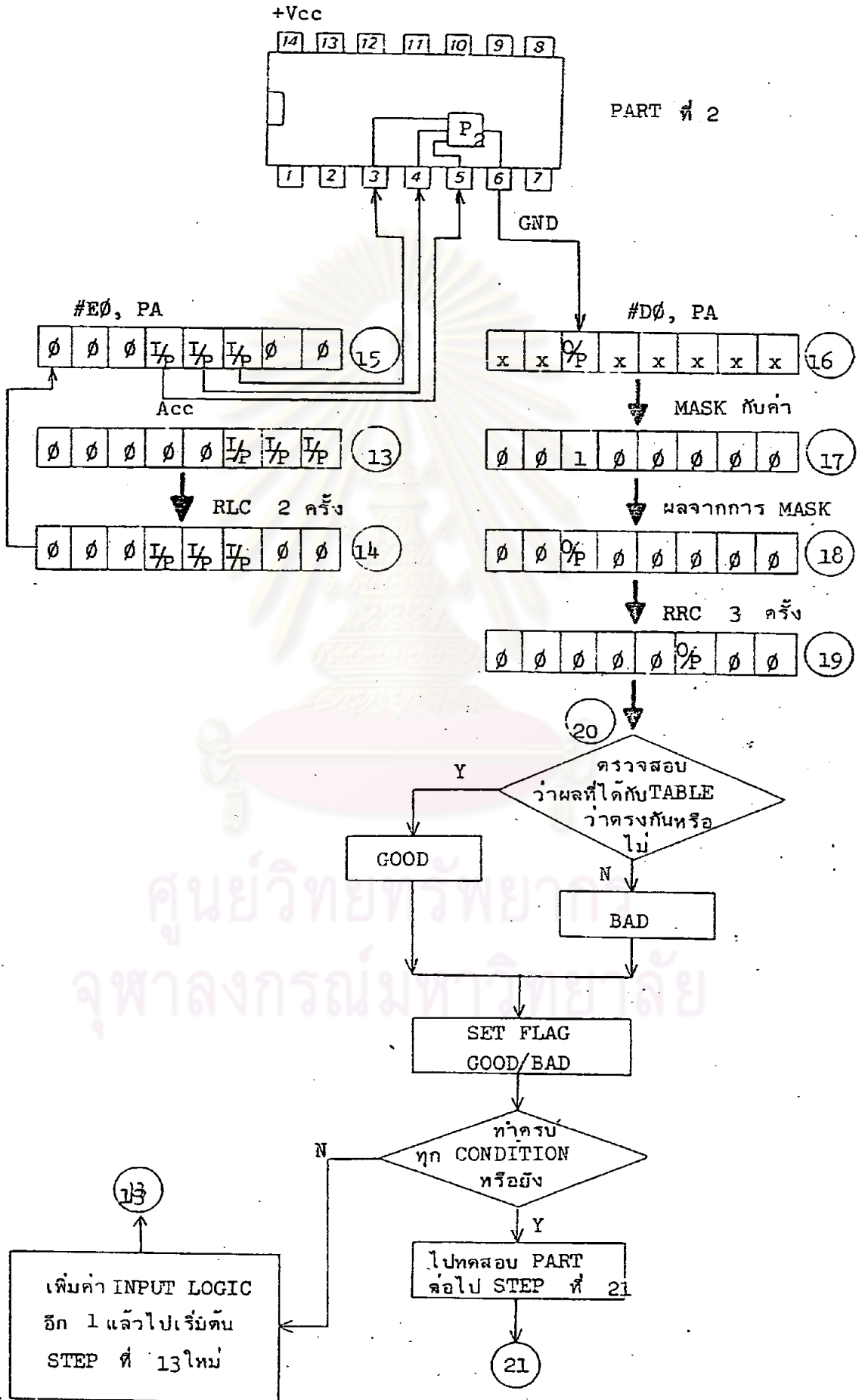
PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๔ ข้อมูลที่ SET ดังนี้

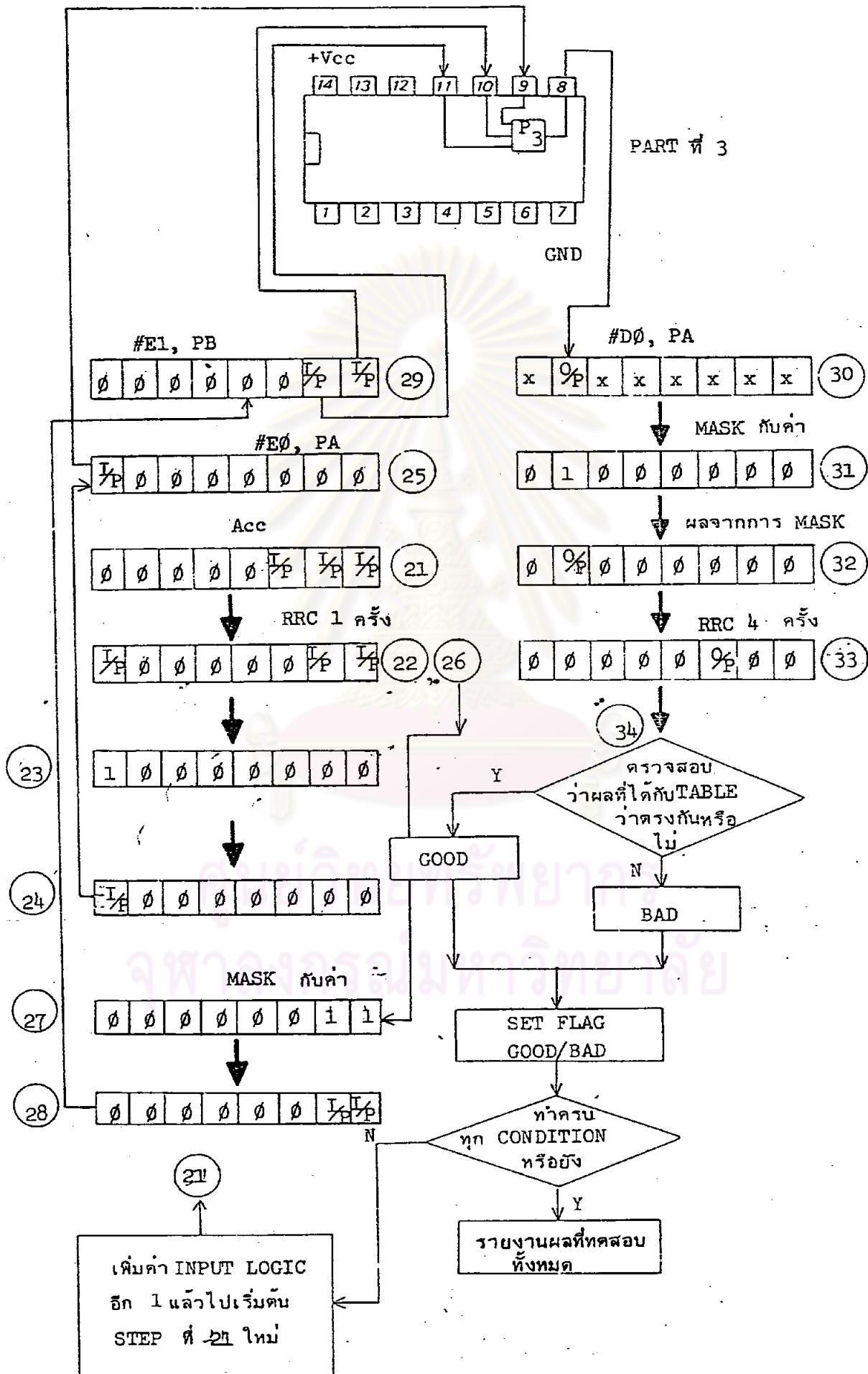


ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

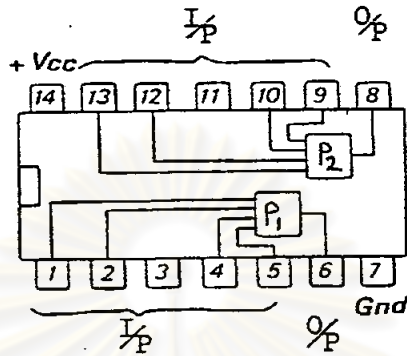
FLOW CHART ที่ ก.๔ FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ ๔







จ. IC ประเภทที่ ๔ ใช้ SOCKET # 1 (มี ๑๔ ขา  $V_{cc}$  อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๔



รูปที่ ก.๔ IC ประเภทที่ ๔

จากรูปที่ ก.๔ มีทั้งหมด ๒ GATE ในที่นี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน (PART)

ได้แก่  $P_1$  และ  $P_2$

- $P_1$  มีขา ๑, ๒, ๔, และ ๕ เป็น INPUT / ขา ๖ เป็น OUTPUT
- $P_2$  มีขา ๙, ๑๐, ๑๑ และ ๑๒ เป็น INPUT / ขา ๘ เป็น OUTPUT

โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นโปรแกรมย่อยที่สามารถใช้ได้กับ IC GATE ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่ลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน LOGIC OUTPUT TABLE ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นก็สามารถทดสอบ

IC แต่ละชนิดได้

IC ประเภทที่ ๔ นี้ได้แก่

- DUAL 4 INPUT NAND GATE เช่น 7420, 7422, 7440, 74140 และ 74C20

แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมเพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW CHART ที่ ก.๕

PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๔ ข้อมูลที่ SET

ดังนี้

#F1, PB

#F0, PA

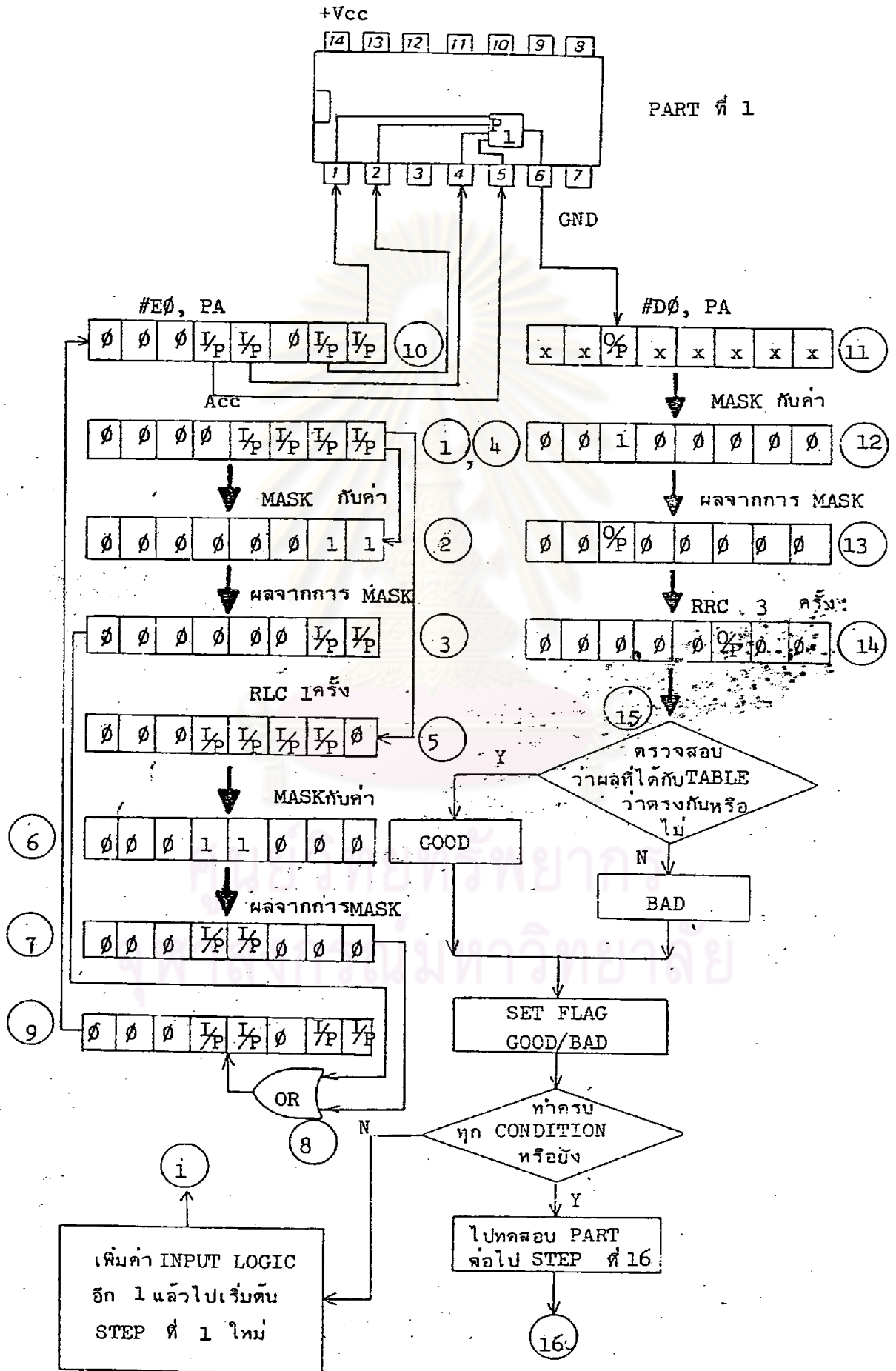
X'00' 

0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	1	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

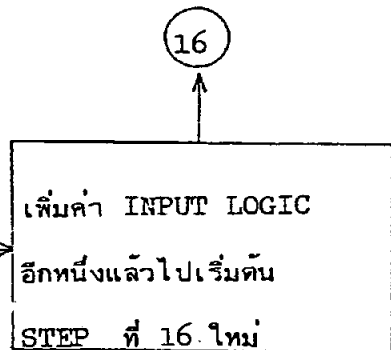
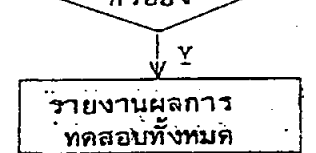
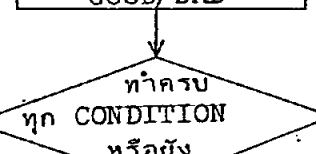
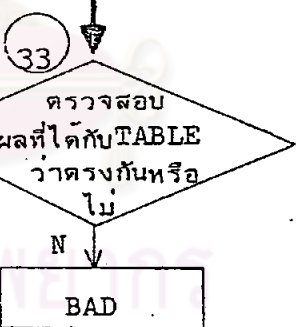
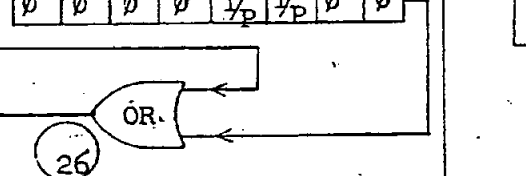
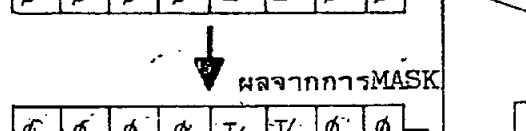
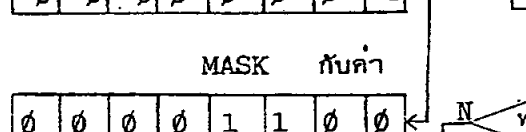
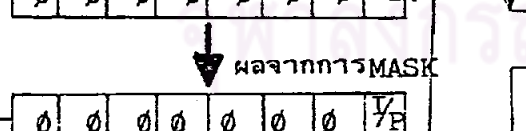
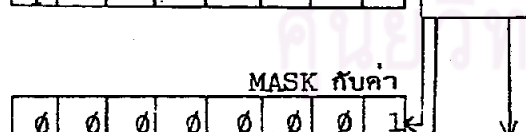
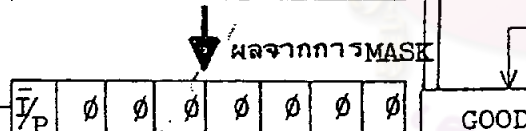
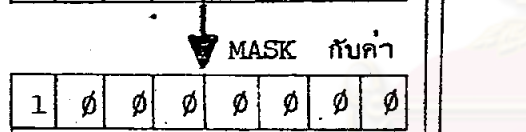
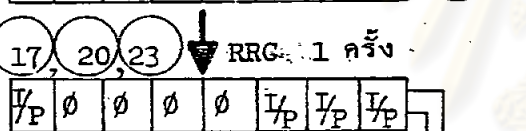
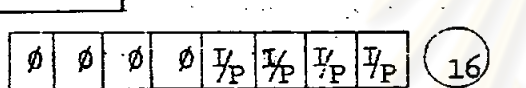
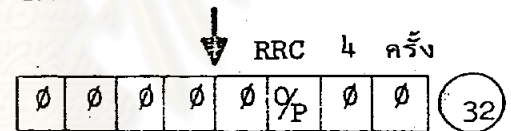
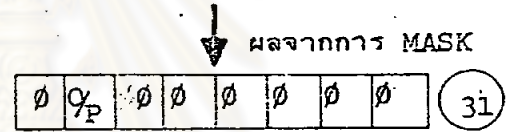
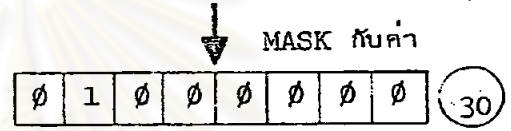
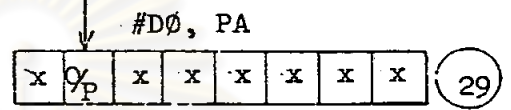
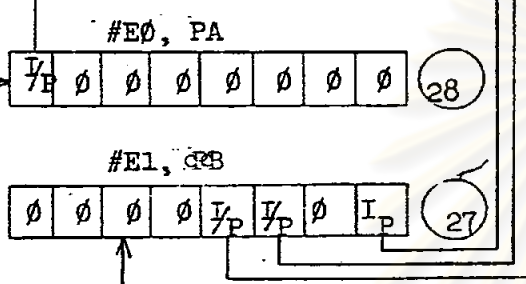
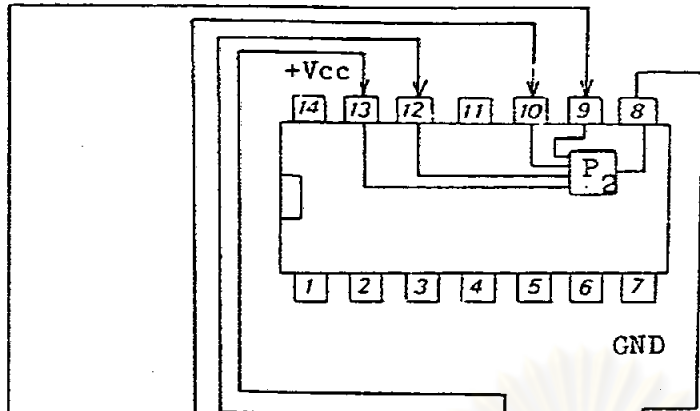
X'60'

FLOW CHART ที่ ก.๔ FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ ๔

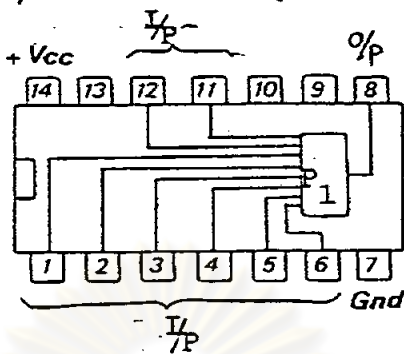




PART ที่ 2



๑. IC ประเภทที่ ๖ ใช้ SOCKET # 1 (มี ๑๔ ขา  $V_{cc}$  อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๖



รูปที่ ก.๖ IC ประเภทที่ ๖

จากรูป ก.๖ มีทั้งหมด ๑ GATE ในที่นี้แบ่งเป็น ๑ ส่วน (PART)

ได้แก่  $P_1$

-  $P_1$  มีขา ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ ๑๑ และ ๑๒ เป็น INPUT /ขา ๘ เป็น OUTPUT

โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นโปรแกรมน้อยที่สามารถใช้ได้กับ IC GATE ที่ทำหน้าที่ต่างกันแต่มีลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน LOGIC OUTPUT TABLE ที่แตกต่างกันออกไปเท่านั้นก็สามารถทดสอบ IC แต่ละชนิดได้

IC ประเภทที่ ๖ นี้ ได้แก่

- 8 INPUT NAND GATE เช่น 7430

แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมเพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW CHART

ที่ ก.๖

PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๖ ข้อมูลที่ SET ดังนี้

#F1, PB

#F0, PA

X'00' 

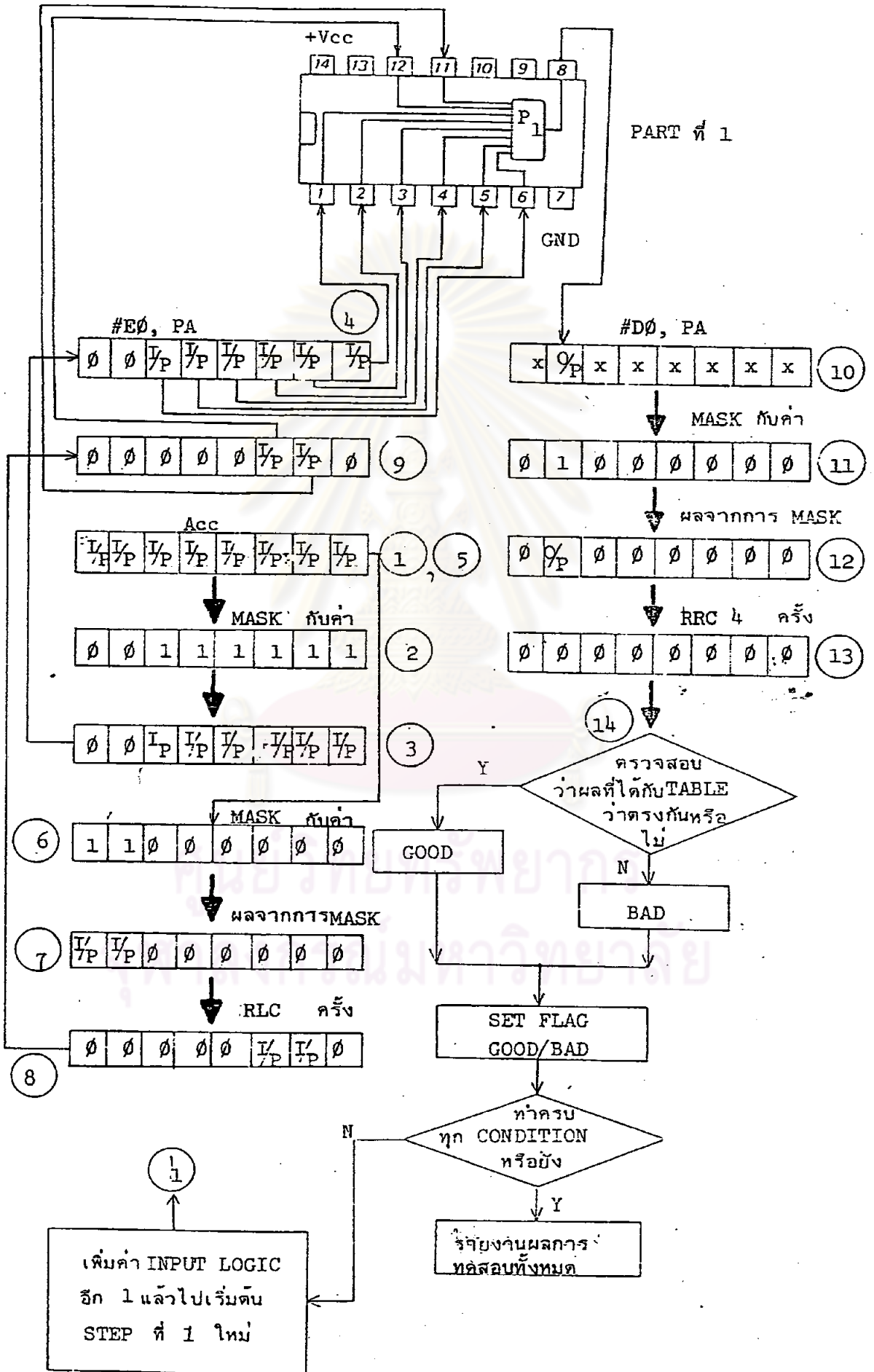
0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

0	1	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

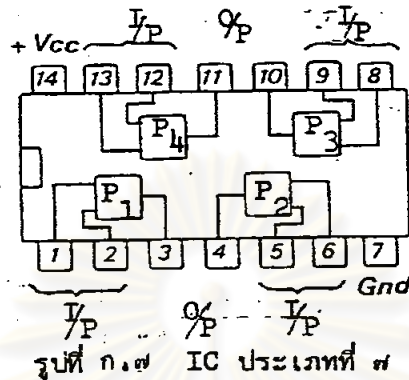
 X'40'



FLOW CHART ที่ ก.๖ FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ 6



ข. IC ประเภทที่ ๗ ใช้ SOCKET # 1 (มี ๑๔ ขา) Vcc อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๗



จากรูป ก.๗ มีทั้งหมด 4 GATEในนี้แบ่งเป็น ๔ ส่วน (PART)

ได้แก่ P1, P2, P3 และ P4

- P<sub>1</sub> มีขา ๑ และ ๒ เป็น INPUT/ ขา ๓ เป็น OUTPUT
- P<sub>2</sub> มีขา ๔ และ ๖ เป็น INPUT/ ขา ๕ เป็น OUTPUT
- P<sub>3</sub> มีขา ๘ และ ๙ เป็น INPUT/ ขา ๑๐ เป็น OUTPUT
- P<sub>4</sub> มีขา ๑๒ และ ๑๓ เป็น INPUT/ ขา ๑๑ เป็น OUTPUT

โปรแกรมที่ใช้ในการทดสอบจะเป็นโปรแกรมย่อยที่สามารถใช้ได้กับ IC GATE

ที่ทำหน้าที่ต่างกัน แต่มีลักษณะของขาเหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยน LOGIC

OUTPUT TABLE ที่แตกต่างกันออกไปแทน ก็สามารถทดสอบ IC แต่ละ

ชนิดได้

IC ประเภทที่ ๗ นี้ได้แก่

- QUAD 2 INPUT EXCLUSIVE OR GATE เช่น 74LS266, 74LS386, 74C86, 4030 และ 4070 (CMOS)
- QUAD 2 INPUT NAND GATE เช่น 4011 (CMOS)
- QUAD 2 INPUT NOR GATE เช่น 4001 (CMOS)
- QUAD 2 INPUT OR GATE เช่น 4071 (CMOS)

แนวความคิดในการเขียนโปรแกรมเพื่อจะทดสอบ IC พวกนี้ ดู FLOW  
CHART ที่ ก.๗

PIN CONTROL สำหรับ SET ขา IC ประเภทที่ ๗ ข้อมูลที่ SET  
ดังนี้ (จะต้อง SET ก่อนจะทดสอบแล้วบอกผู้ใช้ว่า READY)

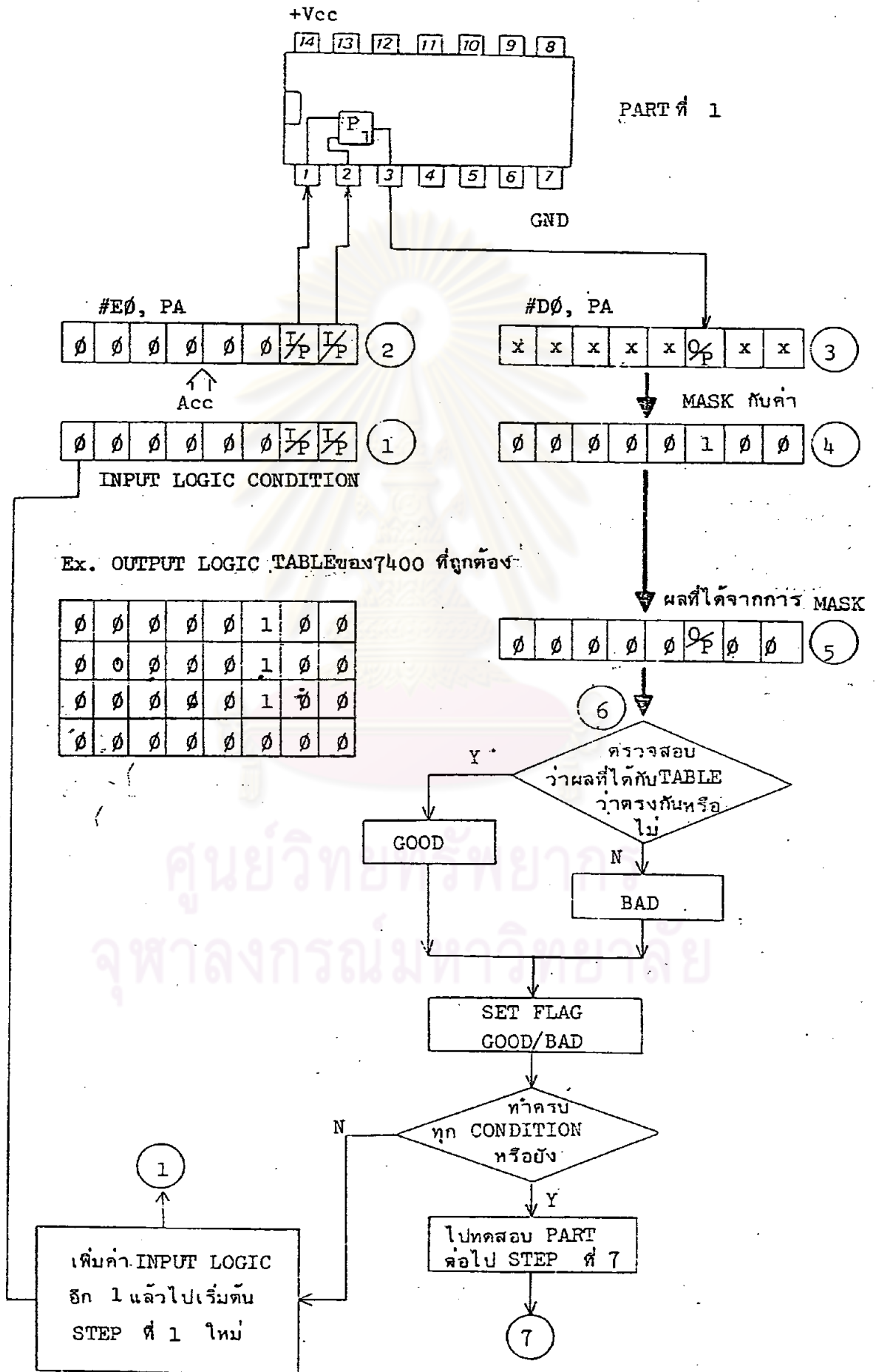
#F1, PB

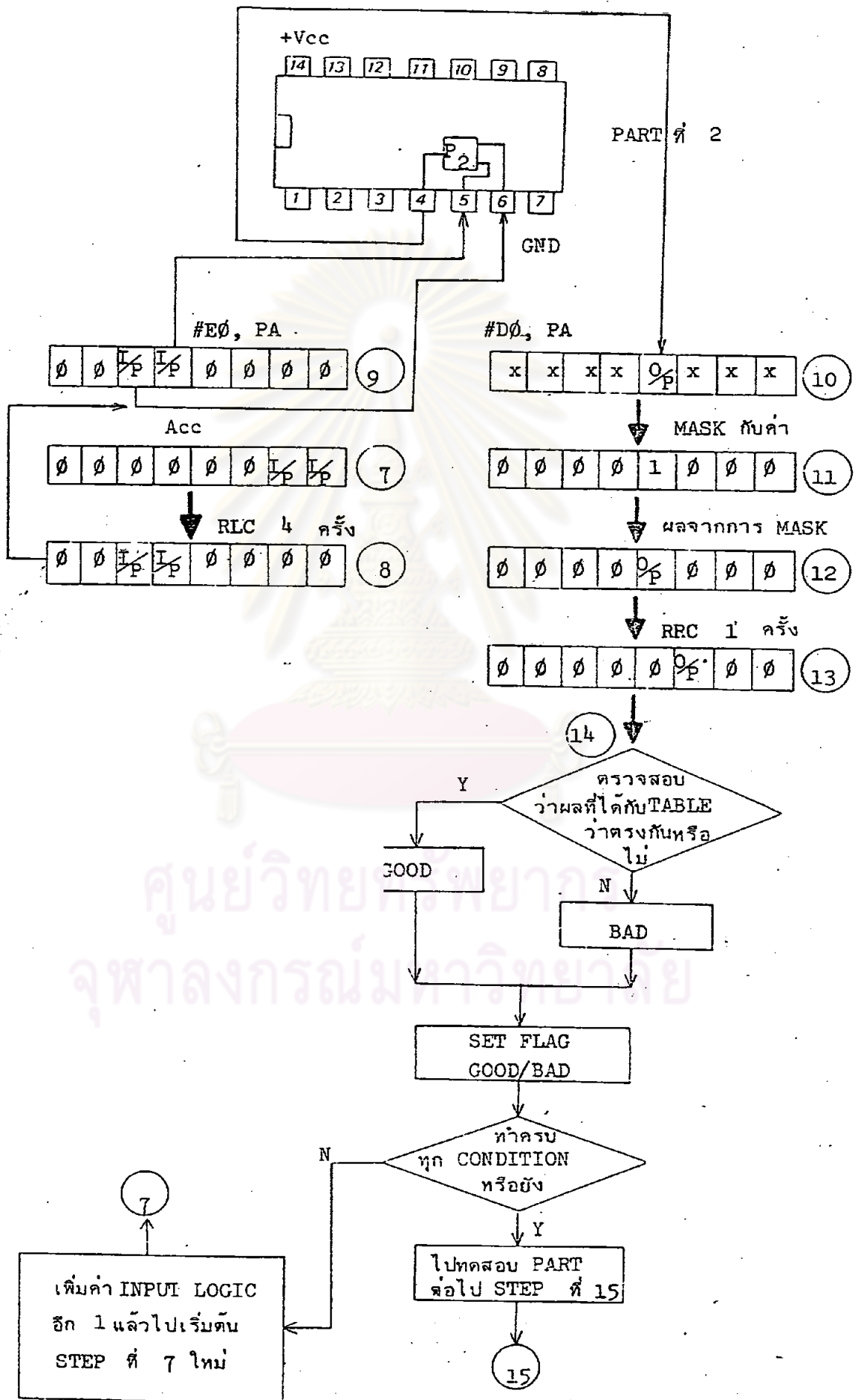
#F0, PA

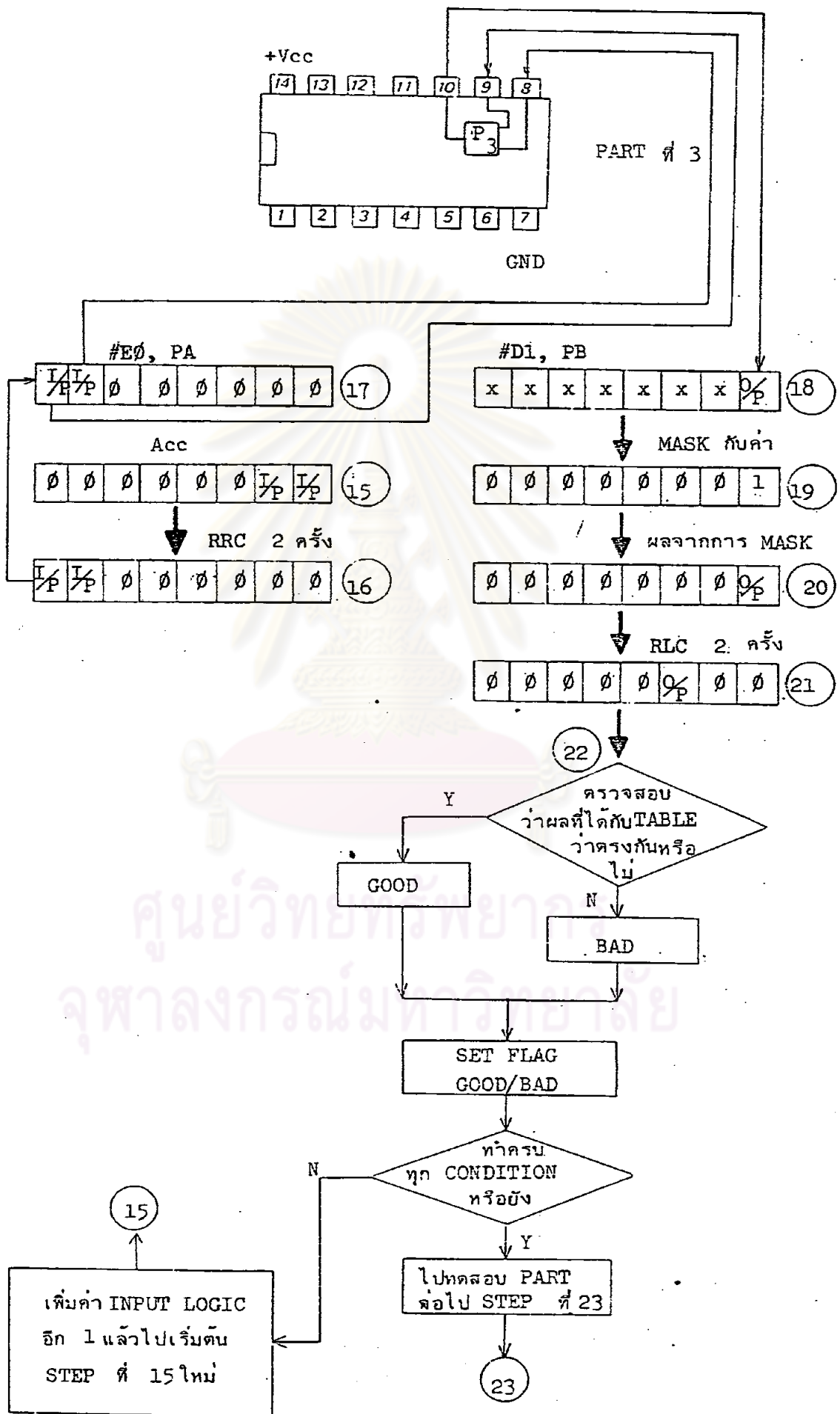
X '03'	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	X'0C'
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------

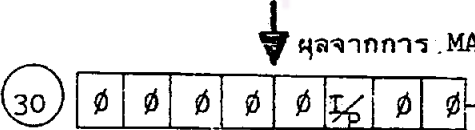
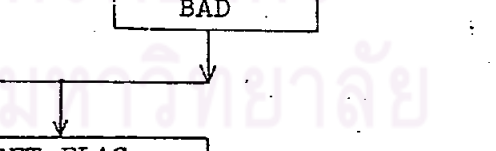
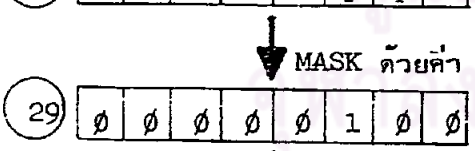
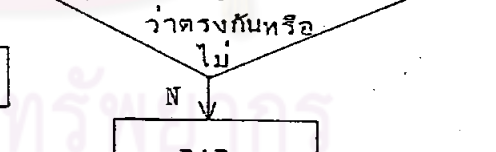
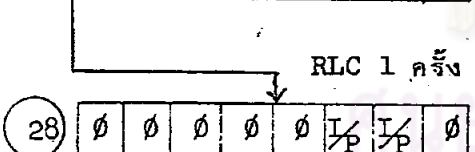
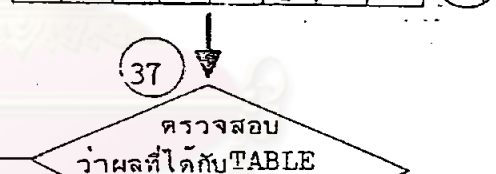
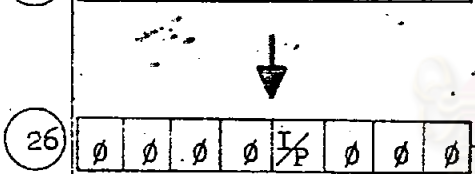
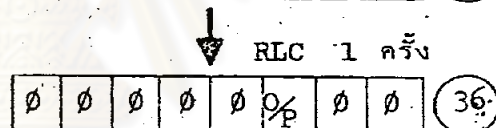
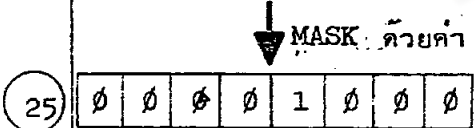
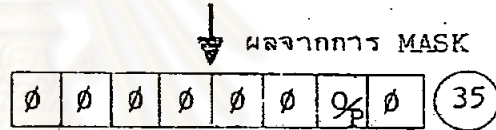
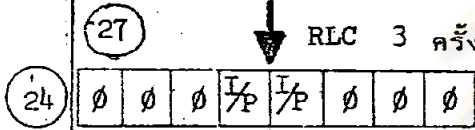
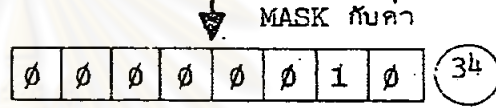
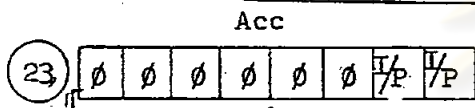
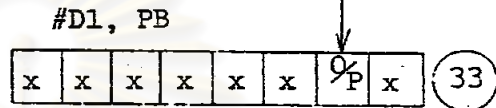
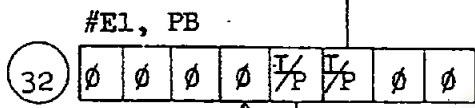
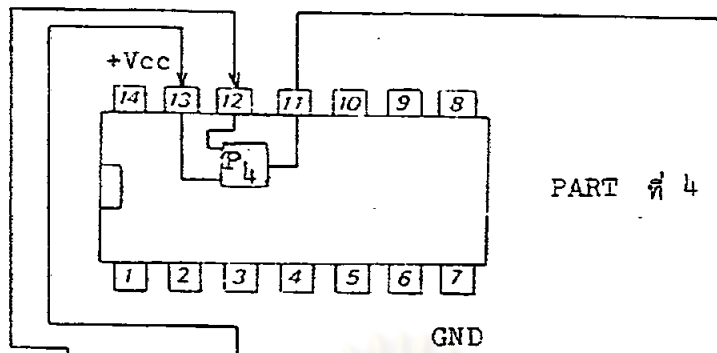
ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FLOW CHART ที่ ก.๗ FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ ๗



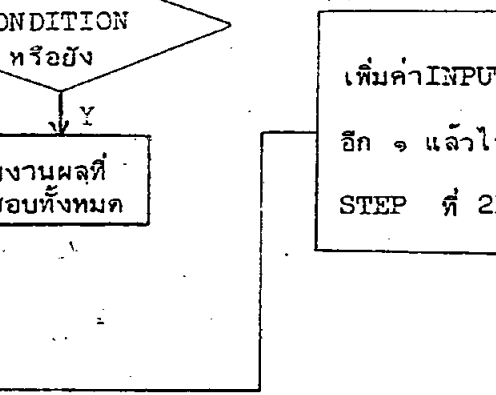




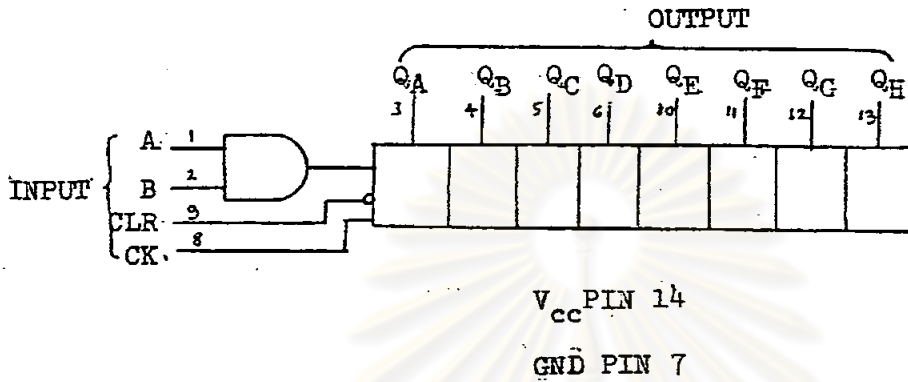


FLAG - GOOD/BAD

	00
P <sub>1</sub>	01
	10
	11
P <sub>2</sub>	00
	01
	10
	11
P <sub>3</sub>	00
	01
	10
	11
P <sub>4</sub>	00
	01
	10
	11



ช. IC ประเภทที่ ๘ ใช้ SOCKET # 1 (มี ๑๔ ขา  $V_{CC}$  อยู่ขา ๑๔ และ GND อยู่ขา ๗) มีลักษณะภายในดังรูปที่ ก.๘ (สำหรับทดสอบ IC เบอร์ ๗๔๑๖๔ โดยเฉพาะ)



รูปที่ ก.๘ ลักษณะภายใน IC เบอร์ 74164

การทดสอบ IC เบอร์ 74164 แบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ CLEAR SHIFT REGISTER โดย SET ขา CLEAR (CLR) ให้มีขา LOGIC "0" รับผลเข้าระบบตรวจสอบว่าได้ข้อมูลจาก OUTPUT เป็น LOGIC "0" จริงหรือไม่

ขั้นตอนที่ ๒ ทดสอบ CONDITION ที่ A และ B เป็น L (LOW) ทั้งคู่ (DATA INPUT =  $\emptyset$ ) โดย SET ให้ขา CLR เป็น H (HIGH) หมายถึง วงจร SHIFT REGISTER สามารถทำงานได้แล้ว SIMULATE สัญญาณ CLOCK (CK) โดยใช้การส่งข้อมูลสลับกันระหว่าง H กับ L จะได้ลักษณะ เป็นสัญญาณ CLOCK แล้วรับผลกลับ ประมวลผลที่ได้ว่าถูกต้องหรือไม่แล้วทำขั้นตอนที่ ๓ ต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๒ แต่ขา INPUT A กับ B มีค่า ดังนี้

ขั้นตอนที่	B	A
3	0	1
4	1	0
5	1	1



โปรแกรมทดสอบจะทำตาม FLOW CHART ที่ ก.๘

SET PIN CONTROLLER สำหรับ IC เบอร์ 74164 ดังนี้

0	0	0	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

#F1 ,PB

X'0F'

0	0	1	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

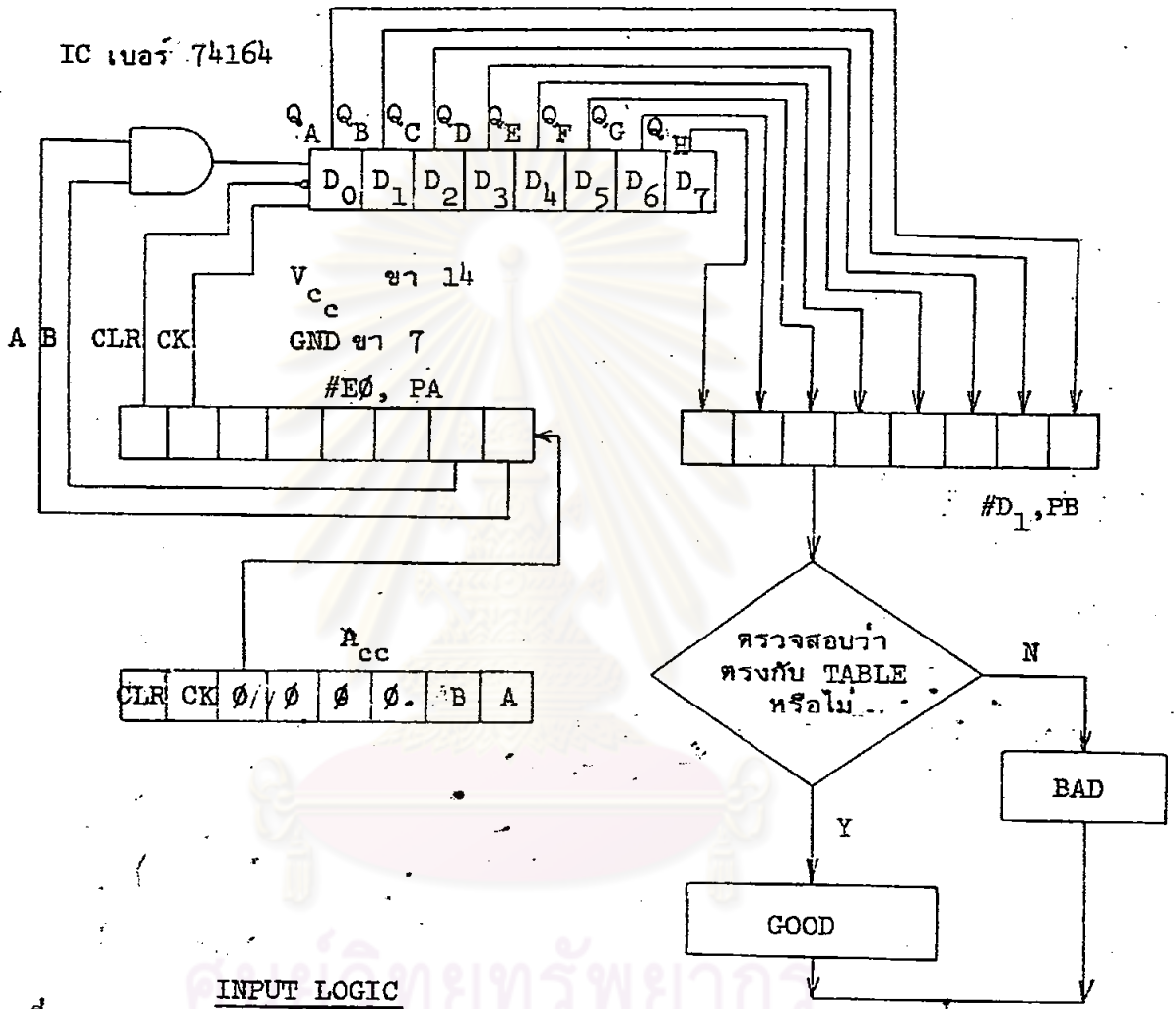
#F0 ,PA

X'2C'



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

FLOW CHART ที่ ก.๘ แสดง FLOW CHART ของโปรแกรมทดสอบ IC เบอร์ 74164  
 ประเภทที่ ๘



ขั้นตอนที่

- 1 CLR CK

∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
---	---	---	---	---	---	---	---

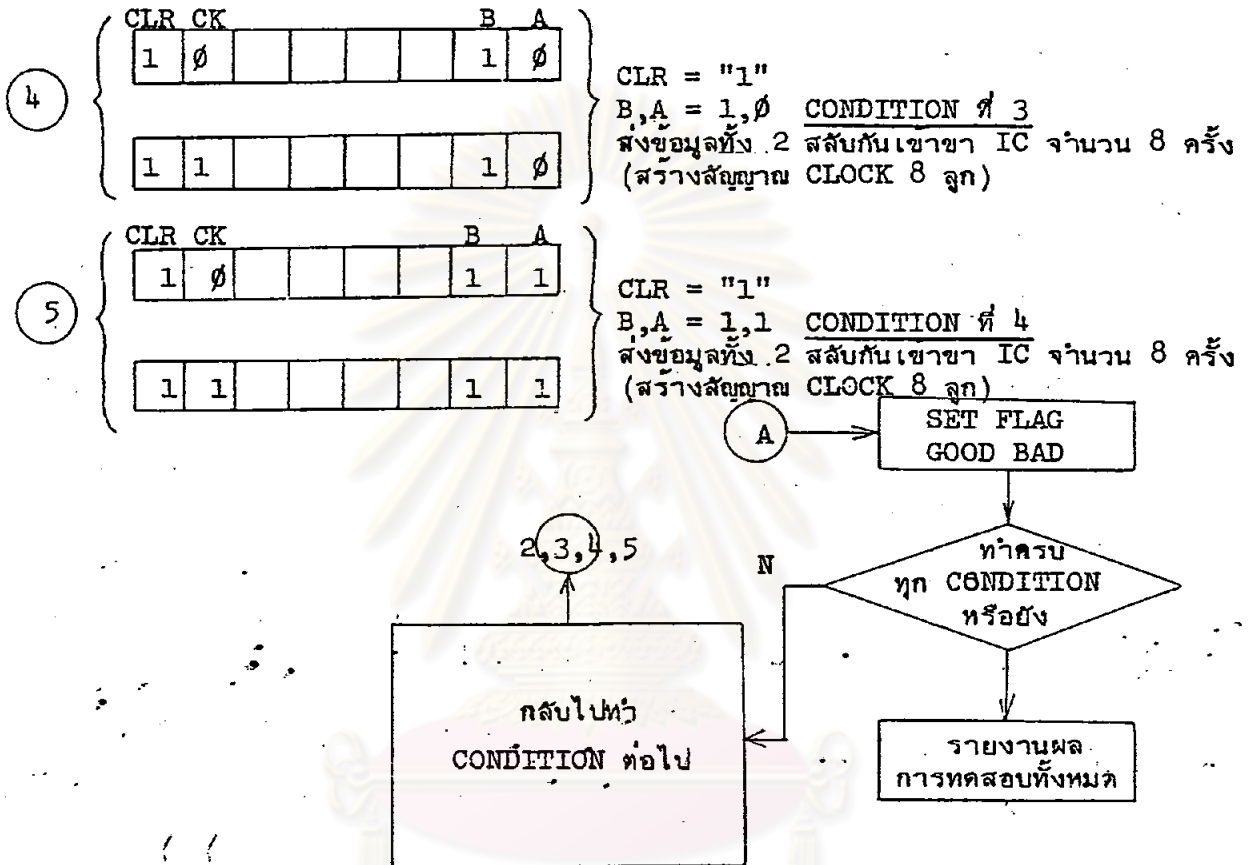
← CLEAR SHIFT REGISTER CLR = "0"
- 2 CLR CK

1	∅					∅	∅
1	1					∅	∅

CLR = "1"  
 B, A = ∅∅ CONDITION ที่ 1  
 ส่งข้อมูลทั้ง 2 สลับกันเข้าขา IC จำนวน 8 ครั้ง  
 (สร้างสัญญาณ CLOCK 8 ลูก)
- 3 CLR CK

1	∅					∅	1
1	1					∅	1

CLR = "1"  
 B, A = ∅1 CONDITION ที่ 2  
 ส่งข้อมูลทั้ง 2 สลับกันเข้าขา IC จำนวน 8 ครั้ง  
 (สร้างสัญญาณ CLOCK 8 ลูก)



ตาราง OUTPUT DATA TABLE

STEP	D <sub>7</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>
1	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
2	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
3	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
4	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
5	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	1
	∅	∅	∅	∅	∅	∅	1	1
	∅	∅	∅	∅	∅	1	1	1
	∅	∅	∅	∅	1	1	1	1
	∅	∅	∅	1	1	1	1	1
	∅	∅	1	1	1	1	1	1
	∅	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1

CK1 }  
CK2 }  
CK3 }  
CK4 }  
CK5 }  
CK6 }  
CK7 }  
CK8 }

OUTPUT ของ SHIFT REGISTER  
ซึ่งมี 8 แบบ เมื่อ INPUT BA = 1



ภาคผนวก ข

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



โปรแกรม START

เริ่ม START PROGRAM ที่ ADDRESS ๒๐๐๐ นี้ เป็น PROGRAM INITIALIZE

DEVICE ทั้งหมดว่าให้ทำ MODE ได้ ตามที่ออกแบบ HARDWARE ไว้

2000	3E9B	MVI A,9B	; SET IC 8255 ให้เป็น INPUT ทั้ง 3 PORT
2002	D3D3	OUT D3	; IC LOGIC OUTPUT MONITOR
2004	3E80	MVI A,80	; SET IC 8255 ให้เป็น OUTPUT ทั้ง 3 PORT
2006	D3E3	OUT E3	; IC INPUT LOGIC DRIVER
2008	3E80	MVI A,80	; SET IC 8255 ให้เป็น OUTPUT ทั้ง 3 PORT
200A	D3F3	OUT F3	; IC PIN CONTROLLER
200C	3E90	MVI A,90	; { SET IC 8255 ให้ PORT A เป็น INPUT, PORT B และ PORT C เป็น OUTPUT
200E	D363	OUT 63	; KEYBOARD และ SOCKET DISPLAY
2010	3E80	MVI A,80	; SET IC 8255 ให้เป็น OUTPUT ทั้ง 3 PORT
2012	D3B3	OUT B3	; BINARY INPUT DISPLAY
2014	3E80	MVI A,80	; SET IC 8255 ให้เป็น OUTPUT ทั้ง 3 PORT
2016	D3C3	OUT C3	; BINARY OUTPUT DISPLAY
2018	3E00	MVI A,00	; คัดเสียงกระดิ่ง
201A	D300	OUT 00	; CLEAR ALARM
201C	00	NOP	;
201D	00	NOP	;
201E	00	NOP	;
201F	00	NOP	;
2020	CD4E26	CALL 264C	; { เริ่ม PROGRAM ที่รับเลขเบอร์ IC จาก KEYBOARD และ DISPLAY
2023	21004E	LXI H,4E00	; { MEMORY ที่เก็บหมายเลขเบอร์ IC ที่กดเข้ามาที่ ADDRESS 4E00 เลขตัวแรก
2026	7E	MOV A,M	; นำค่า MEMORY มาตรวจหมายเลขอะไร
2027	00	NOP	;

2028 00	NOP		;
2029 00	NOP		;
202A 00	NOP		;
202B 00	NOP		;
202C FE05	CPI	05	; ตรวจสอบว่าเป็นเลข 5 หรือไม่
202E CA5020	JZ	2050	; { ถ้าใช่ไปทำ PROGRAM ที่ ADDRESS 2050 (ตรวจสอบหมายเลขถัดไป)
2031 FE07	CPI	07	; ถ้าไม่ใช่ตรวจสอบว่าเป็นเลข 7 หรือไม่
2033 CA5020	JZ	2050	; { ถ้าใช่ไปทำ PROGRAM ที่ ADDRESS 2050 (ตรวจสอบหมายเลขถัดไป)
2036 00	NOP		;
2037 00	NOP		;
2038 00	NOP		;
2039 00	NOP		;
203A 00	NOP		;
203B 00	NOP		;
203C 00	NOP		;
203D 00	NOP		;
203E 00	NOP		;
203F 00	NOP		;
2040 FEFF	CPI	FF	; ตรวจสอบว่าเป็นค่า FF หรือไม่
2042 CA4820	JZ	2048	; ถ้าใช่กลับไปเริ่มตรวจสอบหมายเลขใหม่
2045 CD4C26	CALL	264C	; ไปรับหมายเลขใหม่(ต้องกดเบอร์ IC ใหม่)
2048 C32020	JMP	2020	; กลับไปตรวจสอบหมายเลขใหม่

โปรแกรม P1

ส่งเสียง ALARM TONE	ยาวและตรวจ KEY	ว่ากดอะไรเข้ามา	
204B D310	OUT	10	; ส่งเสียง ALARM TONE ยาว
204D C3B920	JMP	20B9	; กลับไปตรวจ KEY ว่ากด KEY ไตเข้ามา

ตรวจหมายเลขถัดไป

```

2050 23      INX  H      ; MEMORY ADDRESS ที่ 4E01
2051 7E      MOV  A,M     ; ข้อมูลจาก MEMORY เก็บที่ A
2052 FE04    CPI  04     ; ตรวจสอบเป็นเลข 4 หรือไม่
2054 CA0021  JZ   2100    ; ถ้าใช่ไปทำ PROGRAM ที่ ADDRESS 2100
                          ; (ตรวจเลขถัดไป)
2057 CD6820  CALL 2068    ; ถ้าไม่ใช่แสดงว่าไม่มี IC เบอร์นี้
205A CD2326  CALL 2623    ; { SET MEMORY DISPLAY เป็นFF ทุก LOCATION และ
                          ; CLEAR DISPLAY
205D CD0028  CALL 2800    ; ตรวจสอบมีใครกด KEY อะไรเข้ามาทาง KEYBOARD
2060 FE16    CPI  16     ; ตรวจสอบว่ากดปุ่ม CLEAR หรือไม่
2062 CA6D20  JZ   206D    ; ถ้ากดไปทำ STEP ที่ ADDRESS 206D
2065 C35D20  JMP  205D    ; ถ้าไม่ใช่ WAITING LOOP

```

โปรแกรมย่อย P2

แสดงผล DISPLAY ว่า NO HAVE IC

```

2068 3E80    MVI  A,80     ; UNKNOWN IC
206A D300    OUT  00     ; SET LED UNKNOWN IC
206B 00      NOP      ;
206C C9      RET      ;
206D 3E00    MVI  A,00     ; CLEAR DISPLAY UNKNOWN IC
206F D300    OUT  00     ; LED UNKNOWN IC
2071 C34C26  JMP  264C     ; ไปรอรับเบอร์ IC ใหม่ที่กดเข้ามา

```

โปรแกรมย่อย DECODE HEX 4 BIT UPPER เป็น 7 SEGMENT

```

2074 78      MOV  A,B     ; นำค่า INPUT LOGIC ไว้ที่ A
2075 E6F0    ANI  F0     ; MASK เอา 4 BIT บน (UPPER)
2077 0F      RRC      ;
2078 0F      RRC      ; } ย้าย 4 BIT บนมาเป็น 4 BIT ล่าง

```

```

2079 0F      RRC      ;
207A 0F      RRC      ;
207B CD0222  CALL 2202  ; LOOK UP TABLE จาก HEX เป็น 7-SEGMENT
207E C9      RET      ;

```

โปรแกรมย่อย P3

SET PIN IC.ขา;ขา INPUT/OUTPUT=1,2/3; 4,5/6; 9,10/8; 12,13/11

ประเภทที่ . SOCKET#1

```

207F 00      NOP      ;
2080 3E64    MVI  A,64    ; A = 64
                8 6 3
                | | | | | | | |
                9 5 4 2 1
2082 D3F0    OUT  F0    ; PORT A 8255 PIN CONTROLLER
2084 3E02    MVI  A,02    ; A = 02
                11
                | | | | | | | |
                13 12 10
2086 D3F1    OUT  F1    ; PORT B 8255 PIN CONTROLLER
2088 C9      RET      ;

```

โปรแกรมย่อย P4

LED แสดง IC SOCKET อันที่ 1 (14ขา V<sub>cc</sub> ขา 14, GND ขา 7)

```

2089 3E01    MVI  A,01    ; A = 01, PC0 = SOCKET # 1
208B D362    OUT  62    ; PORT C 8255 KEYBOARD และ IC SOCKET
                DISPLAY
208D C9      RET      ;

```

โปรแกรมย่อย P5

LED แสดง IC SOCKET อันที่ 2 (14ขา, V<sub>cc</sub> ขา 4, GND ขา 11)

```

208E 3E02    MVI  A,02    ; A = 02, PC1 = SOCKET # 2
2090 D362    OUT  62    ; PORT C 8255 KEY&IC SOCKET DISPLAY
2092 C9      RET      ;

```



โปรแกรมย่อย P.6

LED แสดง IC SOCKET หน้าที่ 3 (14 ขา,  $V_{cc}$  ขา 5, GND ขา 10)

2093 3E04 MVI A,04 ; A = 04,  $PC_2$  = SOCKET # 3  
2095 D362 OUT 62 ; PORT C 8255 KEY & IC SOCKET DISPLAY  
2097 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P.7

LED แสดง IC SOCKET หน้าที่ 4 (16 ขา,  $V_{cc}$  ขา 16, GND ขา 8)

2098 3E08 MVI A,08 ; A = 08,  $PC_3$  = SOCKET # 4  
209A D362 OUT 62 ; PORT C 8255 KEY & IC SOCKET DISPLAY  
209C C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P.8

LED แสดง IC SOCKET หน้าที่ 5 (16 ขา,  $V_{cc}$  ขา 5, GND ขา 13)

209D 3E10 MVI A,10 ; A = 10,  $PC_4$  = SOCKET # 5  
209F D362 OUT 62 ; PORT C 8255 KEY & IC SOCKET DISPLAY  
20A1 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P.9

LED แสดง IC SOCKET หน้าที่ 6 (16 ขา,  $V_{cc}$  ขา 5, GND ขา 12)

20A2 3E20 MVI A,20 ; A = 20,  $PC_5$  = SOCKET # 6  
20A4 D362 OUT 62 ; PORT C 8255 KEY & IC SOCKET DISPLAY  
20A6 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 10

LED แสดง IC SOCKET อันดับ 7 (24 ขา,  $V_{cc}$  ขา 24, GND ขา 12)

```
20A7 3E40      MVI  A,40      ; A = 40, PC6 = SOCKET # 7
20A9 D362      OUT  62        ; PORT C 8255 KEY & IC SOCKET DISPLAY
20AB C9        RET                ;
20AC 00        NOP                ;
20AE 00        NOP                ;
20B0 00        NOP                ;
```

โปรแกรมย่อย P 11

LED แสดง "READY" DISPLAY

```
20B1 3E04      MVI  A,04      ; A = 04, D2
20B3 D300      OUT  00        ; LED แสดง "READY" ดิจิต
20B5 C9        RET                ;
```

โปรแกรมย่อย P 12

FAST/SLOW TEST

```
20B6 21FE4F    LXI  H,4FFE    ; STATUS ของ FAST/SLOW อยู่ที่ 4FFE
20B9 CD0028    CALL 2800     ; รอรับผลจาก KEYBOARD
20BC FE13      CPI  13       ; ตรวจสอบว่าเป็น SLOW หรือไม่
20BE CAC920    JZ   20C9     ; ถ้าใช่รอการกด KEY ปุ่ม TEST
20C1 FE17      CPI  17       ; ตรวจสอบว่าเป็น TEST หรือไม่
20C3 CAD420    JZ   20D4     ; ถ้าใช่ SET STATUS 4FFE เป็น 00
20C6 C39821    JMP  2198     ; ถ้าไม่ใช่ไปตรวจว่าเป็น CLEAR หรือไม่
20C9 CD0028    CALL 2800     ; รอรับผลจาก KEYBOARD
20CC FE17      CPI  17       ; ตรวจสอบว่าเป็น TEST
20CE C22321    JNZ  2123     ; ถ้าไม่ใช่ส่งเสียง ALARM (กด KEY ดิจิต)
```

20D1 36FF MVI M,FF ; ปิดท้ายด้วย FF หลังเบอร์ IC ที่กดเข้ามา

20D3 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 13

SET FLAG FAST TEST = ๑๑

20D4 36๐๐ MVI M,๐๐ ;

20D6 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 14

ลักษณะ IC ประเภท 1/เลือก SOCKET/แจ้ง READY /ตรวจ FAST/หรือ SLOW TEST

20D7 CD8๐2๐ CALL 2๐8๐ ; PIN CONTROL ประเภท 1

20DA CD892๐ CALL 2๐89 ; เลือก SOCKET # 1 LED ติด

20DD CDB12๐ CALL 2๐B1 ; แจ้งพร้อมแล้ว (READY)

20E๐ CDB62๐ CALL 2๐B6 ; ตรวจสอบว่าคอป SLOW หรือไม่กดแล้วแต่ผู้ใช้

20E3 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 15

ตรวจ FLAG FAST/SLOW TEST (F/S FLAG) ถ้า SLOW ก็ร่นางเวลา (DELAY) ให้เลย

20E4 E5 PUSH H ;

20E5 D5 PUSH D ;

20E6 C5 PUSH B ; SAVE REGISTER ทั้งหมด

20E7 F5 PUSH PSW ;

20E9 21FE4F LXI H,4FFE ; F/S FLAG อยู่ที่ 4FFE

20EB 7E MOV A,M ; เอาค่าที่ FLAG เข้าไปไว้ที่ A

20EC FEFF CPI FF ; ตรวจสอบว่าเป็น SLOW หรือไม่

20EE C2F42๐ JNZ 2๐F4 ; ถ้าไม่เป็นทดสอบขั้นตอนต่อไป

20F1 CD4D27 CALL 274D ; ถ้าเป็นทดสอบแบบช้า (SLOW) ก็ร่นางเวลา (DELAY) 1 SEC

```

20F4 F1      POP  PSW      ;
20F5 C1      POP  B       ;
20F6 D1      POP  D       ;
20F7 E1      POP  H       ;
20F8 C9      RET          ;

```

คืนค่าเก่าให้กับ REGISTER นั้นอย่างเดิม

โปรแกรมย่อย P.16

4 BIT LOWER DISPLAY (D<sub>3</sub>-D<sub>0</sub>) จากฐาน 2 เป็นฐาน 16 ในรูปของ 7 SEGMENT

B - เป็น INPUT

```

20F9 78      MOV  A,B       ; B ไปเก็บไว้ที่ A
20FA E60F    ANI  0F       ; MASK 4 BIT หลัง D3-D0 ไว้
20FC CD0222  CALL 2202      ; { DECODE ว่าเลข BINARY ตรงกับ 7 SEGMENT
                          ; เลขฐาน 16 อะไรผลลัพท์อยู่ที่ A
20FF C9      RET          ;

```

ต่อโปรแกรม DECODE เบอร์ IC

ในช่วง DIGIT ที่ 3

```

2100 23      INX  H       ; เลื่อนข้อมูลมาที่ตัวเลข IC ตัวที่ 3
2101 7E      MOV  A,M       ; ข้อมูลใน MEMORY มาเก็บเข้าที่ A
2102 FE11    CPI  11       ; ตรวจสอบว่าเป็นเลขหรืออักษร L=(11)HEX
2104 CA1921  JZ   2119      ; ถ้าใช่ L ไปตรวจว่าเลขหรืออักษรต่อไปเป็น S หรือเป็น
2107 FE12    CPI  12       ; ถ้าไม่ใช่ L ตรวจว่าใช่ S หรือไม่
2109 CAD321  JZ   21D3      ; { ถ้าใช่ตรวจว่าเลขต่อไปเป็นเลขอะไรของตารางพวก
                          ; IC ประเภท SHOCKY
210C FE10    CPI  10       ; ถ้าไม่ใช่ S ตรวจต่อไปว่าเป็น H หรือไม่
210E CADF21  JZ   21DF      ; ถ้าใช่ก็ไปที่ตารางของพวก IC ประเภท HIGH SPEED
2111 FE0C    CPI  0C       ; ถ้าไม่ใช่ตรวจว่าเป็น C หรือไม่
2113 CAEB21  JZ   21EB      ; ถ้าใช่ก็ไปที่ตารางของพวก IC ประเภทตระกูล CMOS
2116 C3F721  JMP  21F7      ; { ไปทำ PROGRAM ต่อเฉพาะ IC ที่มีเบอร์เป็น
                          ; ตัวเลขล้วน ๆ
2119 23      INX  H       ; นำตัวเลขหลักที่ 4 มาตรวจ
211A 7E      MOV  A,M       ; นำค่าเลขตัวที่ 4 จาก MEMORY ไว้ที่ A

```

ตัวเลข

211B FE12 CPI 12 ; ตรวจสอบว่าเป็นตัว S หรือไม่  
211D CA2B21 JZ 212B ; ถ้าใช่ไปทำตามตารางของ IC ประเภท LS  
2120 C3C721 JMP 21C7 ; ไปทำคอตโปรแกรมตารางของ IC ประเภท L  
2123 D310 OUT 10 ; ส่งเสียง ALARM เสียง TONE เดียว  
2125 C3C920 JMP 20C9 ; กลับไปตรวจว่าคอต TEST มาหรือไม่

โปรแกรมตรวจคอต IC ประเภท LSxxx

2128 00 NOP ;  
2129 00 NOP ;  
212A 00 NOP ;  
212B 23 INX H ; เลื่อนเลขคอตไปหลังอักษร LS (=x1)  
212C 7E MOV A,M ; ย้ายข้อมูลจาก MEMORY เข้า A (A=X1)  
212D 4F MOV C,A ; SAVE A ไว้ที่ C  
212E E5 PUSH H ; SAVE HL ไว้ที่ M<sup>sp</sup>  
212F 11C00D LXI D,0DC0 ; LOAD POINTER ชีตาร้าง PROGRAM ของ IC  
; ที่จจะวิ่งไปทำการทดสอบ  
2132 21600D LXI H,0D60 ; LOAD POINTER ชีตาร้างเบอร์ ICพวก  
; 54/74LSXXX  
2135 7E MOV A,M ; เอาหมายเลขเบอร์ IC ในตารางมาเพื่อตรวจสอบ  
2136 FEFF CPI FF ; ตรวจสอบว่าเท่ากับค่า FF หรือไม่(หมดข้อมูลแล้ว)  
2138 CA4C26 JZ 264C ; ถ้าเท่ากับ 0 แจ้ง NO IC ไม่มี IC เบอร์นี้อยู่  
213B 47 MOV B,A ; ถ้าไม่เท่ากับ FF SAVE A ไว้ที่ B  
213C E6F0 ANI F0 ; MASK 4 BIT หน้า (D<sub>7</sub>-D<sub>4</sub>)  
213E 0F RRC ;  
213F 0F RRC ;  
2140 0F RRC ; }  
2141 0F RRC ; } เลื่อนข้อมูลจาก D<sub>7</sub>-D<sub>4</sub> เป็น D<sub>3</sub>-D<sub>0</sub>  
2142 B9 CMP C ; เปรียบเทียบเบอร์ IC (X<sub>1</sub>X<sub>2</sub>X<sub>3</sub>) ตัวแรก X<sub>1</sub>  
2143 CA4D21 JZ 214D ; เท่ากันตรวจเลขคอตไปอีก

2146 23	INX H	;	ถ้าไม่เท่าเลื่อนไปตรวจข้อมูลเบอร์ IC ถัดไป
2147 23	INX H	;	
2148 13	INX D	;	พร้อมเลื่อนข้อมูล PROGRAM. ทั่ว
2149 13	INX D	;	
214A C33521	JMP 2135	;	กลับไปตรวจใหม่ลักษณะเดิม
214D 78	MOV A,B	;	เอาข้อมูลเบอร์ IC ที่ SAVE ไว้มาเก็บที่ A
214E 44	MOV B,H	;	SAVE POINTER ข้อมูลเบอร์ IC
214F 4D	MOV C,L	;	
2150 E1	POP H	;	(เรียก POINTER ที่ข้อมูลเบอร์ IC ที่กดเข้ามา ของเกาติณมา)
2151 C5	PUSH B	;	SAVE ข้อมูลใน BC REGISTER
2152 23	INX H	;	เลื่อน POINTER ข้อมูลเลขถัดไป (=X <sub>2</sub> )
2153 4E	MOV C,M	;	เอาเลขเบอร์ (=X <sub>2</sub> ) ไปเก็บที่ C เพื่อไปเปรียบเทียบ
2154 E60F	ANI 0F	;	MASK ข้อมูลเอาเฉพาะ 4BIT หลัง (D <sub>3</sub> -D <sub>0</sub> )
2156 B9	CMP C	;	เปรียบเทียบว่าข้อมูลเบอร์ IC ตรงกับข้อมูลเบอร์ IC ที่กดเข้ามาหรือไม่
2157 CA7021	JZ 2170	;	ถ้าเท่ากันไปตรวจเลขถัดไปคือ X3
215A 2B	DCX H	;	ไม่เท่าถอยไปเลขเก่าก่อน X <sub>1</sub> เพื่อตรวจใหม่
215B 7E	MOV A,M	;	นำข้อมูลเบอร์ IC X <sub>1</sub> เก็บที่ A
215C C1	POP B	;	คืนค่า POINTER ข้อมูลเบอร์ IC กลับเข้า BC
215D E5	PUSH H	;	SAVE POINTER เบอร์ IC ที่กดเข้ามา
215E 60	MOV H,B	;	นำ POINTER ข้อมูลเบอร์ IC คืนที่เดิม
215F 69	MOV L,C	;	
2160 4F	MOV C,A	;	นำข้อมูลเบอร์ IC X <sub>1</sub> เก็บจาก A ไว้ที่ C
2161 C34621	JMP 2146	;	ไปตรวจข้อมูลเบอร์ IC ถัดไป
2164 E5	PUSH H	;	
2165 210023	LXI H,2300	;	
2168 4F	MOV C,A	;	
2169 0600	MVI B,00	;	

216B 09	DAD B	;	
216C 7E	MOV A,M	;	
216D E1	POP H	;	
216E C9	RET	;	
216F 00	NOP	;	
2170 23	INX H	;	เลื่อน POINTER ข้อมูลถัดไป (=X <sub>3</sub> )
2171 7E	MOV A,M	;	นำ X <sub>3</sub> ใน M เก็บที่ A
2172 FEFF	CPI FF	;	{เปรียบเทียบว่าเท่ากับ FF (หมดข้อมูลเบอร์ IC ทั้ง หมดที่มีอยู่แล้วตรวจหมดแล้วไม่พบ)}
2174 CA4C26	JZ 264C	;	ถ้าจบแล้ว(เท่ากับ FF)ไปแจ้งว่า NO IC
2177 C1	POP B	;	ถ้าไม่เท่าคืน POINTER ชื่อข้อมูลเบอร์ IC ที่ BC
2178 E5	PUSH H	;	SAVE POINTER ชื่อเบอร์ IC ที่กดเข้ามา
2179 60	MOV H,B	;	คืน POINTER ชื่อข้อมูลเบอร์ IC จาก BC เข้า HL
217A 69	MOV L,C	;	
217B 23	INX H	;	เลื่อนค่า POINTER ชื่อข้อมูลเบอร์ IC ถัดไป
217C 7E	MOV A,M	;	ย้ายข้อมูลเบอร์ IC จาก M มา A
217D 44	MOV B,H	;	SAVE POINTER ข้อมูลเบอร์ IC ที่ BC
217E 4D	MOV C,L	;	
217F E1	POP H	;	คืน POINTER ชื่อข้อมูลที่กดเข้ามา X <sub>3</sub>
2180 C5	PUSH B	;	SAVE POINTER ข้อมูลเบอร์ IC
2181 4E	MOV C,M	;	นำค่า M=X <sub>3</sub> เก็บใน C เพื่อเปรียบเทียบต่อไป
2182 47	MOV B,A	;	SAVE A ไว้ที่ B
2183 E6F0	ANI F0	;	MASK 4BIT หน้า (D <sub>7</sub> -D <sub>4</sub> )
2185 0F	RRC	;	เคลื่อนย้ายจาก 4 BIT หน้า (D <sub>7</sub> -D <sub>4</sub> ) เป็น 4 BIT หลัง (D <sub>3</sub> -D <sub>0</sub> )
2186 0F	RRC	;	
2187 0F	RRC	;	
2188 0F	RRC	;	
2189 B9	CMP C	;	{เปรียบเทียบว่าข้อมูลเบอร์ IC ในตารางกับข้อมูล - เบอร์ IC ที่กดเข้ามา
218A CAA021	JZ 21A0	;	ถ้าเท่ากับไปตรวจต่อไป

218D 2B	DCX H	; } { ไม่เท่าเลื่อนค่า POINTER ซี่เบอร์ IC ที่กดเข้า มากองหลังไป 2 ที
218E 2B	DCX H	
218F 7E	MOV A,M	; นำค่าเบอร์ IC ที่กดเข้ามาไว้ที่ A(A=X <sub>0</sub> )
2190 C1	POP B	; คืนค่า BC ที่ SAVE ไว้กลับที่เดิมซึ่งเก็บค่า POINTER ข้อมูลเบอร์ IC
2191 E5	PUSH H	; SAVE POINTER เบอร์ IC ที่กดเข้ามา
2192 60	MOV H,B	; } { คืน POINTER ซี่ข้อมูลเบอร์ IC จาก BC เข้ามาเก็บที่ HL ตามลำดับ
2193 69	MOV L,C	
2194 4F	MOV C,A	; SAVE ค่าเบอร์ IC ที่กดเข้ามาจาก A ไปเก็บที่ C
2195 C34721	JMP 2147	; กลับไปตรวจข้อมูลเบอร์ IC ถัดไปใหม่อีก
2198 FE16	CPI 16	; ตรวจสอบว่าเป็นปุ่ม CLEAR หรือไม่
219A CA4524	JZ 2445	; ถ้าใช่กลับไปเตรียม LED ทั้งหมดแล้วเริ่มต้นใหม่
219D C34B20	JMP 204B	; ส่งเสียง ALARM TONE ยาวและไปตรวจ KEYBOARD
21A0 23	INX H	; เลื่อน POINTER เบอร์ IC ที่กดเข้ามาเพิ่มอีก
21A1 7E	MOV A,M	; เคลื่อนย้ายค่าเบอร์ IC ที่กดเข้ามาไว้ที่ A
21A2 E60F	ANI 0F	; MASK 4 BIT หลัง (D <sub>3</sub> -D <sub>0</sub> )
21A4 C1	POP B	; คืน POINTER ซี่เบอร์ IC ใน TABLE ไว้ที่ BC
21A5 E5	PUSH H	; SAVE HL REGISTER
21A6 60	MOV H,B	; } { เปลี่ยน POINTER เป็นเบอร์ IC จากตาราง
21A7 69	MOV L,C	
21A8 4F	MOV C,A	; SAVE A (เบอร์ IC ที่กดเข้ามา) ไว้ที่ C
21A9 7E	MOV A,M	; นำข้อมูลเบอร์ IC จากตารางเข้าไว้ที่ A
21AA E60F	ANI 0F	; MASK 4 BIT หลัง (D <sub>3</sub> -D <sub>0</sub> )
21AC B9	CMP C	; เปรียบเทียบข้อมูลทั้งสอง
21AD CAC021	JZ 21C0	; ถ้าเท่ากันไป RUN PROGRAM ทดสอบ IC เบอร์นั้นได้
21B0 44	MOV B,H	; } { ถ้าไม่เท่ากัน SAVE POINTER ไว้ที่ BC
21B1 4D	MOV C,L	
21B2 E1	POP H	; คืนค่า POINTER เบอร์ IC ที่กดเข้ามา



21B3	C5	PUSH B	; SAVE POINTER เบอร์ IC จากตาราง
21B4	2B	DCX H	; ลดค่า POINTER เบอร์ IC ที่กดเข้ามา
21B5	C38D21	JMP 218D	; กลับไปตรวจใหม่
21B8	2B	DCX H	;
21B9	C38D21	JMP 218D	;
21BC	CA4C26	JZ 264C	;
21BF	C9	RET	;
21C0	EB	XCHG	; สลับที่ HL กับ DE
21C1	56	MOV D,M	; นำค่า ADDRESS ที่ PROGRAM(A <sub>15</sub> -A <sub>9</sub> ) ไว้ที่ D
21C2	23	INX H	; เพิ่มค่า POINTER ที่ ADDRESS PROGRAM อีก 1
21C3	5E	MOV E,M	; นำค่า ADDRESS ที่ PROGRAM (A <sub>8</sub> -A <sub>0</sub> )
21C4	EB	XCHG	; สลับที่ DE กับ HL
21C5	E9	PCHL	; ไปทำตามคำสั่งที่ HL ADDRESS ทดสอบเบอร์ IC นั้น ๆ
21C6	00	NOP	; NO OPERATE
21C7	7E	MOV A,M	; นำข้อมูลใน MEMORY เก็บที่ A
21C8	4F	MOV C,A	; นำข้อมูลใน A เก็บไว้ที่ C REGISTER
21C9	E5/	PUSH H	; SAVE HL
21CA	11300D	LXI D,0D30	; POINTER ที่ TABLE โปรแกรมที่จะทำตามคำสั่ง สำหรับเบอร์ IC 54/74Sxxx
21CD	21000D	LXI H,0D00	; POINTER ที่ TABLE เบอร์ IC ประเภท 54/74Sxxx
21D0	C33521	JMP 2135	; กลับไปตรวจเบอร์ IC
21D3	23	INX H	; เพิ่ม HL = HL + 1
21D4	4F	MOV C,M	;
21D5	E5	PUSH H	; SAVE HL
21D6	11B00C	LXI D,0CB0	; POINTER ที่ TABLE โปรแกรมที่จะทำตามคำสั่ง สำหรับเบอร์ IC 54/74Sxxx
21D9	21300C	LXI H,0C30	; POINTER ที่ TABLE เบอร์ IC ประเภท 54/74Sxxx
21DC	C33521	JMP 2135	; กลับไปตรวจเบอร์ IC

21DF 23	INX H	; เพิ่ม HL = HL + 1
21E0 4E	MOV C,M	;
21E1 E5	PUSH H	; SAVE HL
21E2 11700C	LXI D,0C70	; POINTER ชี้ TABLE โปรแกรมที่จะทำตามคำสั่ง ; สำหรับเบอร์ IC 54/74Hxxx
21E5 21000C	LXI H,0C00	; POINTER ชี้ TABLE เบอร์ IC ประเภท 54/74Cxxx
21E8 C33521	JMP 2135	; กลับไปตรวจเบอร์ IC
21EB 23	INX H	; เพิ่ม HL = HL + 1
21EC 4E	MOV C,M	;
21ED E5	PUSH H	; SAVE HL
21EE 11700E	LXI D,0E70	; POINTER ชี้ TABLE โปรแกรมที่จะทำตามคำสั่ง ; สำหรับเบอร์ IC 54/74Cxxx
21F1 21200E	LXI H,0E20	; POINTER ชี้ TABLE เบอร์ IC ประเภท 54/74Cxxx
21F4 C33521	JMP 2135	; กลับไปตรวจเบอร์ IC
21F7 4E	MOV C,M	;
21F8 E5	PUSH H	; SAVE HL
21F9 11700B	LXI D,0B70	; POINTER ชี้ TABLE โปรแกรมที่จะทำตามคำสั่ง ; สำหรับเบอร์ IC 54/74xxx
21FC 21000B	LXI H,0B00	; POINTER ชี้ TABLE เบอร์ IC ประเภท 54/74xxx
21FE C33521	JMP 2135	; กลับไปตรวจเบอร์ IC

โปรแกรมย่อย P 17

สำหรับ LOOK UP TABLE จาก HEX เป็น 7-SEGMENT DISPLAY

2202 E5	PUSH H	; SAVE HL
2203 C5	PUSH B	; SAVE BC
2204 21000F	LXI H,0F00	; POINTER ชี้ TABLE 7-SEGMENT DISPLAY ที่ ; ADDRESS 0F00
2207 4F	MOV C,A	; INPUT A เลข HEX เก็บไว้ที่ C
2208 0600	MVI B,00	; CLEAR B=00
220A 09	DAD B	; HL=HL+BC
220B 7E	MOV A,M	; เอาข้อมูลที่ได้จาก MEMORY เก็บไว้ที่ A ; ( A เป็น OUTPUT )
220C C1	POP B	; คืน BC ที่ SAVE ไว้

220D E1 PDP H ; คืน HL ที่ SAVE ไว้

220E C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 18

แสดงผลในรูปของเลขฐาน ๑๖ และ BINARY ทาง LED 2 DIGIT สำหรับ INPUT LOGIC -

-CONDITION ที่ DRIVE เข้า IC.

220F CDF920 CALL 20F9 ; เรียกโปรแกรมย่อย MASK เฉพาะ 4 BIT LOWER และแปลง CODE เป็น 7-SEGMENT

2212 D37B OUT 7B ; DISPLAY ออก LED 7-SEGMENT #7B (DIGIT16)<sup>0</sup>

2214 CD7420 CALL 2074 ; เรียกโปรแกรมย่อย MADK เฉพาะ 4 BIT UPPER และแปลง CODE เป็น 7-SEGMENT

2217 D37A OUT 7A ; DISPLAY ออก LED 7-SEGMENT #7A (DIGIT16)<sup>1</sup>

2219 78 MOV A,B ; B เก็บค่า INPUT LOGIC ที่เป็นเลข BINARY ส่งไปเก็บที่ A

221A D3C0 OUT C0 ; DISPLAY ออก 8255 ที่เป็นเลข BINARY PORT A, DEVICE #C0 (INPUT LOGIC DISPLAY)

221C C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 19

แสดงผล BINARY OUTPUT LOGIC ของภายใน IC ประเภท ๑ (พวกที่ลักษณะภายในแบบ 74๐๐)

221D 00 NOP ;

221E 00 NOP ;

221F 00 NOP ;

2220 F5 PUSH PSW ; SAVE A และ STATUS FLAG

2221 0F RRC ; ROTATE ไปทางขวา ๑ ครั้ง

2222 0F RRC ; ROTATE ไปทางขวา ๑ ครั้ง

2223 CD6922 CALL 2269 ; BINARY OUTPUT ออก PORT A , DEVICE #B0 (พร้อมออก 7-SEGMENT เป็นเลขฐาน ๑๖ ด้วย)

2226 F1 PDP PSW ; คืน A และ STATUS-FLAG ดังเดิม

2227 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 20

แสดงผลเป็น HEX. OUTPUT LOGIC, 1 DIGIT

2228 C5 PUSH B ; SAVE B C

2229 47 MOV B,A ; เอา A ไปเก็บใน B ( A เป็น BINARY )

```

222A CDF920 CALL 20F9 ; เรียกโปรแกรมย่อย MASK 4 BIT LOWER
; และ CODE เป็น 7-SEGMENT
222D D37F OUT 7F ; ส่ง OUTPUT ไปที่ LED 7-SEGMENT#7F
222F C1 PDP B ; คีน BC อย่างเต็ม
2230 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 21

SET GOOD FLAG และ DELAY นาน ๑ วินาที สำหรับทดสอบแบบ FAST/SLOW

```

2231 EB XCHG ; สลับ HL กับ DE
2232 36FF MVI M,FF ; เอาค่า FF ไปเก็บที่ M ( ถ้า IC ส่วนนั้นคือ
; ก็จะ SET เป็น FF = GOOD)
2234 CD4A23 CALL 234A ; เรียกโปรแกรมย่อย แสดงทาง LED ว่า GOOD และ
; DELAY นาน ๑ วินาที
2237 EB XCHG ; สลับ HL กับ DE
2238 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 22

SET BAD FLAG และ DELAY นาน ๑ วินาที สำหรับทดสอบแบบ FAST/SLOW

```

2239 EB XCHG ; สลับ HL กับ DE
223A 3600 MVI M,00 ; เอาค่า 00 ไปเก็บที่ M (ถ้า IC ส่วนนั้นเสีย
; ก็จะ SET เป็น 00 = BAD)
223C CD3E23 CALL 233E ; เรียกโปรแกรมย่อย แสดงทาง LED ว่า BAD และ
; DELAY นาน ๑ วินาที
223F EB XCHG ; สลับ HL กับ DE
2240 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 23

แสดงผล INPUT LOGIC ในลักษณะเลขฐาน 16 และ DRIVE LOGIC

เข้าขา INPUT ของ IC และรับผลกลับ

```

2241 CD0F22 CALL 220F ; เรียกโปรแกรมแสดงผลเลขฐาน 16 INPUT LOGIC
; ส่ง LOGIC เข้า INPUT ของขา IC ของ
2244 D3E0 OUT E0 ; GATE ส่วนที่กำลัส่งตรวจสอบ PORTA # E0
; รับผลกลับเข้าระบบ เพื่อนำไปประมวลผลที่ได้ 8255
2246 DBD0 IN D0 ; PORTA # D0
2248 C9 RET ;

```



โปรแกรมย่อย P 24

ตรวจสอบว่าที่ได้ตรงกับ DATA หรือไม่ SET FLAG GOOD -BAD และ DELAY นาน ๑ วินาที

2249 4E	MOV C,M	; เอา DATA ผลลัพธ์ที่ถูกต้องจาก TABLE ; เก็บไว้ที่ C
224A 91	SUB C	; เอา A=A-C (A=DATA จากผลลัพธ์ที่ไว้, C=DATA จริงที่ถูกต้อง)
224B CD5222	JNZ 2252	; ถ้าไม่เท่ากันก็เสีย (BAD) ไป SET BAD FLAG ; และ DELAY ๑ วินาที
224E CD3122	CALL 2231	; เรียกโปรแกรม SET GOOD FLAG และ ; DELAY นาน ๑ วินาที
2251 C9	RET	;
2252 CD3922	CALL 2239	; เรียกโปรแกรม SET BAD FLAG และ DELAY ; นาน ๑ วินาที
2255 C9	RET	;

โปรแกรมย่อย P 25

แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกันหรือไม่ตรวจสอบว่าทำครบ 4 CONDITION

2256 CD2022	CALL 2220	; แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT
2259 CD4922	CALL 2249	; ตรวจสอบว่าผลที่ได้ตรงกับ DATA หรือไม่, ; SET FLAG GOOD/BAD และ DELAY
225C 23	INX H	; เพิ่ม HL=HL+1, HL เก็บ ADDRESS POINTER ; ชี้ข้อมูลพวก TRUTH TABLE (OUTPUT LOGIC)
225D 13	INX D	; เพิ่ม DE=DE+1, DE POINTER ชี้ MEMORY ที่เก็บ ; ผลการตรวจสอบว่า GOOD หรือ BAD แต่ละ CONDITION
225E 78	MOV A,B	; B=INPUT LOGIC CONDITION ที่ DRIVE ; เข้าขา INPUT ของ IC เก็บที่ A
225F FE03	CPI 03	; เพื่อตรวจสอบว่าทำครบ 4 CONDITION หรือยัง
2261 C9	RET	;

โปรแกรมย่อย P 26

ถอย POINTER (HL) ที่ชี้ผลลัพธ์ที่ถูก ไปเริ่มต้นใหม่ < ตัว

และ SET INPUT LOGIC B=00 เริ่มใหม่

2262 2B	DCX H	; HL = HL - 1
2263 2B	DCX H	; HL = HL - 1
2264 2B	DCX H	; HL = HL - 1
2265 2B	DCX H	; HL = HL - 1

2266 0600 MVI B,00 ; SET B = 00

2268 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 27

แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ที่ LED และ HEX. LOGIC OUTPUT ที่ 7-SEGMENT

2269 D3B0 OUT B0 ; {แสดงผลออก LED 8255, PORT A, DEVICE # B0 (BINARY LOGIC OUTPUT)}

226B CD2822 CALL 2228 ; {แสดงผลออกทาง LED 7-SEGMENT เป็นเลขฐาน 16 (HEX)}

226E C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 28

ทดสอบ IC ประเภทที่ ๑ ส่วนที่ ๑ (PART 1) SOCKET#1

226F 00 NOP ;

2270 00 NOP ;

2271 3E06 MVI A,06 ; {SET ค่าA=(06)HEX เพื่อใหแสดงผลออก 7-SEGMENT เป็นเลข ๑}

2273 D377 OUT 77 ; {ส่งขอมูลจาก A=(06)HEX ออกไป LED 7 SEGMENT ติดเป็นเลข ๑}

2275 0600 MVI B,00 ; SET INPUT LOGIC B=00 CONDITION 00

2277 CD0F22 CALL 220F ; {แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เฉพาะเลขฐาน ๑๖}

227A 79 MOV A,B ; เอาค่าใน B เก็บไว้ที่ A

227B CD4422 CALL 2244 ; {DRIVE INPUT LOGIC เข้าขา IC และรับผลกลับ มาประมวล}

227E E604 ANI 04 ; MASK BIT ที่ 3(D3) OUTPUT ของ PART ที่ 1

2280 CD5622 CALL 2256 ; {ตรวจสอบว่าเท่าหรือไม่ ทดสอบจนครบ 4 CONDITION}

2283 C9 RZ ; ครบ 4 CONDITION แล้ว RETURN

2284 00 NOP ;

2285 00 NOP ;

2286 04 INR B ; ไม่ครบเพิ่มค่า INPUT LOGIC อีก ๑

2287 C37722 JMP 2277 ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 29

ทดสอบ IC ประเภทที่ ๑ ส่วนที่ ๒ (PART 2) SOCKET#1

228A	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า EA ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ ๑
228D	3E5B	MVI A,5B	; A=(5B)HEX="2" 7-SEGMENT
228F	D377	OUT 77	; { แสดงผลว่ากำลังทดสอบส่วนที่ ๒ (PART 2) 7-SEGMENT ดิจ.เลข "2"
2291	CD6222	CALL 2262	; { ถอยหลังกลับไป TRUTH TABLE เริ่มต้นใหม่ และ SET CONDITION แรกใหม่ =00
2294	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เฉพาะเลขฐาน
2297	78	MOV A,B	; { เคลื่อน INPUT LOGIC ที่จะขับเข้าขา IC จาก B ไว้ที่ A
2298	07	RLC	; } เคลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงกับขา IC
2299	07	RLC	
229A	07	RLC	
229B	CD4422	CALL 2244	; { DRIVE INPUT LOGIC เข้าขา IC และรับผล กลับมาประมวล MASK BIT ที่ 5(D5) OUTPUT ของ PART ที่ ๒
229E	E620	ANI 20	;
22A0	0F	RRC	; } เลื่อนผลที่ได้ให้ตรงกับข้อมูลใน TABLE
22A1	0F	RRC	
22A2	0F	RRC	
22A3	CD5622	CALL 2256	; { ตรวจสอบว่าผลที่ได้ต่างกับที่เป็นจริงหรือไม่, ตรวจสอบ ครบ 4 CONDITION
22A6	C8	RZ	; ถ้าครบการ TEST ทั้ง 4 CONDITION แล้ว RETURN
22A7	00	NOP	;
22A8	00	NOP	;
22A9	04	INR B	; { ถ้าไม่ครบ 4 condition ให้เพิ่ม B=B+1 คือ INPUT LOGIC STAGE ต่อไป
22AA	C39422	JMP 2294	; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 30

ทดสอบ IC ประเภทที่ ๑ ส่วนที่ ๓ (PART 3) SOCKET#1

22AD	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ ๒
22B0	3E4F	MVI A,4F	; { A=(4F)HEX ลักษณะตรงกับเลข "3" ของ 7-SEGMENT

```
22B2 D377      OUT  77      ; {แสดงผลทาง LED 7-SEGMENT เป็นเลข 3-  
                ; DEVICE#77  
22B4 CD6222    CALL 2262    ; {กอยหลังกลับไป TRUTH TABLE เริ่มต้นใหม่ และ  
                ; SET CONDITION  
22B7 CD0F22    CALL 220F    ; {แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เฉพาะเลขฐาน  
                ; ๑๖  
22BA 78        MOV  A,B     ; {เคลื่อน INPUT LOGIC ที่จะรับเข้าขา IC จาก  
                ; B ไว้ที่ A  
22BB 0F        RRC          ; }  
22BC 0F        RRC          ; }เคลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงขา IC  
22BD E680      ANI  80      ; MASK เอา BIT 7(D7) ออกไปใช้งาน  
22BF D3E0      OUT  E0      ; ส่ง LOGIC เข้าขา IC เพียง ๑ ขา (ขา ๔)  
22C1 78        MOV  A,B     ; {เคลื่อน INPUT LOGIC ที่จะรับเข้าขา IC จาก  
                ; B ไว้ที่ A  
22C2 E601      ANI  01      ; MASK เอา BIT 0(D0) ออกไปใช้งาน  
22C4 D3E1      OUT  E1      ; ส่ง LOGIC เข้าขา IC อีกขาหนึ่ง (ขา ๑๐)  
22C6 DBD0      IN   D0      ; รับ OUTPUT ที่ได้เข้าระบบ  
22C8 E640      ANI  40      ; MASK เอาเฉพาะ BIT 6 (D6)  
22CA 0F        RRC          ; }  
22CB 0F        RRC          ; }เคลื่อนผลที่ได้จาก OUTPUT ให้ตรงกับข้อมูลใน TABLE  
22CC 0F        RRC          ; }  
22CD 0F        RRC          ; }  
22CE CD5622    CALL 2256    ; {ตรวจสอบว่าผลที่ได้เท่ากับที่เป็นจริงหรือไม่, ตรวจสอบว่า  
                ; ครบ 4 CONDITION  
22D1 C3        RZ          ; {ถ้าครบการ TEST ทั้ง 4 CONDITION แล้ว RETURN  
22D2 00        NOP        ;  
22D3 00        NOP        ;  
22D4 04        INR  B       ; {ถ้าไม่ครบ 4 CONDITION ให้เพิ่ม B=B+1 คือ  
                ; INPUT LOGIC STAGE ต่อไป  
22D5 C3B722    JMP  22B7    ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป
```

โปรแกรมย่อย P 31

ทดสอบ IC ประเภทที่ ๑ ส่วนที่ ๔ (PART 4) SOCKET#1

```
22D3 CD4A24    CALL 244A    ; SET ค่า 'EA' นี้นำมาผลการทดสอบ PART ที่ ๓
```



```

22DB CDFC22      CALL 22FC      ; CLEAR LOGIC INPUT ที่ค้างอยู่ที่ PORT
                  ; ให้เป็น 0
22DE 3E66        MVI  A,66      ; SET A=(66)HEX=เลข ๔ ของ 7-SEGMENT
22E0 D377        OUT  77      ; แสดงผลทาง LED 7-SEGMENT เป็นเลข ๔,
                  ; DEVICE#77
22E2 CD6222      CALL 2262      ; ถอดหลังกลับไป TRUTH TABLE เริ่มต้นใหม่ และ
                  ; SET CONDITION แรกใหม่
22E5 CD0F22      CALL 220F      ; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เฉพาะเลขฐาน 16
22E8 CD5B23      CALL 235B      ; เรียกโปรแกรมช่วยทดสอบ PORT ที่ 4 เรืองของ
                  ; INPUT LOGIC
22EB D3E1        OUT  E1      ; ส่ง LOGIC เข้าขา IC ทดสอบ (DEVICE#E1)
22ED DBD1        IN   D1      ; รับผลที่ได้กลับ ทาง DEVICE#D1
22EF E602        ANI  02      ; MASK เอา BIT ที่ 1(D1)
                  ; เลื่อน OUTPUT ที่ได้โดยตรงกับข้อมูลใน TABLE
22F1 07          RLC          ;
22F2 CD5622      CALL 2256      ; ตรวจสอบว่าผลที่ได้เท่ากับที่เป็นจริงหรือไม่, ตรวจสอบ
                  ; ว่าครบ 4 CONDITION
22F5 CA5423      JZ   2354      ; ถ้าครบ การทดสอบไปทำการปิดท้ายผลลัพธ์ด้วย EE
                  ; และ CLEAR PORT แล้ว RETURN กลับไป
22F8 04          INR  B        ; ถ้าไม่ครบ 4 CONDITION ให้เพิ่ม B=B+1 คือ
                  ; INPUT LOGIC STAGE ต่อไป
22F9 C3E522      JMP  22E5      ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

```

โปรแกรมย่อย P 32

CLEAR LOGIC INPUT ที่ค้างอยู่ที่ PORT ให้เป็น 0

```

22FC 3E00        MVI  A,00      ; A = 00
22FE D3E0        OUT  E0      ; CLEAR PORT A, DEVICE # E0
2300 D3E1        OUT  E1      ; CLEAR PORT B, DEVICE # E1
2302 D3E2        OUT  E2      ; CLEAR PORT C, DEVICE # E2
2304 C9          RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 33

CLEAR INPUT/OUTPUT BINARY-DISPLAY

```

2305 00          NOP          ;
2306 00          NOP          ;

```

```
2307 00      NOP      ;
2308 00      NOP      ;
2309 3E00    MVI   A,00    ; SET A = 00
230B D3B0    OUT   B0     ;
230D D3B1    OUT   B1     ; CLEAR BINARY INPUT LOGIC
230F D3B2    OUT   B2     ;
2311 D3C0    OUT   C0     ;
2313 D3C1    OUT   C1     ; CLEAR BINARY OUTPUT LOGIC
2315 D3C2    OUT   C2     ;
2317 C9      RET      ;
```

โปรแกรมย่อย P 34 -

CLEAR LED 7-SEGMENT ที่แสดง BAD PART, DEVICE # 78-7F ตามลำดับ

```
2318 3E00    MVI   A,00    ; SET A = 00
231A D378    OUT   78     ; CLEAR 7-SEGMENT # 78
231C D379    OUT   79     ; CLEAR 7-SEGMENT # 79
231E D37A    OUT   7A     ; CLEAR 7-SEGMENT # 7A
2320 D37B    OUT   7B     ; CLEAR 7-SEGMENT # 7B
2322 D37C    OUT   7C     ; CLEAR 7-SEGMENT # 7C
2324 D37D    OUT   7D     ; CLEAR 7-SEGMENT # 7D
2326 D37E    OUT   7E     ; CLEAR 7-SEGMENT # 7E
2328 D37F    OUT   7F     ; CLEAR 7-SEGMENT # 7F
232A C9      RET      ;
```

โปรแกรมย่อย P 35

CLEAR LED 7-SEGMENT ที่แสดงเบอร์ IC ตั้งแต่ #70-77 ตามลำดับ

```
232B 3E00    MVI   A,00    ; SET A = 00
```

```

232B D370      OUT  70      ; CLEAR 7-SEGMENT # 70
232F D371      OUT  71      ; CLEAR 7-SEGMENT # 71
2331 D372      OUT  72      ; CLEAR 7-SEGMENT # 72
2333 D373      OUT  73      ; CLEAR 7-SEGMENT # 73
2335 D374      OUT  74      ; CLEAR 7-SEGMENT # 74
2337 D375      OUT  75      ; CLEAR 7-SEGMENT # 75
2339 D376      OUT  76      ; CLEAR 7-SEGMENT # 76
233B D377      OUT  77      ; CLEAR 7-SEGMENT # 77
233D C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 36

แสดงผลทาง LED ว่า BAD และ DELAY นาน ๑ วินาที

```

233E F5        PUSH PSW      ; SAVE A และ STATUS FLAG
233F 3E01      MVI  A,01      ; SET ค่า A=01 (ตรงกับ DATA BIT ที่ D0="1")
2341 D300      OUT  00      ; (ส่ง OUT ไทลอด LED ดิจ (LED นี้จะมีอักษร
                          ; (กำกับว่า BAD)
2343 D310      OUT  10      ; พร้อมทั้งส่งเสียงออกมา 1 TONE
2345 F1        POP  PSW      ; คืน A และ STATUS FLAG, กลับไปอย่างเดิม
2346 CDE420    CALL 20E4     ; เรียกโปรแกรมย่อย DELAY นาน ๑ วินาที
2349 C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 37

แสดงผลทาง LED ว่า GOOD และ DELAY นาน ๑ วินาที

```

234A F5        PUSH PSW      ; SAVE A และ STATUS FLAG
234B 3E02      MVI  A,02      ; SET ค่า A=02 (ตรงกับ DATA BIT ที่ 1
                          ; D1="1")
234D D300      OUT  00      ; (ส่ง OUT ไทลอด LED ดิจ (LED นี้จะมีอักษร
                          ; (กำกับว่า GOOD)
234F F1        POP  PSW      ; คืน A และ STATUS FLAG, กลับไปอย่างเดิม
2350 CDE420    CALL 20E4     ; เรียกโปรแกรมย่อย DELAY นาน ๑ วินาที
2353 C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P38

SET คำปิดท้าย เมื่อทำการตรวจสอบเสร็จสิ้นทุก PART แล้วและรายงานผล

2354 CDCF25 CALL 25CF ; SET 'EE' ปิดท้ายผลลัพธ์ที่ได้และ CLEAR PORT  
2357 CD6E23 CALL 236E ; รายงานผลทั้งหมดว่า GOOD หรือ BAD  
235A C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P39

โปรแกรมช่วยในการทดสอบ PART 4 ของ IC ประเภทที่ ๑

235B 78 MOV A,B ; เคลื่อน INPUT LOGIC ที่จะขับเข้าขา IC จาก B ไว้ที่ A  
235C 07 RLC ;  
235D 07 RLC ; เลื่อน LOGIC CONDITION ให้ตรงกับขา INPUT  
235E 07 RLC ; ของ IC ขา 13  
235F E608 ANI 08 ; MASK เฉพาะ BIT ที่ 3(D<sub>3</sub>) ขา IC ขาที่ 13  
2361 4F MOV C,A ; SAVE LOGIC ที่จะ DRIVE ขา 13ไว้ก่อนที่ C  
2362 78 MOV A,B ; เอา INPUT LOGIC เข้ามาใหม่ที่ A  
2363 07 RLC ; เลื่อน LOGIC CONDITION ให้ตรงกับขา INPUT ของ IC ขา 12  
2364 E604 ANI 04 ; MASK เฉพาะ BIT ที่ 2(D<sub>2</sub>) ขา IC ที่ 12  
2366 B1 ORA C ; รวมผล LOGIC ที่จะ DRIVE เข้า IC เข้าด้วย  
; ก่อน DRIVE  
2367 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P40

ROTATE RIGHT CARRY

2368 0F RRC ;  
2369 0F RRC ;  
236A 0F RRC ;  
236B 0F RRC ;  
236C 0F RRC ;  
236D C9 RET ;

```
236E CD0B24 CALL 240B ; CLEAR MEMORY ที่แสดงผล BAD PART และ  
; LED 7 SEGMENT # 78-7F  
2371 CD5F24 CALL 245F ; CLEAR FLAG GOOD/BAD และ CLEAR I/O BINARY  
; DISPLAY  
2374 D377 OUT 77 ; CLEAR LED7-SEGMENT#77  
2376 216010 LXI H,1060 ; POINTERชี้จุดเริ่มต้นผลลัพธ์ในการทดสอบแต่ละPART  
2379 0601 MVI B,01 ; SET B=01 บอกให้ทราบว่า เป็น PART 1  
237B 7E MOV A,M ; เอาผลลัพธ์มาทดสอบ  
237C FE00 CPI 00 ; เปรียบเทียบ=00 หรือไม่ (00 = BAD)  
237E C28B23 JNZ 238B ; ถ้าไม่เท่ากับ 00 ไปตรวจต่อที่ 238B  
2381 78 MOV A,B ; ถ้า BAD เอาค่า 01 ใน B ไปเก็บใน A  
2382 CD0222 CALL 2202 ; LOOK UP TABLE จาก HEX เป็น 7-SEGMENT DISPLAY  
2385 CDA423 CALL 23A4 ; เอาค่าที่ได้เก็บใน MEMORY ที่ตรงกับ PART นั้น ๆ  
2388 C35524 JMP 2455 ; SET FLAG GOOD/BAD ว่า BAD และทดสอบ  
; ผลที่ได้ต่อไป  
  
238B FEEA CPI EA ; ตรวจว่าจบ PART หรือยัง  
238D CA9923 JZ 2399 ; ถ้าหมด PART แล้วตรวจผล PART ต่อไป  
2390 FEEE CPI EE ; ตรวจว่าถึง PART สุดท้ายหรือยัง  
2392 CA9E23 JZ 239E ; ถ้าถึง PART สุดท้าย แสดงผลทาง 7-SEGMENT  
; ว่ามีส่วนใดเสีย  
2395 23 INX H ; เพิ่มค่า HL = HL + 1  
2396 C37B23 JMP 237B ; กลับไปทดสอบว่า GOOD หรือ BAD ต่อไป  
  
2399 04 INR B ; เพิ่ม B = B+1  
239A 23 INX H ; เพิ่มค่า HL = HL + 1  
239B C37B23 JMP 237B ; กลับไปทดสอบว่า GOOD หรือ BAD ต่อไป
```

239E D320           OUT   20           ส่งเสียงว่า สรุปผลได้ดังนี้ (เสียง 4 STEP)  
23A0 CD2224       CALL 2422       ;สรุปผลโดยแสดงผลทาง LED7 - SEGMENT  
23A3 C9            RET            ;

โปรแกรมย่อย P41

PART ใดเสียก็จะเอาค่ามันไปเก็บใน MEMORY ที่ตรงกับ PART นั้น ๆ

23A4 F5            PUSH PSW       ; SAVE Au ละ FLAG  
23A5 E5            PUSH H         ; SAVE HL  
23A6 FE06         CPI   06       ; ตรวจสอบว่าเป็น PART1 ที่เสียใช่หรือไม่(06=PART1)  
23A8 CAD323       JZ   23D3       ; ถ้าใช่เอาค่า 06 เก็บใน MEMORY ที่ 4A09  
23AB FE5B         CPI   5B       ; ตรวจสอบว่าเป็นPART2ที่เสียใช่หรือไม่(5B=PART2)  
23AD CADA23       JZ   23DA       ; ถ้าใช่เอาค่า5B เก็บใน MEMORY ที่ 4E0A  
23B0 FE4F         CPI   4F       ; {ตรวจสอบว่าเป็น PART 3 ที่เสียใช่หรือไม่  
                  ; (4F=PART3)  
23B2 CAE123       JZ   23E1       ; ถ้าใช่เอาค่า4F เก็บใน MEMORY ที่ 4E0B  
23B5 FE66         CPI   66       ; ตรวจสอบว่าเป็นPART4 ที่เสียใช่หรือไม่(66=PART4)  
23B7 CAE823       JZ   23E8       ; ถ้าใช่เอาค่า 66เก็บในMEMORY ที่ 4E0C  
23BA FE6D         CPI   6D       ; ตรวจสอบว่าเป็นPART5 ที่เสียใช่หรือไม่(6D=PART5)  
23BC CAEF23       JZ   23EF       ; ถ้าใช่เอาค่า 6D เก็บใน MEMORY ที่ 4E0D  
23BF FE7D         CPI   7D       ; ตรวจสอบว่าเป็น PART6ที่เสียใช่หรือไม่(7D=PART6)  
23C1 CAF623       JZ   23F6       ; ถ้าใช่เอาค่า 7D เก็บใน MEMORY ที่ 4E0E  
23C4 FE07         CPI   07       ; ตรวจสอบว่าเป็นPART7 ที่เสียใช่หรือไม่ (07=PART7)  
23C6 CAFD23       JZ   23FD       ; ถ้าใช่เอาค่า 07 เก็บใน MEMORY ที่ 4E0F  
23C9 FE7F         CPI   7F       ; ตรวจสอบว่าเป็น PART8ที่เสียใช่หรือไม่(7F=PART8)  
23CB CA0424       JZ   2404       ; ถ้าใช่เอาค่า 7F เก็บใน MEMORY ที่ 4E10  
23CE D310         OUT   10       ; ส่งเสียง ERROR สำหรับว่าตรวจแล้วไม่เจอ  
                  ; PART ที่แจ้งว่าเสีย  
23D0 C35A23       JMP  235A       ; RETURN

โปรแกรมย่อย P42

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 1 ที่ (4E09)

```
23D3 21094E LXI H,4E09 ; ENTRY POINT ของ PART 1 ที่ 4E09
23D6 77 MOV M,A ;
23D7 E1 POP H ;
23D8 F1 POP PSW ;
23D9 C9 RET ;
```

โปรแกรมย่อย P43

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 2 ที่ (4E0A)

```
23DA 210A4E LXI H,4E0A ; ENTRY POINT ของ PART 1 ที่ 4E0A
23DD 77 MOV M,A ;
23DE E1 POP H ;
23DF F1 POP PSW ;
23E0 C9 RET ;
```

โปรแกรมย่อย P44

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 3 ที่ (4E0B)

```
23E1 210B4E LXI H,4E0B ; ENTRY POINT ของ PART 1 ที่ 4E0B
23E4 77 MOV M,A ;
23E5 E1 POP H ;
23E6 F1 POP PSW ;
23E7 C9 RET ;
```

โปรแกรมย่อย P45

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 4 ที่ (4E0C)

23E8	210C4E	LXI	H,4E0C	;ENTRY POINT ของ PART 1 ที่ 4E0C
23EB	77	MOV	M,A	;
23EC	E1	POP	H	;
23ED	F1	POP	PSW	;
23EE	C9	RET		;

โปรแกรมย่อย P46

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 5 ที่ (4E0D)

23EF	210D4E	LXI	H,4E0D	; ENTRY POINT ของ PART 5 อยู่ที่ 4E0D
23F2	77	MOV	M,A	;
23F3	E1	POP	H	;
23F4	F1	POP	PSW	;
23F5	C9	RET		;

โปรแกรมย่อย P47

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 6 ที่ (4E0E)

23F6	210E4E	LXI	H,4E0E	; ENTRY POINT ของ PART 6 อยู่ที่ 4E0E
23F9	77	MOV	M,A	;
23FA	E1	POP	H	;
23FB	F1	POP	PSW	;
23FC	C9	RET		;



โปรแกรมย่อย P48

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 7 ที่ (4E0F)

23ED 210F4E LXI H,4E0F ; ENTRY POINT ของ PART 7 ที่ 4E0F  
2400 77 MOV M,A ;  
2401 F1 POP H ;  
2402 F1 POP PSW ;  
2403 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P49

เอาผลที่ได้เก็บไว้ใน MEMORY PART 8 ที่ (4E10)

2404 21104E LXI H,4E10 ; ENTRY POINT ของ PART 8 อยู่ที่ 4E10  
2407 77 MOV M,A ;  
2408 E1 POP H ;  
2409 F1 POP PSW ;  
240A C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P50

CLEAR MEMORY ที่แสดงผลส่วนที่เสีย (BAD PART) และ CLEAR LED7-SEGMENT#78-7E

240B F5 PUSH PSW ; SAVE A<sub>cc</sub> และ FLAG  
240C E5 PUSH H ; SAVE HL  
240D C5 PUSH B ; SAVE BC  
240E 0608 MVI B,08 ; B เก็บจำนวน DIGIT=8DIGITของ7-SEGMENT  
2410 21094E LXI H,4E09 ; POINTER ข้อมูล BAD PART DISPLAY เริ่มที่ 4E09  
2413 3E00 MVI A,00 ; SET A = 00  
2415 77 MOV M,A ;  
2416 23 INX H ; CLEAR MEMORY ทั้ง 8ที่ตั้งแอด 4E09-4E10  
2417 05 DCR B ;

2418 C21524 JNZ 2415 ;  
241B CD1823 CALL 2318 ; CLEAR LED7-SEGMENT DISPLAY, DIVICE#78-7F  
241E C1 POP B ; คีน BC  
241F E1 POP H ; คีน HL  
2420 F1 POP PSW ; คีน A และ FLAG  
2421 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 51

แสดงผลว่าส่วนใดเสีย (BAD PART) หรือ GATE ใดเสียทาง LED 7-SEGMENT

2422 21094E LXI H,4E09 ; POINTER ที่จุดเริ่มต้นของ MEMORY PART  
ที่เก็บผลไว้ว่าดีหรือเสีย  
2425 7E MOV A,M ;  
2426 D378 OUT 78 ; 7-SEGMENT # 78 แสดง PART ที่ 1  
2428 23 INX H ; จ MEMORY ถัดไป (4E0A)  
2429 7E MOV A,M ;  
242A D379 OUT 79 ; 7-SEGMENT # 79 แสดง PART ที่ 2  
242C 23 INX H ; จ MEMORY ถัดไป (4E0B)  
242D 7E MOV A,M ;  
242E D37A OUT 7A ; 7-SEGMENT # 7A แสดง PART ที่ 3  
2430 23 INX H ; จ MEMORY ถัดไป (4E0C)  
2431 7E MOV A,M ;  
2432 D37B OUT 7B ; 7-SEGMENT # 7B แสดง PART ที่ 4  
2434 23 INX H ; จ MEMORY ถัดไป (4E0D)  
2435 7E MOV A,M ;  
2436 D37C OUT 7C ; 7-SEGMENT # 7C แสดง PART ที่ 5  
2438 23 INX H ; จ MEMORY ถัดไป (4E0E)  
2439 7E MOV A,M ;  
243A D37D OUT 7D ; 7-SEGMENT # 7D แสดง PART ที่ 6



243C 23 INX H ; จ MEMORY (4E0F)  
 243D 7E MOV A,M ;  
 243E D37E OUT 7E ; 7-SEGMENT # 7E แสดง PART ที่ 7  
 2440 23 INX H ; จ MEMORY ตกไป (4E10)  
 2441 7E MOV A,M ;  
 2442 C36A24 JMP 246A ; ไปทำต่อที่ 246A

โปรแกรมย่อย P52

CLEAR LED GOOD/BAD แล้วกลับไปเริ่มต้น PROGRAM ใหม่

2445 D350 OUT 50 ; CLEAR LED แสดงผล GOOD/BAD  
 2447 C30020 JMP 2000 ; กลับไปเริ่มต้นโปรแกรมใหม่

โปรแกรมย่อย P53

SETค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบแต่ละ PART

244A EB XCHG ; สลับ HL กับ DE  
 244B 36EA MVI M,EA ; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายข้อมูลเมื่อทดสอบหมด  
 244D 23 INX H ; เพิ่ม HL = HL + 1  
 244E EB XCHG ; สลับ HL กลับ DE  
 244F C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P54

SETค่า EE เพื่อปิดท้ายผลการทดสอบสุดท้าย

2450 EB XCHG ; สลับ HL กับ DE  
 2451 36EE MVI M,EE ; SET ค่า 'EE' ปิดท้ายข้อมูล ผลทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบ  
 2453 EB XCHG ; สลับ HL กับ DE  
 2454 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 55

SET FLAG ที่ 4 FFC ซึ่งแสดง BAD = (FF)HEX

2455 E5            PUSH H            ; SAVE HL  
2456 21FC4F       LXI H,4FFC       ; FLAG GOOD/BAD อยู่ที่ 4FFC  
2459 36FF           MVI M,FF        ; SET เป็น FF (แสดงว่า BAD)  
245B E1            POP H            ; คืน HL  
245C C39A23       JMP 239A        ; กลับไปทดสอบ PART ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 56

CLEAR FLAG ที่ 4FFC ซึ่งแสดง GOOD หรือ BAD และ CLEAR BINARY DISPLAY ทั้งหมด

245F E5            PUSH H            ; SAVE HL  
2460 21FC4F       LXI H,4FFC       ; FLAG GOOD/BAD อยู่ที่ 4FFC  
2463 3600           MVI M,00        ; CLEAR FLAG M4FFC = 00  
2465 E1            POP H            ; คืน HL  
2466 CD0923       CALL 2309       ; CLEAR INPUT และ OUTPUT BINARY DISPLAY  
2469 C9            RET              ;

โปรแกรมย่อย P 57

ช่วยแสดง PART ที่เสียหาย LED # SEGMENT และแสดงผลทาง LED ว่า GOOD/BAD

246A D37E           OUT 7E           ; 7-SEGMENT # 7F แสดง PART ที่ 8  
246C 21FC4F       LXI H,4FFC       ; PIONTER FLAG GOOD/BAD  
246E 7E            MOV A,M        ; เขามาตรวจสอบเก็บไว้ที่ A  
2470 FEFF           CPI FF           ; ตรวจสอบว่า BAD หรือไม่ (FF = BAD)  
2472 C27E24       JNZ 247E        ; ถ้าไม่ BAD แสดงผลว่า GOOD  
2475 3E01           MVI A,01        ; ถ้า BAD แสดงผลว่า BAD, SET A=01 (ตรงกับ D<sub>0</sub>)  
2477 D300           OUT 00           ; แสดงผลทาง LED ว่า BAD  
2479 D310           OUT 10           ; ส่งเสียง 1TONE ยาว  
247B C38224       JMP 2482        ; ไปตรวจว่าจะทดสอบต่อหรือไม่โดยตรวจทาง KEYBOARD

โปรแกรมย่อย P 58

แสดงผลว่า GOOD ทาง LED และกลับไปตรวจว่าจะทดสอบต่อหรือไม่ โดยตรวจ KEYBOARD

```

247E 3E02      MVI  A,02      ; SET A = 02 (ตรงกับ D1)
2480 D300      OUT  00      ; แสดงผลที่หลอด LED ว่า GOOD
2482 CD0028    CALL 2800      ; ดูว่ากด KEYBOARD อะไรเข้ามา
2485 FE15      CPI   15      ; ตรวจว่าจะทดสอบต่อหรือไม่ (เป็น CONTINUE)
2487 CACB25    JZ   25CB      ; ถ้าต้องการทดสอบต่อไป CLEAR 7-SEGMENT BAD
                                   ; PART DISPLAY ทั้งหมดแล้วรอคำสั่ง TEST
248A FE16      CPI   16      ; ตรวจว่า กดปุ่ม CLEAR หรือไม่
248C CA4524    JZ   2445      ; ถ้ากดปุ่ม CLEAR กลับไปเริ่มต้น PROGRAM ใหม่
248F D310      OUT  10      ; ส่งเสียง ERROR กด KEY ผิด 1TONE ยาว
2491 C38224    JMP  2482      ; จนรอว่ากดปุ่มอะไรต่อไป
2494 C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 59

SET PIN IC 14 ขา , ขา INPUT/ ขา OUTPUT = 1/2, 3/4, 5/6, 9/8, 11/10, 13/12

```

IC ประเภทที่ 2 SOCKET#1
2495 3E6A      MVI  A,6A      ;
2497 D3F0      OUT  F0      ; ส่ง OUTPUT ออกไปทาง PORT A # F0
2499 3E05      MVI  A,05      ;
249B D3F1      OUT  F1      ; ส่ง OUTPUT ออกไปทาง PORT B # F1
249D C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 60

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 1

```

249E 3E06      MVI  A,06      ; '06' = เลข 1
24A0 D377      OUT  77      ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77
24A2 C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 61

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 2

```
24A3 3E5B      MVI  A,5B      ; '5B' = เลข 2
24A5 D377      OUT   77        ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77
24A7 C9        RET                    ;
```

โปรแกรมย่อย P 62

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 3

```
24A8 3E4F      MVI  A,4F      ; '4F' = เลข 3
24AA D377      OUT   77        ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77
24AC C9        RET                    ;
```

โปรแกรมย่อย P 63

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 4

```
24AD 3E66      MVI  A,66      ; '66' = เลข 4
24AF D377      OUT   77        ; แสดงผล 7 - SEGMENT # 77
24B1 C9        RET                    ;
```

โปรแกรมย่อย P 64

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 5

```
24B2 3E6D      MVI  A,6D      ; '6D' = เลข 5
24B4 D377      OUT   77        ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77
24B6 C9        RET                    ;
```

โปรแกรมย่อย P 65

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 6

```
24B7 3E7D      MVI  A,7D      ; '7D' = เลข 6
```

24B9 D377 OUT 77 ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77

24BB C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P66

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 7

24BC 3E07 MVI A,07 ; '07' = เลข 7

24BE D377 OUT 77 ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77

24C0 C9 RET ;

24C1 3E3E MVI A,3E ; '3E' = เลข 6

24C3 07 RLC ;

24C4 D377 OUT 77 ;

24C6 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P67

แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 8

24C7 3E7F MVI A,7F ; '7F' = เลข 8

24C9 D377 OUT 77 ; แสดงผล 7-SEGMENT # 77

24CB C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P68

แสดงผล BINARY และ HEX ที่ 7-SEGMENT และตรวจสอบผลตรงกับ TRUTH TABLE หรือไม่

24CC F5 PUSH PSW ; SAVE A และ FLAG

24CD CD6922 CALL 2269 ; {แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ที่ LED และ HEX LOGIC OUTPUT ที่ 7-SEGMENT

24D0 F1 POP PSW ; คืน A และ FLAG

24D1 CD4922 CALL 2249 ; {ตรวจสอบว่าผลที่ได้อตรงกับ DATA หรือไม่ SET FLAG GOOD/BAD และ DELAY นาน ๐ วินาที (0วินาที)

24D4 C3C525 JMP 25C5 ; ไปตรวจว่าทำครบ 2 CONDITION ทั้งหมดหรือยัง ↗

โปรแกรมย่อย P69

ถอยหลังกลับไป DATA เริ่มต้นใหม่และ SET INPUT LOGIC เริ่มต้นที่ 00 ใหม่

```

24D7 2B          DCX  H          ; } ถอยหลังกลับไป DATA จาก TRUTH TABLE -
24D8 2B          DCX  H          ; } เริ่มใหม่อีก
24D9 0600        MVI  B,00        ; SET CONDITION แรกใหม่คือ 00
24DB C9          RET              ;

```

โปรแกรมย่อย P 70

ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC และรับผลกลับ

```

24DC D3E1        OUT  E1         ; } ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC เพื่อทดสอบ,
24DE DBD1        IN   D1         ; } DIVICE # E1
24E0 C9          RET              ;

```

โปรแกรมย่อย P 71

CLEAR 7-SEGMENT, DIVICE 77-7F และ CLEAR INPUT/OUTPUT BINARY DISPLAY

```

24E1 116010      LXI  D,1060      ; POINTER ชี้ที่เก็บผลการทดสอบเริ่มต้นที่จุดนี้
24E4 CD1823      CALL 2318      ; CLEAR LED 7-SEGMENT, DIVICE # 78-7F
24E7 CD0923      CALL 2309      ; CLEAR INPUT/OUTPUT BINARY DISPLAY
24EA D377        OUT  77          ; CLEAR 7-SEGMENT, DIVICE # 77
24EC C9          RET              ;

```

โปรแกรมย่อย P 72

ทดสอบ IC ประเภทที่ 2 ส่วนที่ 1 (PART 1) SOCKET #1

```

24ED CD9E24      CALL 249E      ; แสดงทาง 7-SEGMENT เป็นเลข 1 (PART 1)
24F0 0600        MVI  B,00          ; CONDITION แรกคือ 0
24F2 CD0F22      CALL 220F      ; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
24F5 78          MOV  A,B          ; ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไว้ที่ A

```



24F6	CD4422	CALL 2244	; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
24F9	E602	ANI 02	; MASK เอา BIT ที่ 1 (D1)
24FB	0F	RRC	; (เลื่อน DATA ให้ตรงกับ TRUTH TABLE (ทางขวา ๑ ครั้ง)
24FC	CDCC24	CALL 24CC	; (แสดงผล BI/HEX OUTPUT LOGIC , ทดสอบ ; ว่าผลที่ได้ถูกต้องหรือไม่
24FF	CA0625	JZ 2506	; (ถ้าทำการทดสอบครบทุก CONDITION แล้วทดสอบ ; PART ที่ 2 ต่อไป
2502	04	INR B	; ไม่ครบเปลี่ยน INPUT LOGIC ขึ้นต่อไป
2503	C3F224	JMP 24F2	; กลับไปทดสอบ CONDITION ใหม่ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 73

ทดสอบ IC ประเภทที่ 2 ส่วนที่ 2 (PART 2) SOCKET #1

2506	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ 1 แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART ที่ 2
2509	CDA324	CALL 24A3	;
250C	CDD724	CALL 24D7	; ถอยหลังกลับไป DATA เริ่มต้นใหม่และ SET CONDITION แรกเป็น 0
250F	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2512	78	MOV A, B	; ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไปที่ A แล้วเตรียมส่งออก
2513	07	RLC	; } เลื่อนข้อมูลให้ตรงกับขา IC
2514	07	RLC	; } (ทางซ้าย ๒ ครั้ง)
2515	CD4422	CALL 2244	; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
2518	E608	ANI 08	; MASK เอา BIT ที่ 3 (D3)
251A	0F	RRC	; } เลื่อนข้อมูลเพื่อให้ตรงกับ TRUTH TABLE
251B	0F	RRC	; } (ทางขวา ๓ ครั้ง)
251C	0F	RRC	; }
251D	CDCC24	CALL 24CC	; (แสดงผล BI/HEX OUTPUT LOGIC, ทดสอบว่าผล ; ที่ได้ถูกต้องหรือไม่
2520	CA2725	JZ 2527	; (ถ้าทำการทดสอบครบทุก CONDITION แล้วทดสอบ ; PART ที่ 3 ต่อไป
2523	04	INR B	; ไม่ครบเปลี่ยน INPUT LOGIC ขึ้นต่อไป
2524	C30F25	JMP 250F	; กลับไปทดสอบ CONDITION ใหม่ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 74

ทดสอบ ICประเภทที่ 2 ส่วนที่ 3 (PART 3) SOCKET#1

2527	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ 2
252A	CDA824	CALL 24A8	; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART ที่ 3
252D	CDB724	CALL 24D7	; { ถอยหลังกลับไป DATA เริ่มต้นใหม่และ SET CONDITION แรกเป็น 0
2530	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2533	78	MOV A,B	; { ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไว้ที่ A เพื่อเตรียมส่งออก
2534	07	RLC	; } เลื่อนข้อมูลให้ตรงกับขา IC (ทางซ้าย ๔ ครั้ง)
2535	07	RLC	
2536	07	RLC	
2537	07	RLC	
2538	CD4422	CALL 2244	; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
253B	E320	ANI 20	; MASK เอา BIT ที่ 5 (D <sub>5</sub> )
253D	07	RLC	; } เลื่อนข้อมูลเพื่อให้ตรงกับ TRUTH TABLE (ทางซ้าย ๓ ครั้ง)
253E	07	RLC	
253F	07	RLC	
2540	CDCC24	CALL 24CC	; { แสดงผล BI/HEX OUTPUT LOGIC, ทดสอบว่าผลที่ได้ออกตรงหรือไม่
2543	CA4A25	JZ 254A	; { ถ้าทำการทดสอบครบทุก CONDITION แล้วทดสอบ PART ที่ 3 ต่อไป
2546	04	INR B	; ไม่ครบเปลี่ยน INPUT LOGIC ขึ้นต่อไป
2547	C33025	JMP 2530	; กลับไปทดสอบ CONDITION ใหม่ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 75

ทดสอบ ICประเภทที่ 2 ส่วนที่ 4 (PART 4) SOCKET#1

254A	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ 3
254D	CDAD24	CALL 24AD	; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART ที่ 4
2550	CDD724	CALL 24D7	; { ถอยหลังกลับไป DATA เริ่มต้นใหม่และ SET CONDITION แรกเป็น 0
2553	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2556	78	MOV A,B	; { ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไว้ที่ A เพื่อเตรียมส่งออก

2557 0F	RRC		; เลื่อนข้อมูลให้ตรงกับขา IC (ทางขวา ๑ ครั้ง)
2558 CD4422	CALL 2244		; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
255B E640	ANI 40		; MASK เอา BIT ที่ 6 (D) 6
255D 07	RLC		; } เลื่อนข้อมูลที่ได้อีกให้ตรงกับ TRUTH TABLE
255E 07	RLC		; } (ทางซ้าย ๒ ครั้ง)
255F CDCC24	CALL 24CC		; { แสดงผล BI/HEX OUTPUT LOGIC, ทดสอบว่า ผลที่ได้ถูกต้องหรือไม่
2562 CA6925	JZ 2569		; { ถ้าทำการทดสอบครบทุก CONDITION แล้วทดสอบ PART ที่ 5 ต่อไป
2565 04	INR B		; ไม่ครบเปลี่ยน INPUT LOGIC ขึ้นต่อไป
2566 C35325	JMP 2553		; กลับไปทดสอบ CONDITION ใหม่ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 76

ทดสอบ IC ประเภทที่ 2 ส่วนที่ 5 (PART 5) SOCKET#1

2569 CDFC22	CALL 22FC		; CLEAR LOGIC ที่ค้างอยู่ที่ PORT ให้หมดไป
256C CD4A24	CALL 244A		; SETค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ 4
256F CDB224	CALL 24B2		; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART ที่ 5
2572 CDD724	CALL 24D7		; { ถอยหลังกลับไปดู DATA เริ่มต้นใหม่ และ SET CONDITION แรกเป็น 0
2575 CD0E22	CALL 220F		; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2578 78	MOV A,B		; { ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไว้ที่ A เพื่อ เตรียมส่งออก
2579 07	RLC		; เลื่อนข้อมูลให้ตรงกับขา IC (ทางซ้าย ๑ ครั้ง)
257A CD0C24	CALL 240C		; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
257D E601	ANI 01		; MASK เอา BIT ที่ 0 (D) 0
257E CDCC24	CALL 24CC		; { แสดงผล BI/HEX OUTPUT LOGIC, ทดสอบว่าผลที่ได้ ที่ถูกต้องหรือไม่
2582 CA8925	JZ 2589		; { ถ้าทำการทดสอบครบทุก CONDITION แล้วทดสอบ PART ที่ 6 ต่อไป
2585 04	INR B		; ไม่ครบเปลี่ยน INPUT LOGIC ขึ้นต่อไป
2586 C37525	JMP 2575		; กลับไปทดสอบ CONDITION ใหม่ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 77

ทดสอบประเภทที่ ๒ ส่วนที่ ๖ (PART-5) SOCKET # 1

2589	CDFC22	CALL 22FC	; CLEAR LOGIC ที่ค้างอยู่ที่ PORT ให้หมดไป
258C	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบ PART ที่ 5
258F	CDB724	CALL 24B7	; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART ที่ 6
2592	CDD724	CALL 24D7	; { ถอยหลังกลับไปดู DATA เริ่มต้นใหม่และ SET CONDITION แรกเป็น 0
2595	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2598	78	MOV A,B	; { ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไว้ที่ A เพื่อเตรียมส่งออก
2599	07	RLC	; }
259A	07	RLC	; } เลื่อนข้อมูลให้ตรงกับขา IC
259B	07	RLC	; } (ทางซ้าย ๓ ครั้ง)
259C	CDDC24	CALL 24DC	; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
259F	E604	ANI 04	; MASK เอา BIT ที่ 2 (D <sub>2</sub> )
25A1	0F	RRC	; } เลื่อนข้อมูลที่ได้ออกตรงกับ TRUTH TABLE
25A2	0F	RRC	; } (ทางขวา ๒ ครั้ง)
25A3	CDCC24	CALL 24CC	; { แสดงผล BI/HEX OUTPUT LOGIC, ทดสอบว่าผลที่ได้ถูกต้องหรือไม่
25A6	CA5423	JZ 2354	; { ถ้าทำการทดสอบครบทุก CONDITION แล้ว SET ค่า EE ปิดท้ายและสรุปผลต่อไป
25A9	04	INR B	; ไม่ครบเปลี่ยน INPUT LOGIC ขึ้นต่อไป
25AA	C39525	JMP 2595	; กลับไปทดสอบ CONDITION ใหม่ต่อไป
25AD	00	NOP	;
25AE	00	NOP	;
25AF	00	NOP	;
25B0	00	NOP	;
25B1	00	NOP	;
25B2	00	NOP	;
25B3	00	NOP	;
25B4	CDE124	CALL 24E1	; { CLEAR 7-SEGMENT, DEVICE 77-7F และ CLEAR I/O BINARY DISPLAY
25B7	CDE626	CALL 26E6	; ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET # 1 เช่น 7400
25BA	C9	RET	;

25BB 00	NOP	;	
25BC 00	NOP	;	
25BD 00	NOP	;	
25BE 00	NOP	;	
25BF CD9524	CALL 2495	;	SET PIN ขา IC ประเภทที่ 2
25C2 C3DA20	JMP 20DA	;	{ แสดง LED ดิจิตที่ SOCKET#1, แสดง READY ; ตรวจสอบว่ากดปุ่ม SLOW หรือไม่

โปรแกรมย่อย P 78

ตรวจสอบผลว่าวงจร CONDITION หรือยัง ของ IC ประเภทที่ 2

25C5 23	INX H	;	HL = HL + 1
25C6 13	INX D	;	DE = DE + 1
25C7 78	MOV A,B	;	เอาค่า INPUT LOGIC เก็บที่ A เพื่อเปรียบเทียบ
25C8 FE01	CPI 01	;	เปรียบเทียบว่า INPUT LOGIC เป็น 01 หรือยัง
25CA C9	RET	;	

โปรแกรมย่อย P 79

CLEAR LOGIC DRIVE และ CLEAR BAD PART DISPLAY

25CB CD1823	CALL 2318	;	ไป CLEAR LED -7 SEGMENT BAD PART
25CE C9	RET	;	

โปรแกรมย่อย P 80

SET ค่า 'EE' ทำการทดสอบทั้งหมด และ CLEAR INPUT DRIVER

25CF CD5024	CALL 2450	;	SET ค่า 'EE' ปิดท้ายผลลัพธ์ที่วิเคราะห์แล้ว
25D2 CDFC22	CALL 22FC	;	CLEAR LOGIC OUTPUT ที่ค้างอยู่ที่ PORT ให้เป็น 0
25D5 C9	RET	;	



โปรแกรมย่อย P 81

โปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ 2 SOCKET ที่ #1 ได้นัก 7404 05, 06, 14, 16

25D6 CDBF25 CALL 25BF ; SET ขา IC SOCKET #1 และตรวจว่ากอนอะไรเข้ามา  
 25D9 21240F LXI H, 0F24 ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE DATA OUTPUT  
 25DC CDE124 CALL 24E1 ; CLEAR DISPLAY  
 25DF CDED24 CALL 24ED ; เริ่มทดสอบ 7404,  
 25E2 C3D625 JMP 25D6 ; กลับไปตรวจว่าจะทดสอบต่อหรือไม่

โปรแกรมย่อย P 82

โปรแกรมทดสอบ IC ประเภทที่ 2 SOCKET ที่ #1 ได้นัก 7407, 117

25E5 CDBF25 CALL 25BF ; SET ขา IC SOCKET #1 และตรวจว่ากอน  
 { TEST/CLEAR/CONT/SLOW  
 25E8 21260F LXI H, 0F26 ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE DATA OUTPUT  
 25EB CDE124 CALL 24E1 ; CLEAR DISPLAY  
 25EE CDED24 CALL 24ED ; เริ่มทดสอบ 7407, 117  
 25F1 C3E525 JMP 25E5 ; กลับไปตรวจว่าจะทดสอบต่อหรือไม่

โปรแกรมย่อย P 83

SET ขา IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ #1 ได้นัก 7402

25F4 CD7726 CALL 2677 ; SET ขา IC  
 { แสดง READY และตรวจว่ากอน TEST หรือ  
 25F7 CDDA20 CALL 20DA ; CLEAR หรือ SLOW  
 25FA C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P 84

รองรับการกด KEY เบอร์ IC เข้ามา ถ้าเข้ามาแล้วตรวจว่าเป็นไม่ใด เก็บข้อมูลที่ LOOK UP

TABLE ที่ได้ไว้ใน A สำหรับแสดงผลทาง 7-SEGMENT DISPLAY

25FB 00 NOP ;  
 25FC 00 NOP ;  
 25FD 00 NOP ;

25FE 00	NOP	;	
25FF E5	PUSH H	;	SAVE HL
2600 CD0028	CALL 2800	;	รอกกด KEY อะไรเข้ามา
2603 0600	MVI B,00	;	เมื่อกด KEY เข้ามาแล้ว CLEAR B
2605 FE13	CPI 13	;	X'13=19=19KEY ตรวจสอบว่าจะเกิน 19 KEYหรือไม่
2607 D26526	JNC 2665	;	{ ถ้า มากกว่า ((13) HEX ไปตรวจว่าเป็น KEY โดกดเข้ามา
260A 21000F	LXI H,0E00	;	ถ้า น้อยกว่า (13) HEX POINTER ชี้ตารางข้อมูล
260D 4F	MOV C,A	;	} LOOK UP TABLE
260E 09	DAD B	;	
260F 7E	MOV A,M	;	เอาข้อมูลจากตารางไว้ที่ A
2610 E1	POP H	;	คืน HL กลับที่เดิม
2611 C9	RET	;	

โปรแกรมย่อย P 85

ROTATE ทางซ้าย ๔ ครั้ง

2612 07	RLC	;	
2613 07	RLC	;	
2614 07	RLC	;	
2615 07	RLC	;	
2616 07	RLC	;	
2617 C9	RET	;	
2618 FE16	CPI 16	;	ตรวจสอบว่าเป็นปุ่ม CLEAR หรือไม่
261A CA4C26	JZ 264C	;	{ ถ้ากดปุ่ม CLEAR ไป CLEAR DISPLAY และ SET MEMORY
261B FE17	CPI 17	;	ตรวจสอบว่าเป็นปุ่ม ENTER หรือไม่
261F CA2320	JZ 2023	;	ถ้ากดปุ่ม ENTER ไปเข้า PROGRAM ตรวจสอบเบอร์ I
2622 C9	RET	;	

โปรแกรมย่อย P86

SET MEMORY DISPLAY ให้เป็น FF ทุก ๆ LOCATION จาก 4E00 ถึง 4E07

และเลข DISPLAY DIGIT #0-7

2623	E5	PUSH H	; SAVE HL ไว้
2624	D5	PUSH D	; DAVE DE ไว้
2625	F5	PUSH PSW	; SAVE A และ FLAG
2626	1608	MVI D,08	; COUNTER INDEX 8 จำนวน (8 DIGIT)
2628	21004E	LXI H,4E00	; POINTER MEMORY LOCATION 4E00
262B	36FF	MVI M,FF	; ค่าที่จะ SET ใน MEMORY =FF
262D	23	INX H	; เพิ่ม HL = HL + 1
262F	15	DCR D	; ลดค่า D = D - 1
262F	C22B26	JNZ 262B	; ถ้าไม่ครบ 8 กลับไปทำต่อที่ 262B ถ้าครบทำคำสั่งต่อไป
2632	F1	POP PSW	; คืน A และ FLAG กลับที่เดิมจากที่ SAVE เอาไว้
2633	D1	POP D	; คืน DC ที่ SAVE เอาไว้
2634	E1	POP H	; คืน HL ที่ SAVE
2635	F5	PUSH PSW	; SAVE A และ FLAG
2636	3E00	MVI A,00	; SET A = 00
2638	D370	OUT 70	; CLEAR LED 7-SEGMENT # 70
263A	D371	OUT 71	; CLEAR LED 7 - SEGMENT # 71
263C	D372	OUT 72	; CLEAR LED 7-SEGMENT # 72
263E	D373	OUT 73	; CLEAR LED 7-SEGMENT # 73
2640	D374	OUT 74	; CLEAR LED 7-SEGMENT # 74
2642	D375	OUT 75	; CLEAR LED 7-SEGMENT # 75
2644	D376	OUT 76	; CLEAR LED 7-SEGMENT # 76
2646	CD5226	CALL 2652	; เริ่ม PROGRAM กับ LED 7-SEGMENT#77 ถึง 7F
2649	00	NOP	;
264A	F1	POP PSW	; คืน A และ FLAG
264B	C9	RET	;



```

264C CD2326 CALL 2623 ; SET MEMORY = FF ตั้งแต่ 4E00 ถึง 4E07 และ
                          CLEAR DISPLAY 70-76
264F C30427 JMP 2704 ; ตรวจ KEYBOARD ว่าถูกกดเบอร์ IC เบอร์อะไร
                          เข้ามาพร้อม DISPLAY ทาง 7-SEGMENT ด้วย
                          ถ้าไม่มีการกด CPU จะรออยู่

2652 D377 OUT 77 ; คับ LED 7-SEGMENT # 77
2654 D378 OUT 78 ; คับ LED 7-SEGMENT # 78
2656 D379 OUT 79 ; คับ LED 7-SEGMENT # 79
2658 D37A OUT 7A ; คับ LED 7-SEGMENT # 7A
265A D37B OUT 7B ; คับ LED 7-SEGMENT # 7B
265C D37C OUT 7C ; คับ LED 7-SEGMENT # 7C
265E D37D OUT 7D ; คับ LED 7-SEGMENT # 7D
2660 D37E OUT 7E ; คับ LED 7-SEGMENT # 7E
2662 D37F OUT 7F ; คับ LED 7-SEGMENT # 7F
2664 C9 RET ;
2665 0000 NOP ;
2667 000000 NOP ;
266A FE14 CPI 14 ; ตรวจสอบว่าเป็นปุ่ม ENTER ไขหรือไม่
266C CA9826 JZ 2698 ; ถ้าไขไปเตรียมทดสอบแจ้ง READY
266F 0000 NOP ;
2671 000000 NOP ;
2674 C31826 JMP 2618 ; ถ้าไม่ไขกลับไป ตรวจสอบที่เป็นปุ่ม CLEAR หรือ TEST
                          ไขหรือไม่
    
```

โปรแกรมย่อย P87

SETขา IC 14 ขาขา INPUT/OUTPUT = 2,3/1; 5,6/4; 8,9/10; 11,12/13

```

2677 3E09 SOCKET#1 ประเภทที่ 3 MVI A,09 ; 
                          ๙ ๘ ๖ ๕ ๓ ๒
                          ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
2679 D3F0 OUT F0 ; ส่ง OUTPUT 13 ไปที่ PORT A#F0
267B 3E09 MVI A,09 ; 
                          ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓
267D B3F1 OUT F1 ; ส่ง OUTPUT 12 ไปที่ PORT A # F1
267F C9 RET ;
    
```

2680 0000	NOP	;	
2682 0000	NOP	;	
2684 0000	NOP	;	
2686 E1	POP H	;	SAVE HL
2687 71	MOV M,C	;	
2688 CD0028	CALL 2800	;	รอรับผลจาก KEY BOARD ว่ากดอะไรเข้ามา
268B FE16	CPI 16	;	ถ้ามีตรวจว่าเป็นปุ่ม CLEAR เข้ามาหรือไม่
268D CA4C26	JZ 264C	;	{ ถ้าเป็นปุ่ม CLEAR ไป CLEAR DISPLAY และ SET MEMORY
2690 FE17	CPI 17	;	ตรวจว่าเป็นปุ่ม TEST หรือไม่
2692 CA2320	JZ 2023	;	ถ้าเป็นปุ่ม TEST ก็ไป DECODE เบอร์ IC ที่ กดเข้ามา
2695 C38826	JMP 2698	;	ถ้าไม่ใช่กลับโปรว่าจะกดปุ่ม CLEAR หรือ TEST
2698 0000	NOP	;	
269A 0000	NOP	;	
269C 0000	NOP	;	
269E 000000	NOP	;	
26A1 0000	NOP	;	
26A3 0000	NOP	;	
26A5 0000	NOP	;	
26A7 000000	NOP	;	

โปรแกรมย่อย P 88

ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET ที่ # 1 ได้แก่ 7408, 74132 (NAND GATE)

26AA CDD720	CALL 20D7	;	{ SET ขา IC สำหรับ 7408, 74132 และ ตรวจ KEYBOARD
26AD 21280F	LXI H,0F28	;	POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F28
26B0 CDB425	CALL 25B4	;	ทดสอบ IC 7408, 74132
26B3 C3AA26	JMP 26AA	;	{ กลับไปรอดูว่าจะทดสอบขาต่ออีกหรือ CLEAR หรือ CONT. หรือ SLOW TEST

โปรแกรมย่อย P89

ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET ที่ # 1 ได้นก 7432 (OR GATE)

26B6 CDD720 CALL 20D7 ; { SET ขา IC สำหรับ 7432 และตรวจ  
KEYBOARD

26B9 212C0F LXI H,0F2C ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F2C

26BC CDB425 CALL 25B4 ; ทดสอบ IC 7432

26BF C3B626 JMP 26B6 ; { กลับไปรอดูว่าจะทดสอบซ้ำต่ออีก (COUNT) หรือ  
CLEAR หรือ SLOW TEST

โปรแกรมย่อย P90

ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET ที่ # 1 ได้นก 7486 (EXCLUSIVE - OR GATE)

26C2 CDD720 CALL 20D7 ; { SET ขา IC สำหรับ 7486 และตรวจ  
KEYBOARD

26C5 21300F LXI H,0F30 ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F30

26C8 CDB425 CALL 25B4 ; ทดสอบ IC 7486

26CB C3C226 JMP 26C2 ; { กลับไปรอดูว่าจะทดสอบซ้ำต่ออีก CONT. หรือ  
CLEAR หรือ SLOW TEST

โปรแกรมย่อย P91

ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET ที่ #1 ได้นก 74125 (6 TRI - STATE INVERTER)

26CE CDD720 CALL 20D7 ; { SET ขา IC สำหรับ 74125 และตรวจ  
KEYBOARD

26D1 21340F LXI H,0F34 ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F34

26D4 CDB425 CALL 25B4 ; ทดสอบ IC 74125

26D7 C3CE26 JMP 26CE ; { กลับไปรอดูว่าจะทดสอบซ้ำต่ออีก (CONT) หรือ  
CLEAR หรือ SLOW TEST

โปรแกรมย่อย P92

ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET ที่ #1 ได้นก 74126 (6TRI - STATE BUFFER)

26DA CDD720 CALL 20D7 ; SET ขา IC สำหรับ 74126 และตรวจ KEYBOARD

26DD 21380F LXI H,0F38 ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F38

26E0 CDB425 CALL 25B4 ; ทดสอบ IC 74126

26E3 C3DA26 JMP 26DA ; { กลับไปรอดูว่าจะทดสอบซ้ำต่ออีก (CONT) หรือ  
CLEAR หรือ SLOW TEST

โปรแกรมย่อย P93

ทดสอบ IC ประเภทที่ ๑ SOCKET # 1 โคนกั 74๐๐, 74132

26E6 CD7122 CALL 2271 ; ทดสอบส่วนที่ 1 (PART 1)

26E9 CD8A22 CALL 228A ; ทดสอบส่วนที่ 2 (PART 2)

26EC CDAD22 CALL 22AD ; ทดสอบส่วนที่ 3 (PART 3)

26EF CDD822 CALL 22D8 ; ทดสอบส่วนที่ 4 (PART 4)

26F2 C9 RET ;

โปรแกรมย่อย P94

ทดสอบ IC เบอร์ 74๐๐, 74132

26F3 CDB720 CALL 20D7 ; { SET ขา IC สำหรับ 74๐๐, 74132 และ  
; ตรวจ KEYBOARD

26F6 21200F LXI H, 0F20 ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F20

26F9 CDE124 CALL 24E1 ; CLEAR 7-SEGMENT, CLEAR DISPLAY BINARY

26FC CDE626 CALL 26E6 ; ทดสอบ 74๐๐, 74132

26FF C3F326 JMP 26E3 ; { กลับไปรอดูว่าจะทดสอบซ้ำต่ออีก (CONT) หรือ  
; SLOW หรือ TEST

โปรแกรมย่อย P95

รอรับเบอร์ IC ที่กดเข้ามาและแสดงผลทาง 7-SEGMENT พร้อมกับเก็บข้อมูลเบอร์ IC ที่ได้ไว้ใน MEMORY

2702 00 NOP ;

2703 00 NOP ;

2704 21004E LXI H, 4E00 ; POINTER ชี้ที่เก็บ DATA เมื่อ KEY เบอร์ IC เข้ามา

2707 CD3527 CALL 2735 ; { รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน  
; MEMORY ADDR 4E00

270A D370 OUT 70 ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT #70

270C CD3527 CALL 2735 ; { รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน  
; MEMORY ADDR 4E01

270F D371 OUT 71 ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT #71

2711 CD3527 CALL 2735 ; { รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน  
; MEMORY ADDR 4E02

2714 D372 OUT 72 ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT #72

```

2716 CD3527      CALL 2735      ; {รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน
                  ; MEMORY ADDR 4E03
2719 D373        OUT 73         ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT #73
271B CD3527      CALL 2735      ; {รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน
                  ; MEMORY ADDR 4E04
271E D374        OUT 74         ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT #74
2720 CD3527      CALL 2735      ; {รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน
                  ; MEMORY ADDR 4E05
2723 D375        OUT 75         ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT # 75
2725 CD3527      CALL 2735      ; รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน
                  ; MEMORY ADDR 4E06
2728 D376        OUT 76         ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT #76
272A CD3527      CALL 2735      ; {รอการกด KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน
                  ; MEMORY ADDR 4E07
272D D377        OUT 77         ; {แสดงผลทาง 7-SEGMENT #77
272F CDFF25      CALL 25FF      ; {รอการกด KEY เข้ามาอันสุดท้าย ถ้ากดก็จะ
2732 C30020      JMP 2000      ; กลับไปเริ่มต้น โปรแกรม ใหม่หมด

```

โปรแกรมย่อย P06

รอการกด KEY เข้ามา, เก็บข้อมูลลง MEMORY พร้อมกับ LOOK UP TABLE สำหรับ

7-SEGMENT DISPLAY และเลือก MEMORY ถัดไป

```

2735 CDFF25      CALL 25FF      ; {รอการกด KEY ใดเข้ามาแล้ว LOOK UP TABLE
                  ; ใด CODE ใหม่สำหรับ 7-SEGMENT DISPLAY
2738 71         MOV M,C       ; {เมื่อมีการกด KEY เข้ามาก่อน LOOK UP TABLE
                  ; ไว้ใน MEMORY (เบอร์ IC )
2739 23         INX H         ; HL = HL + 1
273A C9         RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P07

SET ขา IC ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKETที่ #1ได้นก 7402

```

273B CDF425      CALL 25F4      ; SET ขา IC สำหรับ 7402
273E 213C0F      LXI H,0F3C    ; POINTER ชี้ TRUTH TABLE ที่ 0F3C
2741 CDE124      CALL 24E1      ; CLEAR 7-SEGMENT, CLEAR DISPLAY BINARY
2744 CDE527      CALL 27E5      ; ทดสอบ 7402
2747 C33B27      JMP 273B      ; {กลับไปรอดูว่าจะทดสอบซ้ำอีก (CONT) หรือ
                  ; CLEAR หรือ SLOW TEST

```

โปรแกรมย่อย P08

PROGRAM DELAY 1 SEC.

274A 00	NOP	;
274B 00	NOP	;
274C 00	NOP	;
274D E5	PUSH H	; SAVE HL
274E C5	PUSH B	; SAVE BL
274F D5	PUSH D	; SAVE DE
2750 26B0	MVI H,B0	; SETค่าH=B0 (สามารถADJUST DELAY TIME ได้)
2752 2E02	MVI L,02	; SET ค่าL=02
2754 4C	MOV C,H	; C=B0
2755 0605	MVI B,05	; B=05
2757 1668	MVI D,68	; D=68
2759 1EC1	MVI E,C1	; E=C1
275B 1D	DCR E	; E=E-1
275C C25B27	JNZ 275B	; ถ้า E≠00 ให้กลับไปที่ 275B
275F 15 ( (	DCR D	; D=D-1
2760 C25927	JNZ 2759	; ถ้า D≠00 ให้กลับไปที่ 2759
2763 05	DCR B	; B=B-1
2764 C25727	JNZ 2757	; ถ้า B≠00 ให้กลับไปที่ 2757
2767 2D	DCR L	; L=L-1
2768 C25527	JNZ 2755	; ถ้า L≠00 ให้กลับไปที่ 2755
276B D1	POP D	; คืน DE
276C C1	POP B	; คืน BC
276D E1	POP H	; คืน HL
276E C9	RET	;

โปรแกรมย่อย P99

ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 1 (PART 1)

276F	CD9E24	CALL 249E	; แสดง PART ที่ ทาง 7-SEGMENT #77
2772	0600	MVI B,00	; CLEAR B=00 เป็น DATA INPUT เริ่มต้น 00
2774	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2777	78	MOV A,B	; { ส่ง LOGIC CONDITION จาก B ไวที่ A เพื่อเตรียมส่งออก.
2778	07	RLC	; เลื่อนข้อมูลให้ตรงกับขา IC (ทางซ้าย ๑ ครั้ง).
2779	CD4422	CALL 2244	; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ
277C	E601	ANI 01	; MASK เอา BIT ที่ 0 (D <sub>0</sub> )
277E	07	RLC	; } เลื่อนข้อมูลเพื่อให้ตรงกับ TRUTH TABLE
277F	07	RLC	; } (ทางซ้าย ๒ ครั้ง)
2780	CD5622	CALL 2256	; { แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ตรวจสอบผลที่ได้อาจตรงกันหรือไม่ ตรวจสอบว่าทำครบ 4 CONDITION
2783	C8	RZ	; ถ้าครบ 4 CONDITION ก็จะ RETURN
2784	04	INR B	; ไม่ครบเลื่อนไปทดสอบ CONDITION ถัดไป
2785	C37427	JMP 2774	; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

โปรแกรมย่อย P100

ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 2 (PART 2)

2788	CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลทดสอบ PART ที่ 1
278B	CDA324	CALL 24A3	; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่า เป็น PART 2
278E	CD6222	CALL 2262	; { ถอยหลังกลับไป TRUTH TABLE เริ่มต้นใหม่และ SET CONDITION ใหม่
2791	CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
2794	78	MOV A,B	; ค่าใน B เก็บที่ A
2795	07	RLC	; }
2796	07	RLC	; } เลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงขา IC
2797	07	RLC	; } (ทางซ้าย ๔ ครั้ง)
2798	07	RLC	; }

2799 CD4422 CALL 2244 ; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC และรับผลกลับ  
279C E608 ANI 08 ; MASK เอา BIT ที่ 3 (D<sub>3</sub>)  
279E 0F RRC ; เลื่อนผลที่ได้ให้ตรงกับ TRUTH TABLE  
279F CD5622 CALL 2256 ; { แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ตรวจสอบผลที่  
ได้ว่าตรงกันหรือไม่  
27A2 C8 RZ ; { ตรวจสอบว่าทำครบ 4 CONDITION  
ถ้าครบ 4 CONDITION ก็จะ RETURN  
27A3 04 INR B ; ไม่ครบเลื่อนไปทดสอบ CONDITION ถัดไป  
27A4 C39127 JMP 2791 ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

โปรแกรมย่อย P101

ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 3 (PART 3)

27A7 CD4A24 CALL 244A ; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลทดสอบ PART ที่ 1  
27AA CDA824 CALL 24A8 ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 3  
27AD CD6222 CALL 2262 ; { ถอยหลังกลับไปดู TRUTH TABLE เริ่มต้นใหม่  
และ SET CONDITION แรกใหม่  
27B0 CD0F22 CALL 220F ; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16  
27B3 78 MOV A,B ; ค่าใน B เก็บที่ A  
27B4 0F RRC ; } เลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงขา IC  
27B5 0F RRC ; } (ทางขวา ๒ ครั้ง)  
27B6 D3E0 OUT E0 ; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC  
27B8 DBD1 IN D1 ; รับผลกลับ  
27BA E601 ANI 01 ; MASK BIT ที่ 0 (D<sub>0</sub>)  
27BC 07 RLC ; } เลื่อน LOGIC OUTPUT ที่ได้ให้ตรงกับ -  
27BD 07 RLC ; } -TRUTH TABLE  
27BE CD5622 CALL 2256 ; { แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ตรวจสอบผล  
ที่ได้ว่าตรงกันหรือไม่ ตรวจสอบว่าทำครบ 4 CONDITION  
27C1 C8 RZ ; ถ้าครบ 4 CONDITION ก็จะ RETURN  
27C2 04 INR B ; ไม่ครบเลื่อนไปทดสอบ CONDITION ถัดไป  
27C3 C3B027 JMP 27B0 ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป





โปรแกรมย่อย P 102

ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 4 (PART 4)

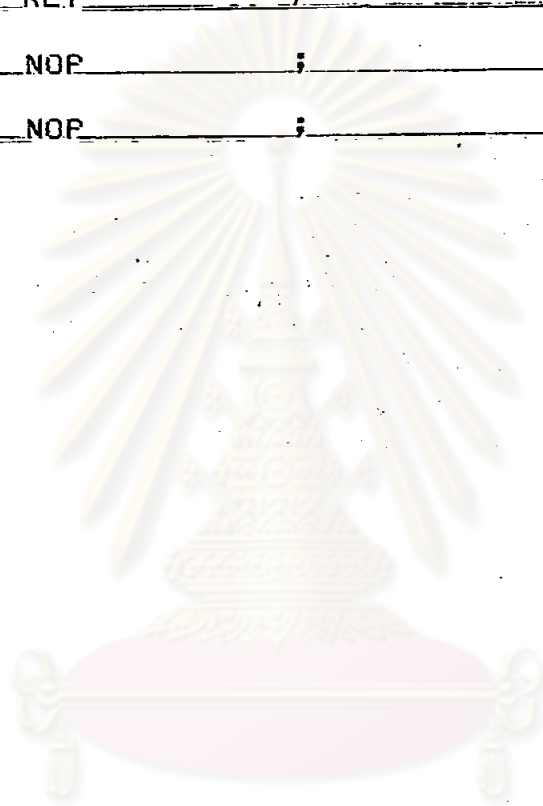
27C6 CD4A24	CALL 244A	; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลทดสอบ PART ที่ 1
27C9 CDAB24	CALL 24AD	; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART:4
27CC CD6222	CALL 2262	; { ถอยหลังกลับไปดู TRUTH TABLE เริ่มต้นใหม่และ SET CONDITION แรกใหม่
27CF CD0F22	CALL 220F	; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED เป็นเลขฐาน 16
27D2 78	MOV A,B	; ค่าใน B เก็บที่ A
27D3 07	RLC	; { เลื่อน INPUT LOGIC ไตรตรงขา IC (ทางซ้าย ๑ ครั้ง)
27D4 D3E1	OUT E1	; ส่ง LOGIC DRIVE เข้าขา IC
27D6 DBD1	IN D1	; รับผลกลับ
27D8 E608	ANI 08	; MASK BIT ที่ที่ 3 (D <sub>3</sub> )
27DA 0F	RRC	; { เลื่อน LOGIC OUTPUT ที่ได้ไต่ตรงกับ TRUTH TABLE
27DB CD5622	CALL 2256	; { แสดงผล BINARY LOGIC OUTPUT ตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกันหรือไม่ตรวจสอบว่าค่าครบ 4 CONDITION
27DE CA5423	JZ 2354	; ถ้าครบ 4 CONDITION ไปสรุปผล
27E1 04	INR B	; ไม่ครบเลื่อนไปทดสอบ CONDITION ถัดไป
27E2 C3CF27	JMP 27CF	; กลับไปทดสอบ CONDITION ค่อยไป

โปรแกรมย่อย P 103

ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ได้แก่ 7402 ทุก ๆ ส่วน (PART )

27E5 CD6F27	CALL 276F	; { ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 1 (PART 1)
27E8 CD8827	CALL 2788	; { ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 2 (PART 2)
27EB CDA727	CALL 27A7	; { ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 3 (PART 3)
27EE CDC627	CALL 27C6	; { ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 4 (PART 4)
27F1 C9	RET	;
27F2 CD2022	CALL 2220	; { แสดงผล BINARY OUTPUT LOGIC ของภายใน IC ส่วนที่ 1 IC ประเภท A
27F5 CD4922	CALL 2249	; { ตรวจสอบว่าผลที่ได้ตรงกับ DATA หรือไม่, SET FLAG G/B และ DELAY

27F8 23	INX H	; เพิ่มค่า HL = HL + 1
27F9 13	INX D	; เพิ่มค่า DE = DE + 1
27FA 78	MOV A,B	; {เอาค่าB เก็บไว้ที่A (B เป็นตัวเก็บ INPUT LOGIC CONDITION) ของตัว A
27FB FE07	CPI 07	; {เปรียบเทียบว่าค่าA=07 หรือทำครบทุก CONDITION หรือยัง
27FD C9	RET	;
27FE 00	NOP	;
27FE 00	NOP	;



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมย่อย P 104

KEY INPUT SCAN ตรวจสอบว่ากดเลขอะไรเข้ามา REGISTER เป็น OUTPUT

2800 CD0D28	CALL 280D	; เรียกโปรแกรม KEY SCAN
2803 47	MOV B,A	; เก็บค่าผลที่ได้ไว้ที่ Bว่าเป็น KEY ใดหรือไม่มีการกด
2804 3AFF4F	LDA 4FFF	; { เอาค่าจาก LOCATION 4FFF ไว้ที่ A เป็น FLAG บอกว่ามีกด KEY
2807 A7	ANA A	; เมื่อ AND ระหว่าง A กับ A
2808 CA0028	JZ 2800	; ผล ถ้าเป็น A=00 กับไปเริ่มต้นใหม่
280B 78	MOV A,B	; ถ้ามีการกดแน่ เอาค่าที่ได้ว่าเป็น KEY ใดเก็บไว้ที่ A
280C C9	RET	;

โปรแกรมย่อย P 105

KEY SCAN และส่งผลที่ได้ทาง A REGISTER

280D CD3128	CALL 2831	; { เรียกโปรแกรม SCAN 3 COLUME (PB <sub>4</sub> , PB <sub>5</sub> , PB <sub>6</sub> #X'61')
2810 3C	INR A	; SET ค่า A=00 (โดยเดิม A=FF เมื่อ A+1=FF+1=00)
2811 CA2C28	JZ 282C	; เมื่อ A=00 ไม่มีการกดไหนทำ STEP 282C
2814 CD6628	CALL 2866	; ถ้ามีการกด KEY เข้ามา DELAY ประมาณ 10ms.
2817 CD3128	CALL 2831	; กลับไปตรวจว่ากด KEY อีกว่ากดเข้ามาจริง
281A 47	MOV B,A	; SET B=A เก็บค่าผลที่ได้ว่าเป็น KEY ใดที่ B
281B 3C	INR A	; A = A+1
281C CA2C28	JZ 282C	; ถ้ามีการกด KEY คือ A=00 กลับไปทำ STEP=282C
281F 3AFF4F	LDA 4FFF	; { ถ้ามีการกด KEY A≠00 แล้วเอาค่าที่อยู่ใน LOCATION 4FFF มาไว้ที่ A
2822 A7	ANA A	; A AND ด้วย A
2823 C21428	JNZ 2814	; { ถ้า A≠00 ให้กลับไปตรวจใหม่ (ทำ PROGRAM ที่ ADDRESS 2814)
2826 3D	DCR A	; ถ้าไม่ให้ A=A-1 (ถ้า A=00, A=00-1=FF)
2827 32FF4F	STA 4FFF	; STORGEค่า A ไว้ที่ ADDRESS 4FFF
282A 78	MOV A,B	; SET ค่าA=B
282B C9	RET	;

```

282C 06EF      MVI  B,FF      ; SET B=FF
282E C32728   JMP  2827      ; กลับไปที่ LOCATION 2827

```

โปรแกรมย่อย P 106

KEY SCAN (SCAN ๓ แถว แนวตั้งรับผลแนวนอน ๔ แถว)

```

2831 1600      MVI  D,00      ; CLEAR D=00 เป็นตัวนับจำนวนBIT ในแนวนอน
                                     ; 0-7 BIT
2833 42        MOV  B,D      ; SET B=00 เป็นค่าที่จะเอาไปบวกและอักษรกับ
                                     ; พวกตัวเลขใช้ในคอน LOOK UP TABLE
2834 3EEF      MVI  A,EF      ; ให้ A=EF เพื่อ SCAN แถวแรก BIT ที่ 4
                                     ; ของ PORT B (PB4) ดู ckt รูป ค.๓๖
2836 D361      OUT  61      ; ส่ง LOGIC '0' ไปในแถว BIT ที่ 4 ของ PORT B
2838 DB60      IN   60      ; รับผลแนวนอนกลับทาง PORT A ใช้ 8 BIT (มี ๔ แถวนอน)
283A EEFF      XRI  FF      ; {ตรวจว่ามีการกด KEY เข้ามาหรือไม่ ใช้
                                     ; EXCLUSIVE OR ด้วย EF กับ A
283C C25B28   JNZ  285B      ; {ถ้า A=00 คือมีการกด KEY ก็ไปทำการตรวจว่ากดเลข
                                     ; อะไรเข้ามา
283E 0608      MVI  B,08      ; {ถ้าไม่มีใครกด A=00 SET ค่า B=08 (ใช้ค่านี้
                                     ; ในคอน LOOK UP TABLE 8-F)
2841 3EDF      MVI  A,DF      ; ให้ A=DF เพื่อ SCAN แถวที่ ๒ BIT ที่ ๒ ของ PORT B
2843 D361      OUT  61      ; ส่ง LOGIC '0' ไปในแถว BIT ที่ 5 ของ PORT B
2845 DB60      IN   60      ; รับผลแนวนอนกลับทาง PORT A
2847 EEFF      XRI  FF      ; {ตรวจว่ามีการกด KEY เข้ามาหรือไม่ ใช้ EXCLUSIVE
                                     ; OR ด้วย FF กับ A
2849 C25B28   JNZ  285B      ; {ถ้า A≠00 คือมีการกด KEY ก็ไปทำการตรวจว่ากด
                                     ; เลขอะไรเข้ามา
284C 0610      MVI  B,10      ; {ถ้าไม่มีใครกด A≠00 SET ค่า B=10 (ใช้ค่านี้
                                     ; ในคอน LOOK UP TABLE)
284E 3EBF      MVI  A,BF      ; ให้ A=BF เพื่อ SCAN แถวที่ 3 BIT ที่ 6 ของ PORT B (PB6)
2850 D361      OUT  61      ; ส่ง LOGIC '0' ไปในแถว 3 BIT ที่ 5 ของ PORT B
2852 DB60      IN   60      ; รับผลแนวนอนกลับทาง PORT A
2854 EEFF      XRI  FF      ; {ตรวจว่ามีการกด KEY เข้ามาหรือไม่ EXCLUSIVE
                                     ; OR ด้วย FF กับ A
2856 C25B28   JNZ  285B      ; {ถ้า A≠00 คือมีการกด KEY ก็ไปทำการตรวจว่า
                                     ; กดเลขอะไรเข้ามา
2859 3D        DCR  A      ; {ถ้าไม่มีใครกด A≠00 SET ค่า A=A-1 (A=00-1=FF)
285A C9        RET

```

โปรแกรมย่อย P 107

ตรวจ กับ LOOK UP TABLE

```

285B 0F RRC ;ตรวจว่าเป็นBIT ไหน(แฉวนอนไหน)เริ่มต้นจาก
;BIT 0 ถึง 7 ตามลำดับ
285C DA6328 JC 2863 ;ถ้ามี CARRY ถ้าตรวจเจอ BIT นั้นไปทำการLOOK
;UP TABLE ต่อไป
285F 14 INR D ;ถ้าไม่มี CARRY ให้ D=D+1 เป็น COUNTER
;บอกว่า เป็น BIT ไตไหน
2860 C35B28 JMP 285B ;กลับไปตรวจอีกว่าเป็น BIT ไตไหน
2863 7A MOV A,D ;เอาค่าที่ได้ว่าเป็น BIT ไต(แฉวนอน)เก็บที่ A
;OR ค่า A กับค่าB ซึ่งเป็นค่าที่จะไป LOOK UP
2864 B0 ORA B ;TABLE ว่าเป็นเลขหรือเป็นอักษรอะไร
2865 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 108

หน่วยเวลา (DELAY TIME) 10ms.

```

2866 1648 MVI D,48 ;
2868 1E0C MVI E,0C ;
286A 1D DCR E ;
286B C26A28 JNZ 286A ;
286E 15 DCR D ;
286E C26828 JNZ 2868 ;
2872 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 109

```

ทดสอบ IC เบอร์ 7401, 7439 (SOCKETแบบIC เบอร์ 7402) 2INPUT NAND GATEx4
2873 CDF425 CALL 25E4 ;SET ขาIC(I/P,O/P)แสดง READY, WAIT FAST/
;SLOW TEST
2876 21200F LXI H,0F20 ;ENTRYชี้ TRUTH TABLE
2879 CDE124 CALL 24E1 ;CLEAR 7SEG.DISPLAY, CLEARE BINARY DISPLAY
287C CDE527 CALL 27E5 ;โปรแกรมทดสอบIC ประเภทที่ ๓,๑๔ ขา
287F C37328 JMP 2873 ;กลับตรวจสอบใหม่ถ้าต้องการ

```

โปรแกรมย่อย P 110

SET ขา IC ประเภทที่ 4 SOCKET # 1 INPUT/OUTPUT=1, 2, 13/12, 3,4,5/6, 9, 10, 11/8

```

2882 3E60 MVI A,60 ; 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| φ | 1 | 1 | φ | φ | φ | φ | φ |
| 9 |   |   |   |   |   |   |   |


2884 D3F0 OUT F0 ; SETขาIC ให้เป็นINPUT และOUTPUT ที่ DEVICE#F0
2886 3E04 MVI A,04 ; 

|    |    |    |   |   |   |   |   |
|----|----|----|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| φ  | φ  | φ  | φ | φ | 1 | φ | φ |
| 13 |    |    |   |   |   |   |   |


2888 D3F1 OUT F1 ; SERขาICให้เป็น INPUTและOUTPUTที่ DEVICE#F1
288A C9 RET ;
288B CD8228 CALL 2882 ; SET ขา IC ขาใดเป็นINPUT ขาใดเป็น
; OUTPUT เป็น IC ประเภทที่
288E CD0A20 CALL 20DA ; (เลือก SOCKET #1 จะแสดง LED/ แจ้ง READY
; ตรวจกดปุ่ม SLOW-หรือไม่
2891 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 111

ลดค่า HL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ครึ่งแล้วแต่ความต้องการและ SET B=00 ใช้ตอนกลับ

ไปตั้งคั้น DRIVE INPUT ใหม่ใน CONDITION

```

2892 2B DCX H ;
2893 2B DCX H ;
2894 2B DCX H ;
2895 2B DCX H ;
2896 2B DCX H ;
2897 2B DCX H ;
2898 2B DCX H ;
2899 2B DCX H ;
289A 0600 MVI B,00 ; SET B=00 กลับไปตั้งคั้น CONDITION แรกใน
; การ STEST คือ 00
289C C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 112

ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 ใช้ SOCKET #1 ในส่วนที่ 1 (PART 1) ได้นก 7410, 12, 27 และ 15

```

289D CD9E24 CALL 249E ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 1
28A0 0600 MVI B,00 ; { CONDITION แรกเป็น 00 ( B เป็นตัวเก็บ
                ; LOGIC CONDITION)
28A2 CD0F22 CALL 220F ; { แสดงผล INPUT LOGIC ในรูปของเลขฐาน 16
                ; ที่ 7-SEGMENT 2 DIGIT
28A5 78 MOV A,B ; { เอาค่า INPUT LOGIC CONDITION ใน B มา
                ; เก็บไว้ที่ A เตรียมส่งออก
                ; MASK เอา 2 BIT หลังคือ BIT D0 และ D1
28A6 E603 ANI 03 ;
28A8 D3E0 OUT E0 ; ส่ง LOGIC เข้าขา INPUT ขา 1 และขา 2 ของ IC
28AA 78 MOV A,B ; เอา LOGIC CONDITION ที่ SAVE ไว้ใน B มาไว้ที่ A
28AB E604 ANI 04 ; MASK เอา BIT ที่ 2 คือ D2
                ; { เลื่อนขมมูลให้ขมมูล INPUT LOGIC ให้ตรงขา
28AD 07 RLC ; { 13 ของ IC
28AE D3E1 OUT E1 ; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา 13 ของ IC
                ; { รับ OUTPUT LOGIC ที่ของ IC ส่วนที่หนึ่ง
28B0 DBD1 IN D1 ; { เข้าระบบ
28B2 E604 ANI 04 ; { MASK เอา BIT ที่ เป็น OUTPUT คือ BIT ที่ 2
                ; ตรงกับขา 12 ของ IC
28B4 CDF227 CALL 27F2 ; { แสดงผล BINARY OUTPUT LOGIC ทาง LED ตรวจ
                ; สอนผลที่ตรวจว่าครบ CONDITION หรือไม่
28B7 CABE28 JZ 28BE ; { ตรวจสอบแล้วถ้าทดสอบครบ CONDITION ก็ให้ไปทดสอบ
                ; PART ที่ 2 ต่อไป
28BA 04 INR B ; { ถ้าไม่ครบเพิ่มค่า INPUT LOGIC CONDITION
                ; อีก 1
28BB C3A228 JMP 28A2 ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

```

โปรแกรมย่อย P 113

ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 SOCKET # 1 ส่วนที่ 2 (PART 2)

```

28BE CD3629 CALL 2936 ; { CLEAR ค่า INPUT LOGIC เก่าที่ค้างอยู่ให้เป็น 00
                ; และ SET 'EA' บิตท้ายใน MEMORY REPORT
28C1 CDA324 CALL 24A3 ; บอกว่าเป็นส่วนที่ 2 ทาง 7-SEGMENT
                ; { ถอน POINTER ที่ชี้ TRUTH TABLE กลับไปตั้งต้น
28C4 CD9228 CALL 2892 ; ใหม่ SET INPUT LOGIC = 00 (B=00)
28C7 CD0F22 CALL 220F ; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED แบบ BINARY
                ; { เอา INPUT LOGIC กรณีต่าง ๆ ไว้ที่ A เตรียมรับ
28CA 78 MOV A,B ; { เข้าขา INPUT ของ IC
28CB 07 RLC ; { เลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงกับขา INPUT ของ IC
28CC 07 RLC ;

```

28CD CD4422 CALL 2244 ; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา INPUT ของ IC ส่วนที่ 2 แล้วรับผลจากขา 6 กลับ

28D0 E620 ANI 20 ; MASK เฉพาะ BIT ที่ 5 ซึ่งตรงกับขา OUTPUT ขา 6 ของ IC ส่วนที่ 2

28D2 0F RRC ;

28D3 0F RRC ;

28D4 0F RRC ;

28D5 CDF227 CALL 27F2 ; เปลี่ยนค่า OUTPUT LOGIC ที่ได้ให้ตรงกับ TRUTH TABLE

28D8 CADF28 JZ 28DF ; แสดงผล OUTPUT ที่ได้ในลักษณะ BINARY ทาง LED ตรวจสอบว่า GOOD/BAD และทำครบทุกกรณี 2 ถ้าทำครบทุก CONDITION แล้วไปทดสอบ PART ที่ 3 ต่อไป

28DB 04 INR B ; ถ้าไม่ครบเพิ่มค่า INPUT LOGIC อีก 1

28DC C3C728 JMP 28C7 ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 114

ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 SOCKET # 1 ส่วนที่ 3 (PART-3)

28DF CD4A24 CALL 244A ; SET ค่า 'EA' ใน MEMORY REPORT หลังผลลัพธ์ ที่เก็บไว้

28E2 CDA824 CALL 24A8 ; บอกว่าเป็นส่วนที่ 3 ทาง 7-SEGMENT

28E5 CD9228 CALL 2892 ; กดย POINTER ที่ชี้ TRUTH TABLE กลับไปตั้งต้นใหม่ SET INPUT LOGIC=00 (B=00)

28E8 CD0F22 CALL 220F ; แสดงผล INPUT LOGIC ทาง LED แบบ BINARY

28EB 78 MOV A,B ; เอา INPUT LOGIC กรณีต่าง ๆ ไว้ที่ A เตรียมรับ เข้าขา INPUT ของ IC

28EC 0F RRC ; เปลี่ยน INPUT LOGIC ให้ตรงกับขา IC

28ED 4F MOV C,A ; SAVE A ไว้ที่ C

28EE E680 ANI 80 ; MASK BIT ที่ 7 (D<sub>7</sub>) ซึ่งตรงกับขา 9

28F0 D3E0 OUT E0 ; ขับ INPUT LOGIC เข้าขา 9 ของ IC LATCH ไว้

28F2 79 MOV A,C ; เอาค่า INPUT LOGIC ที่ SAVE ไว้กลับมาที่ A

28F3 E603 ANI 03 ; MASK ของ BIT ที่ 0 และที่ 1 (D<sub>0</sub> และ D<sub>1</sub>) ซึ่งตรงกับขา INPUT ของ IC ขา 10 และ 11

28F5 D3E1 OUT E1 ; ขับ INPUT LOGIC เข้าขา IC ทั้ง ๒ ขา คือขา 10 และขา 11

28F7 DBD0 IN D0 ; รับผลจาก OUTPUT กลับ

28F9 E640 ANI 40 ; MASK เอา BIT ที่ 6 มาซึ่งตรงกับ OUTPUT LOGIC ที่ได้จากขา 8 ของ IC



28FB 0F	RRC	;	} เปลี่ยน OUTPUT LOGIC ที่ได้ให้ตรงกับ TRUTH TABLE
28FC 0F	RRC	;	
28FD 0F	RRC	;	
28FE 0F	RRC	;	
28FF CDF227	CALL	27F2	{ แสดงผล OUTPUT ที่ได้ในลักษณะ=BINARY ทางLED
2902 CA5423	JZ	2354	{ ตรวจสอบว่าGOOD/BAD และทำครบทุกกรณี ? (ถ้าทำครบทุก CONDITION ก็ไปสรุปผลทั้งหมดอีกทีว่า GOOD และ BAD-PART ใด
2905 04	INR	B	; ถ้าไม่ครบเพิ่มค่า INPUT LOGIC อีก 1
2906 C3E828	JMP	28E8	; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 115

ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 SOCKET #1สำหรับ IC เบอร์ 7410 และ 12

2909 CD8B28	CALL	288B	{ SET ขา IC ประเภทที่ 4 แสดงเลือก SOCKET ที่ 1 ตรวจสอบ KEY ต่าง ๆ
290C 21400F	LXI	H, 0F40	{ SET POINTER ชี้ TRUTH TABLE ของ IC เบอร์ 7410, 12
290F CDE124	CALL	24E1	{ CLEAR 7-SEGMENT และ CLEAR I/O BINARY DISPLAY
2912 CD9D28	CALL	289D	; ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 เริ่ม PART ที่ 1 ก่อน
2915 C30929	JMP	2909	; กลับไปตรวจว่าต้องการจะ TEST ต่อหรือไม่

โปรแกรมย่อย P 116

ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 SOCKET # 1สำหรับ IC เบอร์ 7427

2918 CD8B28	CALL	288B	{ SET ขา IC ประเภทที่ 4 แสดงเลือก SOCKET # ที่ 1, ตรวจสอบ KEY ต่าง ๆ
291B 21480F	LXI	H, 0F48	{ SET POINTER ชี้ TRUTH TABLE ของ IC เบอร์ 7427
291E CDE124	CALL	24E1	{ CLEAR 7-SEGMENT และ CLEAR I/O BINARY DISPLAY
2921 CD9D28	CALL	289D	; ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 เริ่ม PART ที่ 1 ก่อน
2924 C31829	JMP	2918	; กลับไปตรวจว่าต้องการจะ TEST ต่อหรือไม่

โปรแกรมย่อย P 117

ทดสอบ ประเภทที่ 4 SOCKET # 1 สำหรับ IC เบอร์ 7411, 15

```

2927 CD8B28 CALL 298B ; SET ขา IC ประเภทที่ 4 แสดงเลือก SOCKET #
; ที่ 1, ตรวจสอบ KEY ต่าง ๆ
292A 21500F LXI H, 0F50 ; SET POINTER ชี้ TRUTH TABLE ของ IC
; เบอร์ 7411, 15
292B CDE124 CALL 24E1 ; CLEAR 7-SEGMENT และ CLEAR I/O BINARY
; DISPLAY
2930 CD9D28 CALL 289D ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 4 เริ่ม PART ที่ 1 ก่อน
2933 C32729 JMP 2927 ; กลับไปตรวจว่าต้องการจะ TEST คอหรือไม่

```

โปรแกรมย่อย P 118

SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบและ CLEAR LOGIC INPUT ที่ค้างอยู่ที่ PORT

```

2936 CD4A24 CALL 244A ; SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลทดสอบ
2939 CDFC22 CALL 22FC ; CLEAR LOGIC INPUT ที่ค้างอยู่ที่ PORT
293C C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 119

SET ขา IC 14ขา, ขา INPUT/ ขา OUTPUT=1, 2, 3, 4, 5/6; 9, 10, 11, 12, 13/8

ประเภทที่ 5 SOCKET # 1

```

293D 3E60 MVI A, 60 ; 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 ขาดไม่ใช้ (NO CONNECT)
; (ส่ง OUTPUT ออกไปทาง PORT A # F0 SET ขา
293F D3F0 OUT F0 ; INPUT/OUTPUT
2941 3E00 MVI A, 00 ; 

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

 ขา ไม่ใช้ (NO CONNECT)
; (ส่ง OUTPUT ออกไปทาง PORT B # F1 SET ขา
2943 D3F1 OUT F1 ; INPUT/OUTPUT
2945 CDDA20 CALL 20DA ; เลือก SOCKET # 1 LED ติด, แสง READY, ตรวจ
; ว่า SLOW หรือ TEST
2948 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 120

แสดง OUTPUT LOGIC ตรวจสอบผลว่า GOOD หรือ BAD, ตรวจทำถึง CONDITION

สุดท้ายหรือยัง

```

2949 CD2022 CALL 2220 ; (แสดงผล BINARY OUTPUT LOGIC แบบตัว
; เลขฐาน 16
294C CD4922 CALL 2249 ; (ตรวจว่าผลที่ได้ตรงกับข้อมูลหรือไม่และ SET GOOD
; หรือ BAD แล้ว DELAY 1 SEC.
294F 13 INX D ; (เพิ่มค่า POINTER ชี้ผลของการทดสอบใน MEMORY
; อีกหนึ่ง

```

2950 78	MOV A,B	; เอาค่า INPUT LOGIC CONDITION จาก B ไปเก็บไว้ที่ A
2951 FE0E	CPI 0E	; ตรวจสอบว่าทำถึงก่อน INPUT LOGIC CONDITION สุกท้ายหรือยัง
2953 C25729	JNZ 2957	; ถ้าไม่เท่าไปตรวจว่าทำถึง CONDITION สุกท้ายหรือยัง
2956 23	INX H	; เพิ่มค่า POINTER ซี TRUTH TABLE อีกหนึ่ง
2957 FE0F	CPI 0F	; ตรวจสอบว่าทำครบทุก CONDITION หรือยัง
2959 C9	RET	;

โปรแกรมย่อย P 121

ทดสอบ IC ประเภทที่ 5 SOCKET #1 ส่วนที่ 1 (PART 1)

295A CD9E24	CALL 249E	; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 1
295D 0600	MVI B,00	; { CLEAR B=00 (SET INPUT LOGIC เป็น 00 CONDITION แรก)
295F CD0F22	CALL 220F	; { แสดงผล INPUT LOGIC ลักษณะเลขฐาน 16 และเลขฐาน 2
2962 78	MOV A,B	; เตรียม INPUT LOGIC ที่จะส่งออกไว้ที่ A
2963 E603	ANI 03	; { MASK เอาเฉพาะ BIT 1 และ BIT 0 (D <sub>1</sub> และ D <sub>0</sub> ตามลำดับ)
2965 4F	MOV C,A	; SAVE INPUT LOGIC ที่ MASK ไว้ที่ A ก่อน
2966 78	MOV A,B	; เอา INPUT LOGIC มาไว้ที่ A อีก
2967 07 ( (	RLC	; { เลื่อน INPUT LOGIC 2 BIT หนาคือ BIT 3 และ BIT 2 ให้ตรงกับขา IC คือขา 5 และขา 4 ตามลำดับ
2968 E618	ANI 18	; { MASK เอาเฉพาะ BIT 5 และ BIT 4 (D <sub>4</sub> และ D <sub>3</sub> ตามลำดับ)
296A B1	DRA C	; { OR เพื่อรวม INPUT LOGIC DATA ที่สมบูรณ์ที่ตรงกับขา INPUT ของ IC พอดี
296B CD4422	CALL 2244	; { DRIVE LOGIC เข้าขาของ IC แล้วรับผลที่ได้กลับเข้าระบบ
296E E620	ANI 20	; { MASK เอาเฉพาะ BIT ที่ตรง OUTPUT ของส่วนที่กำลังทดสอบอยู่
2970 0F	RRC	; } เลื่อนข้อมูล OUTPUT ที่ได้ให้ตรงกับ TRUTH
2971 0F	RRC	; } TABLE โดย ROTATE ทางขวา ๓ ครั้ง
2972 0F	RRC	; }
2973 CD4929	CALL 2949	; { แสดงผล OUTPUT LOGIC แบบ HEX ตรวจสอบว่าทำครบทุก CONDITION หรือยัง
2976 CA7D29	JZ 297D	; ถ้าทำครบไปทดสอบ PART ต่อไป
2979 04	INR B	; ถ้าไม่ครบเพิ่มค่า INPUT LOGIC อีก 1
297A C35F29	JMP 295F	; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป



ทดสอบ IC ประเภทที่ 5 SOCKET # 1 ส่วนที่ 2 (PART 2)

297D CD4A24	CALL 244A	;	SET ค่า 'EA' ปิดท้ายผลการทดสอบแต่ละ PART และแสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 2
2980 CDA324	CALL 24A3	;	
2983 2B	DCX H	;	{ เลือก POINTER ชี้ OUTPUT LOGIC TABLE ค่าถัดไป
2984 0600	MVI B,00	;	START INPUT LOGIC CONDITION = 00
2986 CD0F22	CALL 220F	;	{ แสดงผล INPUT LOGIC ลักษณะเลขฐาน 16 และเลขฐาน 2
2989 78	MOV A,B	;	เตรียม INPUT LOGIC ที่จะส่งออกไปที่ A
298A 0F	RRC	;	เลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงกับขา IC
298B 4F	MOV C,A	;	SAVE ค่า A ไว้ที่ C
298C E680	ANI 80	;	MASK เอา BIT 7 ซึ่งตรงกับขา 9 ของ IC
298E D3E0	OUT E0	;	{ ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา 9 ของ IC ( LACTH ไว้)
2990 79	MOV A,C	;	เอาค่า SAVE ไว้ใน C มาไว้ที่ A
2991 E601	ANI 01	;	MASK เอา BIT 0 เพื่อตรงกับขา 10 ของ IC
2993 D5	PUSH D	;	SAVE ค่า DE Reg. ใน MEMOR
2994 57	MOV D,A	;	SAVE ค่า INPUT LOGIC สำหรับขา 10 ใน D
2995 78	MOV A,B	;	เอาค่า INPUT LOGIC จาก B ไว้ที่ A
2996 E60C	ANI 0C	;	{ MASK BIT 2 และ BIT 3 ตรงกับขา 12 และขา 13 ของ IC
2998 B2	ORA D	;	{ รวม INPUT LOGIC ที่จะขับเข้าขา 10, 12 และ 13 เข้าด้วยกัน
2999 D1	POP D	;	เอาค่า DE ใน MEMORY คืนที่เดิม
299A D3E1	OUT E1	;	{ ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา 10, 12 และ 13 ของ IC
299C DBD0	IN D0	;	รับผลจาก OUTPUT ของ IC เข้าระบบ
299E E640	ANI 40	;	MASK เอาเฉพาะ BIT 6 ที่เป็น OUTPUT
29A0 0F	RRC	;	{
29A1 0F	RRC	;	
29A2 0F	RRC	;	
29A3 0F	RRC	;	
29A4 CD4929	CALL 2949	;	{ แสดง OUTPUT LOGIC ตรวจสอบผลว่า GOOD หรือ BAD, ตรวจสอบทำครบทุก CONDITION หรือยัง
29A7 CA5423	JZ 2354	;	{ ถ้าทำครบทุก CONDITION หรือยัง ถ้าครบแสดง ผลการตรวจสอบ
29AA 04	INR B	;	เพิ่มค่า INPUT LOGIC อีกหนึ่ง
29AB C38629	JMP 2986	;	กลับทดสอบ CONDITION. ต่อไป

โปรแกรมย่อย P 123

ทดสอบ IC เบอร์ 7420 (4 INPUT NAND GATE), 7422, 40, 140, 13, 74C02

```

29AE CD3D29 CALL 293D ; {SET ขา IC ตาม IC ประเภทที่ 5 และตรวจ
                        ; KEY ว่า จะ CLEAR, CONT, SLOW
29B1 21480F LXI H,0F48 ; {POINTER ที่ OUTPUT TRUTH TABLE ของ IC
                        ; เบอร์ 7420
29B4 CDE124 CALL 24E1 ; {CLEAR 7-SEGMENT และ OUTPUT BINARY
                        ; DISPLAY
29B7 CD5A29 CALL 295A ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 5
29BA C3AE29 JMP 29AE ; {กลับไปทดสอบว่าจะทดสอบต่อหรือ CLEAR หรือ
                        ; ทดสอบแบบ SLOW

```

โปรแกรมย่อย P 124

ทดสอบ IC เบอร์ 7421 (4 INPUT AND GATE)

```

29BD CD3D29 CALL 293D ; {SET ขา IC ตาม IC ประเภทที่ 5 และตรวจ
                        ; KEY ว่า จะ CLEAR, CONT, SLOW
29C0 212C0F LXI H,0F2C ; {POINTER ที่ OUTPUT TRUTH TABLE ของ IC
                        ; เบอร์ 7421 (4 INPUT AND GATE)
29C3 CDE124 CALL 24E1 ; CLEAR 7-SEGMENT และ OUTPUT BINARY DISPLAY
29C6 CD5A29 CALL 295A ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 5
29C9 C3BC29 JMP 29BC ; {กลับไปทดสอบว่าจะทดสอบต่อหรือ CLEAR หรือทดสอบ
                        ; แบบ SLOW

```

โปรแกรมย่อย P 125

ทดสอบ IC ประเภทที่ 7 SOCKET # 1 ทุก ๆ PART โดยใช้ MODULE จากโปรแกรมอื่น

```

29CC CD7122 CALL 2271 ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET # 1 PART 1
29CF CD8827 CALL 2788 ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET # 1 PART 2
29D2 CDA727 CALL 27A7 ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 3 SOCKET # 1 PART 3
29D5 CDD822 CALL 22D8 ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 1 SOCKET # 1 PART 4
29D8 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 126

SET ขา IC ประเภทที่ 7 ขา INPUT/OUTPUT = 1,2/3; 5,6/4; 8,9/10 และ 12,13/11

```

29D9 3E0C      MVI  A,0C      ; SET ขา 1,2/3 และ 5,6/4
                ; (8,9 INPUT)
29DB D3F0      OUT  F0      ; ส่งข้อมูลไป SET PORT A # F 0
29DD 3E03      MVI  A,03      ; SET ขา 10(OUTPUT) และ 12,13/11
29DF D3F1      OUT  F1      ; ส่งข้อมูลไป SET PORT B # F1
                ; เลือก SOCKET # LED คิค, แจง READY
29E1 CDDA20    CALL 20DA    ; ตรวจสอบ KEY ว่า SLOW TEST
29E4 C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 127

ทดสอบ IC เบอร์ 74266 (QUAD EXCLUSIVE - NOR GATE)

```

29E5 CDD929    CALL 29D9    ; SET ขา IC ประเภทที่ ๗
29E8 21320F    LXI  H,0F32  ; POINTER ชี้ LOGIC OUTPUT TABLE
29EB CDE124    CALL 24E1    ; CLEAR 7 SEGMENT HEX/BINARY DISPLAY
29EE CDCC29    CALL 29CC    ; ทดสอบ IC ประเภทที่ ๗
                ; กลับไปทดสอบว่าจะทดสอบต่อหรือ CLEAR หรือ
29F1 C3E529    JMP  29E5    ; ทดสอบแบบ SLOW

```

โปรแกรมย่อย P 128

SET ขา IC ประเภทที่ 6, SOCKET # 1

```

29F4 3E40      MVI  A,40      ; SET ขา 1, 2, 3, 4, 5, 6 เป็น INPUT/
                ; ขา 8 เป็น OUTPUT
29F6 D3F0      OUT  F0      ; SET PIN CONTROLLERตามคำสั่งนั้น
                ; SET ขา 11, 12 เป็น INPUT นอกนั้น
29F8 3E00      MVI  A,00      ; DON't CARE
29FA D3F1      OUT  F1      ; SET PIN CONTROLLER ตามคำสั่งนั้น
                ; เลือก SOCKET # 1 LED คิค แสดงREADY,
29FC CDDA20    CALL 20DA    ; ตรวจสอบ KEY
29FF C9        RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 129

แสดง OUTPUT LOGIC ตรวจสอบผลว่า GOOD หรือ BAD ตรวจทำถึง CONDITION สุกท้ายหรือยัง

```

2A00 CD2022 CALL 2220 ; แสดงผล BINARY OUTPUT LOGIC
                          { ตรวจสอบว่าผลที่ได้ตรงกับ DATA หรือไม่
2A03 CD4922 CALL 2249 ; SET GOOD/BAD
                          { เพิ่มค่า POINTER ซึ่งผลของการทดสอบใน MEMORY
2A06 13 INX D ; อีกหนึ่ง
2A07 78 MOV A,B ; นำค่า INPUT LOGIC CONDITION ไว้ที่
                          { ตรวจสอบว่าทดสอบถึง CONDITION ก่อนสุกท้าย
2A09 FEFE CPI FE ; หรือยัง
                          { ถ้ายังไม่ตรวจสอบว่าถึง CONDITION สุกท้าย
2A0A C20E2A JNZ 2A0E ; หรือยัง
2A0D 23 INX H ; เพิ่มค่า POINTER ซึ่ง TRUTH TABLE อีกหนึ่ง
2A0E FEFF CPI FF ; ตรวจสอบว่าถึง CONDITION สุกท้ายหรือยัง
2A10 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P 130

ทดสอบ IC ประเภทที่ 6 SOCKET ที่ 1 ส่วนที่ 1(PART 1)ในที่มีส่วนเดียว

```

2A11 CD9E24 CALL 249E ; แสดงผลทาง 7-SEGMENT ว่าเป็น PART 1
                          { SET START INPUT LOGIC CONDITION
2A14 0600 MVI B,00 ; = 00 เก็บที่ B
                          { แสดงผลทางเลขฐาน 16 และ BINARY ของ
2A16 CD0F22 CALL 220F ; INPUT LOGIC CONDITION
2A19 78 MOV A,B ; เตรียมส่ง INPUT LOGIC ไว้ที่ A
                          { MASK เอา BIT 0, 1, 2, 3, 4, และ 5
2A1A E63F ANI 3F ; ตรงกับขา 1, 2, 3, 4, 5 และ 6
2A1C D3E0 OUT E0 ; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC ดังกล่าวแล้ว
                          { ส่วนขาที่เหลือเอาค่า INPUT LOGIC
2A1E 78 MOV A,B ; มาทำอีก
                          { โดยMASK เอา BIT 6 และ 7 ตรงกับขา 11
2A1F E6C0 ANI C0 ; และ 12 ตามลำดับ
2A21 07 RLC ;
2A22 07 RLC ; }
2A23 07 RLC ; }   { เลื่อน INPUT LOGIC ให้ตรงกับขา 11 และ 12
2A24 D3E1 OUT E1 ; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC ที่นำมาทดสอบ
2A26 DBD0 IN D0 ; รับผลที่ได้กลับเข้าระบบ
2A28 E640 ANI 40 ; MASKเอา BIT 6 ซึ่งเป็นค่า OUTPUT LOGIC
2A2A 0F RRC ; }   { เลื่อน OUTPUT LOGIC ให้ตรงกับ TABLE

```

```

2A2B 0F      RRC      ;
2A2C 0F      RRC      ;
2A2D 0F      RRC      ;
2A2E CD002A  CALL 2A00  ; {แสดง OUTPUT LOGIC, ตรวจสอบผลว่าGOOD
                        ; หรือ BAD และตรวจว่าครบทุกCONDITION หรือยัง
2A31 CA5423  JZ 2354  ; {ถ้าทำครบ CONDITION รายงานผลการทดสอบ
                        ; ทั้งหมด
2A34 04      INR B      ; เพิ่มค่า INPUT LOGIC CONDITION อีก 1
2A35 C3162A  JMP 2A16  ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

```

โปรแกรมย่อย P 131

ทดสอบ IC ประเภทที่ 6 SOCKET ที่ 1 สำหรับ IC เบอร์ 7430

```

2A38 CDF429  CALL 29F4  ; SET ขา IC ประเภทที่ 6, SOCKET ที่ 1
2A3B 21480F  LXI H,0F48 ; POINTER ชี้ LOGIC OUTPUT TABLE
                        ; CLEAR 7-SEGMENT และ I/P, O/P BINARY
2A3E CDE124  CALL 24E1  ; DISPLAY
2A41 CD112A  CALL 2A11  ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 6
2A44 C3382A  JMP 2A38  ; กลับไปตรวจว่าต้องการจะ TEST หรือไม่

```

โปรแกรมย่อย P 132

DISPLAY OUTPUT 74164 และจัด OUTPUT ให้เรียงลำดับกันจาก QA - QH

```

2A47 DBD0    IN D0    ; {รับผลจาก OUTPUT ของ IC 74164
                        ; ((QA, QB, QC และ QD)
2A49 E63C    ANI 3C    ; MASK เอาเฉพาะ QA, QB, QC และ QD
2A4B 0F      RRC      ; เลื่อนให้ตรงกับ BIT 0, 1, 2 และ 3 ตามลำดับ
2A4C 0F      RRC      ;
2A4D C5      PUSH B    ; SAVE BC ไว้
                        ; SAVE OUTPUT ที่ได้ไว้ที่ C(QA, QB, QC และ QH)
2A4E 4F      MOV C,A    ;
2A4F DBD1    IN D1    ; {รับผลจาก OUTPUT ของ IC 74164 (QE, QF
                        ; QC และ QH)
2A51 E60F    ANI 0F    ; MASK เอา 4 BIT หลัง (QE, QF, QG และ QH)
                        ; เลื่อนให้ตรงกับ BIT 4, 5, 6 และ 7 ตามลำดับ
2A53 CD1326  CALL 2613  ;

```



```

2A56 B1      ORA  C      ;รวม OUTPUT เข้าด้วยกัน โดยที่ QA-QH
                ;ตรงกับ BIT 0-7 ตามลำดับ
2A57 C1      POP  B      ;ค่าที่ SAVE ไว้ใน MEMORY ให้ BC
2A58 D3B0    OUT  B0     ;ส่งออกDISPLAY ทาง LED BINARY DISPLAY
2A5A C9      RET

```

```

2A5B CDF920  CALL 20F9     ;(DECODE จาก 4 BIT(D3-D0) ฐาน ๒ เป็น
                ;7-SEGMENT
2A5E D37F    OUT  7F     ;DISPLAY ออก 7-SEGMENT # 7F
2A60 CD7420  CALL 2074     ;(DECODE จาก 4 BIT(D7-D0) ฐาน ๒ เป็น
                ;7-SEGMENT
2A63 D37E    OUT  7E     ;DISPLAY ออก 7-SEGMENT # 7E
2A65 C9      RET

```

โปรแกรมย่อย P 133

SET ขา IC ประเภทที่ 8 SOCKET # 1 IC เบอร์ 74164

```

2A66 3E3C    MVI  A,3C     ;SET ขา 1, 2, 8 และ 9 เป็น INPUT และขา
                ;3, 4, 5, 6 เป็น OUTPUT
2A68 D3F0    OUT  F0     ;SET PIN CONTROLLER PORT A # F0
2A6A 3E0F    MVI  A,0F     ;SET ขา 10, 11, 12 และ 13 เป็น OUTPUT
2A6C D3F1    OUT  F1     ;SET PIN CONTROLLER PORT B # F1
                ;เลือก SOCKET #1 LED สติงแจง READY ตรวจ
2A6E CDDA20  CALL 20DA     ;FAST/SLOW TEST
2A71 C9      RET

```

โปรแกรมย่อย P 134

CLEAR (CLR) เตรียมการก่อน DISPLAY

```

2A72 E680    ANI  80     ;MASK ขา BIT 7
2A74 07      RLC
2A75 07      RLC      ;เลื่อนให้ตรงกับ BINARY DISPLAY

```

```

2A76 07          RLC          ; )
2A77 32094E     STA  4E09     ; SAVE INPUT 'CLR' ไว้ที่ 4E09
2A7A C9          RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 135

CLOCK (CK) เตรียมการก่อน DISPLAY

```

2A7B E640       ANI  40       ; MASK ๑๑ BIT 6
2A7D 0F         RRC          ;
2A7E 0F         RRC          ; }
2A7F 0F         RRC          ; }   เสร็จให้ตรงกับ BINARY DISPLAY
2A80 320A4E     STA  4E0A     ; SAVE INPUT 'CK' ไว้ที่ 4E0A
2A83 C9         RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 136

DISPLAY INPUT A และ B

```

2A84 E603       ANI  03       ; MASK ๑๑ BIT 0 กับ BIT 1 ซึ่งเป็น A และ B
                               ; INPUT
2A86 D3C0       OUT  C0       ; ส่ง INPUT ที่ได้ออกจาก LED (BINARY DISPLAY)
2A88 C9         RET          ;

```

โปรแกรมย่อย P 137

ทดสอบ IC ประเภทที่ 8

```

2A89 D3E0       OUT  E0       ; ส่ง INPUT LOGIC เข้าเข้า IC ที่นำมาทดสอบ
                               ; CLEAR MEMORY ที่แสดงผลส่วนที่เสียและ CLEAR
2A8B CD0B24     CALL 240B     ; 7-SEGMENT # 78 -7F
2A8E C5         PUSH B       ; SAVE BC ไว้ใน MEMORY
2A8F 47         MOV  B,A      ; นำค่า A SAVE ไว้ที่ B (INPUT LOGIC)
2A90 CD722A     CALL 2A72     ; SET ค่า CLR FLAG ใน MEMORY (BIT 7)
2A93 78         MOV  A,B      ; นำค่า B ไว้ที่ A (INPUT LOGIC)

```

```

2A94 CD7B2A CALL 2A7B ; SETค่า CK FLAGใน MEMORY (BIT 6)
2A97 CDDF2A CALL 2ADF ; เตรียมสัญญาณ CLR และ CK
2A9A D3C2 OUT C2 ; DISPLAY CLR และ CK
2A9C 78 MOV A,B ; นำค่า B ไว้ที่ A (INPUT LOGIC)
2A9D CD842A CALL 2A84 ; DISPLAY INPUT A และ B
2AA0 CD472A CALL 2A47 ; DISPLAY ผลที่ได้จาก OUTPUT QA-QH
2AA3 CDE420 CALL 20E4 ; { ตรวจสอบ FLAG FAST/SLOW TEST ถ้า SLOW
; จะหน่วงเวลาใหญ่
2AA6 C1 PDP B ; เอาค่า BC เกวที่ SAVE ไว้คืน
2AA7 C9 RET ;

```

โปรแกรม P 138

เริ่มต้น TEST IC ประเภทที่ 8 SOCKET # 1

STEPแรก CLEAR 8 BIT SHIFT REG. INPUT CLR=0

```

2AA8 3E00 MVI A,00 ;
2AAA CD892A CALL 2A89 ; CLEAR SHIFT REGISTER
2AAD CD4922 CALL 2249 ; ตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกับข้อมูลหรือไม่
2AB0 23 INX H ; { เลื่อน POINTER ไปข้อมูลที่ เป็น INPUT LOGIC
; สักไป
2AB1 13 INX D ; { เลื่อน POINTER ที่เก็บผลลัพธ์
; CLEAR B=00, B เป็น INPUT A และ B ตอนนี้
2AB2 0600 MVI B,00 ; CONDITION 00
2AB4 0E08 MVI C,08 ; กำหนดจำนวน CK < ครั้ง
2AB6 3E80 MVI A,80 ; { A เป็น CLR และ CR, CONDITIONแรก CK=0,
; CLR
2AB8 B0 ORA B ; { รวมข้อมูลที่ จะรับเข้าขา IC เข้าด้วยกัน CLK, CK,
; A และ B (INPUT LOGIC)
2AB9 CD892A CALL 2A89 ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 8
2ABC 3EC0 MVI A,C0 ; ทำ CK ให้เป็น MASK = '1'
2ABE B0 ORA B ; { รวมข้อมูลที่รับเข้าขา IC เข้าด้วยกัน CLK, CK,
; A และ B
2ABF CD892A CALL 2A89 ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 8
2AC2 0D DCR C ; ลดค่า C อีก 1 (C=C-1)
2AC3 C2B62A JNZ 2AB6 ; ถ้าไม่ครบ CLOCK 8 ลูก ให้กลับไปทดสอบต่อ

```

```

2AC6 CD5922      CALL 2259      ; ถ้าทำครบ CLOCK 8 ลูกแล้วตรวจสอบผลที่ได้กับ
                  ; TABLE และทำครบทุก CONDITION หรือยัง
2AC9 CA5423      JZ 2354      ; ถ้าทำครบรายงานผลการทดสอบทั้งหมด
2ACC 04          INR B          ; เพิ่มค่า B อีก 1 เพื่อทดสอบ CONDITION ต่อไป
2ACD C3B42A      JMP 2AB4      ; กลับไปทดสอบ CONDITION ต่อไป

```

โปรแกรมย่อย P 139

ทดสอบ IC เบอร์ 74164 เป็น IC ประเภทที่ 8 ใช้ SOCKET # 1

```

2AD0 CB662A      CALL 2A66      ; SET ขา IC ประเภทที่ 8
2AD3 21580F      LXI H,0F58    ; POINTER ชี้ OUTPUT LOGIC TABLE
2AD6 CDE124      CALL 24E1      ; CLEAR 7-SEGMENT INPUT/OUTPUT BINARY
2AD9 CD882A      CALL 2AA8      ; ทดสอบ IC ประเภทที่ 8
2ADC C3B02A      JMP 2AD0      ; กลับไปตรวจว่าจะทดสอบอีกหรือไม่ CLEAR หรือ
                  ; SLOW TEST

```

โปรแกรมย่อย P 140

เตรียมสัญญาณ CLR และ CK เพื่อจะ DISPLAY

```

2ADF E5          PUSH H          ;
2AE0 D5          PUSH D          ;
2AE1 C5          PUSH B          ;
2AE2 21094E      LXI H,4E09    ; SET POINTER ไปที่ CLR FLAG
2AE5 0000        NOP            ;
2AE7 7E          MOV A,M        ; เอาค่าใน CLR FLAG ไว้ที่ A
2AE8 23          INX H          ; เลื่อนค่า POINTER ไปชี้ที่ CK FLAG
2AE9 4E          MOV C,M        ; เอาค่าใน CR FLAG ไว้ที่ C
2AEA B1          ORA C          ; รวมสัญญาณ LOGIC เข้าด้วยกัน
2AEB 0E          NOP            ;
2AEC 000000      NOP            ;
2AEF C1          POP B          ;

```



2AF0 D1	POP D	; คืนข้อมูลที่ SAVE ไว้กลับ BC, DE, HL ตามเดิม
2AF1 E1	POP H	;
2AF2 C9	RET	;

โปรแกรมย่อย P 141

ทดสอบ IC ประเภทที่ 7 IC เบอร์ 74C86, 74LS266, 74LS386

2AF3 CDD929	CALL 29D9	; SAVE ขา IC ประเภทที่ 7
2AF6 21300F	LXI H, 0F30	; POINTER ชี้ OUTPUT LOGIC TABLE CLEAR 7-SEGMENT และ INPUT/OUTPUT BINARY
2AF9 CDE124	CALL 24E1	;
2AFC CDCC29	CALL 29CC	; ทดสอบ IC ประเภทที่ 7 SOCKET # 1
2AFF C3F32A	JMP 2AF3	; กลับไปทดสอบว่าจะทดสอบต่อหรือ CLEAR หรือ ทดสอบแบบ SLOW

2B02 00	NOP	;
2B03 00	NOP	;
2B04 00	NOP	;
2B05 00	NOP	;
2B06 00	NOP	;
2B07 00	NOP	;
2B08 00	NOP	;
2B09 00	NOP	;
2B0A 00	NOP	;
2B0B 00	NOP	;
2B0C 00	NOP	;
2B0D 00	NOP	;
2B0E 00	NOP	;

โปรแกรมย่อย P142

เคลื่อนย้ายข้อมูลของ IC ที่จะนำมาทดสอบเก็บไว้ที่ AREA ที่จะ PROCESS โดย LOAD

ค่า HL และ DE ก่อนตามลำดับ

2C00 7E	MOV A,M	; นำข้อมูลจากMEMORY มาเก็บไว้ที่ A ก่อน
2C01 FEFF	CPI FF	; ตรวจสอบว่าหมดข้อมูลหรือยัง (FF ตัวที่ 1) ถ้ายังกลับไป LOAD ข้อมูลลงใน AREA ที่เตรียมไว้ PROCESS
2C03 C2162C	JNZ 2C16	
2C06 4F	MOV C,A	; ถ้าใช่ SAVE ข้อมูลไว้ที่ C
2C07 23	INX H	; ไปดูตัวถัดไป
2C08 7E	MOV A,M	; นำข้อมูลมาตรวจอีก
2C09 FEFF	CPI FF	; ตรวจว่าเท่ากับ FF หรือไม่ (เป็นแสดงว่าหมดข้อมูลแน่)
2C0B C8	RZ	; ถ้าหมดข้อมูลจริง RET
2C0C EB	XCHG	; สลับ POINTER ไปชี้ AREA ที่จะไปเก็บ
2C0D 71	MOV M,C	; นำข้อมูลที่ SAVE ตัวแรกไปเก็บใน MEMORY
2C0E 23	INX H	; เลื่อน ADDRESS ที่จะเก็บไปอีก ๑ ที่
2C0F 77	MOV M,A	; นำข้อมูลใน A เก็บใน MEMORY
2C10 EB	XCHG	; สลับ POINTER ไปชี้ข้อมูลของ IC
2C11 13	INX D	; เลื่อนค่า POINTER ชี้ ADDRESS ใน AREA ที่จะ PROCESS ถัดไป
2C12 23	INX H	; เลื่อนค่า POINTER ชี้ ADDRESS ข้อมูล IC ถัดไป
2C13 C3002C	JMP 2C00	; กลับไปเคลื่อนย้ายข้อมูลถัดไป

ศูนย์วิทยุโทรพยากรณ์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2C16 EB	XCHG	; สลับ POINTER ไปชี้ ADDRESS ใน AREA ที่จะ PROCESS
2C17 C30F2C	JMP 2C0F	; ไปเคลื่อนย้ายข้อมูลไปไว้ใน AREA ที่จะ PROCESS

โปรแกรมย่อย P143

เคลื่อนย้ายข้อมูลจากข้อมูลของ IC ที่อยู่ใน MEMORY ไปเก็บที่ AREA ที่เตรียมไว้ที่จะ

PROCESS (ทุก ๆ ข้อมูลของ IC )

```

2C1A 11C04F      LXI  D,4FC0    ; POINTER ชี้ SOCKET # buffer area
2C1D CD002C      CALL 2C00     ; เคลื่อนย้ายข้อมูลไปยัง ADDRESS ที่ต้องการ
2C20 11C14F      LXI  D,4FC1    ; POINTER ชี้ PINCONTROL BUFFER AREA
2C23 CD002C      CALL 2C00     ; เคลื่อนย้ายข้อมูลไปยัง ADDRESS ที่ต้องการ
2C26 110040      LXI  D,4000    ; POINTER ชี้ INPUT LOGIC AREA
2C29 CD002C      CALL 2C00     ; เคลื่อนย้ายข้อมูลไป ยัง ADDRESS ที่ต้องการ
2C2C
2C2F
2C32 110048      LXI  D,4800    ; POINTER ชี้ OUTPUT TRUTH TABLE AREA
2C35 CD002C      CALL 2C00     ; เคลื่อนย้ายข้อมูลไปยัง ADDRESS ที่ต้องการ
2C38
2C3B
2C3E C9          RET

```

โปรแกรมย่อย P144

DISPLAY ว่าใช้ SOCKET #

```

2C3F 3AC04F      LDA  4FC0     ; LOAD ข้อมูลจากM ซึ่งเป็น SOCKET #
2C42 D362        OUT  62       ; DISPLAY ใช้ SOCKET ใด
2C44 C9          RET

```

โปรแกรมย่อย P145

ทดสอบ IC ทุกประเภท

```

2C45 CD1A2C      CALL 2C1A    ; เคลื่อนย้ายข้อมูลIC ทั้งหมดเข้า AREA ที่จะPROCESS
2C48 21C14F      LXI  H,4FC1  ; POINTER ชี้ ADDRESS PIN CONTROLL BUFFER

```

2C4B 7E	MOV A,M	; นำข้อมูล PIN CONTROL เก็บไว้ที่ A
2C4C D3F0	OUT F0	; PORT A - PIN CONTROL SET ขา IC INPUT/ ; OUTPUT
2C4E 23	INX H	; เลื่อน ADDRESS ของ PIN CONTROL ถัดไป
2C4F 7E	MOV A,M	; นำข้อมูล PIN CONTROL เก็บไว้ที่ A
2C50 D3F1	OUT F1	; PORT B - PIN CONTROL, SET ขา IC ; INPUT/OUTPUT
2C52 23	INX H	; เลื่อน ADDRESS ของ PIN CONTROL ถัดไป
2C53 7E	MOV A,M	; นำข้อมูล PIN CONTROL เก็บไว้ที่ A
2C54 D3F2	OUT F2	; PORT C - PIN CONTROL, SET ขา IC INPUT/ ; OUTPUT
2C56 CD3F2C	CALL 2C3F	; เลือก SOCKET ใดก่อนโดย
2C59 CDD20	CALL 20DD	แจ้ง READY ผู้ใช้เสียบ IC ได้ และตรวจว่า ; กดปุ่ม SLOW หรือไม่กดปุ่ม หรือไม
2C5C C35F2C	JMP 2C5F	; เรียกโปรแกรมทดสอบ

โปรแกรมย่อย P146

ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC ทั้ง 3 PORT

2C5F 210040	LXI H,4000	; POINTER ชี้ INPUT LOGIC CONDITION
2C62 7E	MOV A,M	; นำค่า INPUT LOGIC จาก MEMORY เก็บไว้ที่ A
2C63 32C44F	STA 4FC4	; INPUT/BUFFER DISPLAY
2C66 D3E0	OUT E0	; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC ทาง PORT A
2C68 23	INX H	; เลื่อนไปคูข้อมูลถัดไป
2C69 7E	MOV A,M	; นำค่า INPUT LOGIC จาก MEMORY เก็บไว้ที่ A
2C6A 32C54F	STA 4FC5	; INPUT/OUTPUT BUFFER DISPLAY
2C6D D3E1	OUT E1	; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC ทาง PORT B
2C6F 23	INX H	; เลื่อนไปคูข้อมูลถัดไป
2C70 7E	MOV A,M	; นำ INPUT LOGIC จาก MEMORY เก็บไว้ที่ A
2C71 32C64F	STA 4FC6	; INPUT/OUTPUT BUFFER DISPLAY
2C74 D3E2	OUT E2	; ส่ง INPUT LOGIC เข้าขา IC ทาง PORT C CLEAR A=00 (DISPLAY INPUT FLAG
2C76 0000	NOP	



2C78	000000	NOP		
2C7B	000000	NOP		
2C7E	23	INX	H	; เลื่อนไปคูข้อมูลถัดไป
2C7F	7E	MOV	A,M	; นำข้อมูลถัดไปจาก MEMORY เก็บที่ A
2C80	23	INX	H	; เลื่อน ADDRESS ถัดไป
2C81	FEFD	CPI	FD	; ตรวจสอบว่าต้องทำ CONDITION นี้ต่อไปหรือไม่
2C83	CA932C	JZ	2C93	; ถ้าต้องทำกลับไป DRIVE INPUT LOGIC อีก
2C86	FEFE	CPI	FE	; ตรวจสอบว่า CONDITION นี้จบหรือยัง
2C88	CAEC2C	JZ	2CEC	; ไปตรวจสอบ OUTPUT ว่าได้ผลตรงกับTABLE หรือไม่
2C8B	FEFF	CPI	FF	; ตรวจสอบว่าทำครบทุก CONDITION หรือยัง
2C8D	C20020	JNZ	2000	; ถ้ายังไม่กลับไปตรวจสอบ CONDITION ถัดไป
2C90	C3FE2C	JMP	2CFE	; (DATA ERROR)

2C93	E5	PUSH	H	; SAVE HL
2C94	CD9C2C	CALL	2C9C	; ทำการรับผลและทดสอบ
2C97	E1	POP	H	; คือ HL ที่ SAVE ไว้ที่เดิม
2C98	23	INX	H	; เลื่อนไปคูข้อมูล
2C99	C3622C	JMP	2C62	; INPUT LOGIC ถัดไป

โปรแกรมย่อยที่ 47

รับข้อมูลไปประมวลผลจากขา OUT ของ IC

2C9C	DBD0	IN	D0	; รับผลจาก PORT A
2C9E	32C44F	STA	4FC4	; INPUT/OUTPUT BUFFER DISPLAY (PA)
2CA1	DBD1	IN	D1	; รับผลจาก PORT B
2CA3	32C54F	STA	4FC5	; INPUT/OUTPUT BUFFER DISPLAY (PB)
2CA6	DBD2	IN	D2	; รับผลจาก PORT C

```

2CAB 32C64F STA 4FC6 ; INPUT/OUTPUT BUFFER DISPLAY (PB)
2CAB 0000 NOP
2CAD 000000 NOP
2CB0 000000 NOP
2CB3 2AC84F LHLD 4FC8 ; POINTER ชี้ที่เก็บผลลัพธ์
2CB6 EB XCHG ; SAVE ไว้ที่ DE
2CB7 2AC94F LHLD 4FC9 ; OUTPUT TABLE
2CBA C3C32C JMP 2CC3 ; นำค่าข้อมูลผลจากการทดสอบได้จาก PORT A

2CBD CD4922 CALL 2Z49 ; ตรวจสอบว่าที่ได้ตรงกับ TABLE หรือไม่ แล้วถ้าท
; สอบแบบ SLOW จะ DELAY ให้อายุ.
2CC0 23 INX H ; เลื่อนค่า POINTER TRUTH ข้อมูลถัดไป
2CC1 13 INX D ; เลื่อน ADDRESS ของ MEMMO ที่เก็บผลลัพธ์แต่ละ
; CONDITION
2CC2 09 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P148

ตรวจสอบผลการทดสอบว่าตรงกันหรือไม่

```

2CC3 3AC44F LDA 4FC4 ; นำข้อมูลผลจากการทดสอบที่ได้จาก PORT A
2CC6 47 MOV B,A ; SAVE A ไว้ที่ B
2CC7 3AC14F LDA 4FC1 ; LOAD PIN CONTROL PORT A
2CCA A0 ANA B ; MASK เอาเฉพาะข้อมูล OUTPUT
; ตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกับ TRUTH TABLE หรือไม่
2CCB CDBD2C CALL 2CBD ; แล้ว SAVE ผลวิเคราะห์ไว้
2CCE 3AC54F LDA 4FC5 ; นำข้อมูลผลจากการทดลองที่ได้จาก PORT B
2CD1 47 MOV B,A ; SAVE A ไว้ที่ B
2CD2 3AC24E LDA 4EC2 ; LOAD PIN CONTROL PORT B
2CD5 A0 ANA B ; MASK เอาเฉพาะข้อมูล OUTPUT
; ตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกับ TRUTH TABLE หรือไม่
2CD6 CDBD2C CALL 2CBD ; แล้ว SAVE ผลวิเคราะห์ไว้

```

2CD9 3AC64F LDA 4FC6 ; นำข้อมูลจากการทดสอบที่ได้จาก PORT B  
2CDC 47 MOV B,A ; SAVE ไว้ที่ B  
2CDD 3AC34F LDA 4FC3 ; LOAD PIN CONTROL PORT C  
2CE0 A0 ANA B ; MASK เอาเฉพาะ OUTPUT

2CE1 CDBD2C CALL 2CED ; ตรวจสอบผลที่ได้ว่าตรงกับ TRUTH TABLE หรือไม่  
; แล้ว SAVE ผลที่วิเคราะห์ไว้  
2CE4 22C94F SHLD 4FC9 ; เก็บค่า ADDRESS ที่ OUTPUT TABLE  
2CE7 EB XCHG ; HL = DE  
2CE8 22C84F SHLD 4FC8 ; เก็บค่า ADDRESS ที่ผลลัพธ์  
2CEB C9 RET ;

2CEC E5 PUSH H ; SAVE HL  
2CED CD9C2C CALL 2C9C ; ทำการรับผลและทดสอบ  
2CF0 2AC84F LHLD 4FC8 ; เอาค่า POINTER ที่ผลลัพธ์ไว้ที่ HL  
2CF3 36EA MVI M,EA ; SET ค่า EA ปิดบอกรับ PART แล้ว  
2CF5 23 INX H ; เลื่อน POINTER ที่ผลลัพธ์อีก 1  
2CF6 22C84F SHLD 4FC8 ; SAVE ค่าที่ผลลัพธ์ไว้ที่เดิม  
; คืน HL ที่ SAVE ไว้ (ค่า ENTRY INPUT  
2CF9 E1 POP H ; LOGIC TABLE)  
2CFA 23 INX H ; เลื่อนไปคู่อข้อมูล IN LOGIC ถัดไป  
2CFB C3622C JMP 2C62 ;

2CFE E5 PUSH H ; SAVE HL

2CFF CD9C2C	CALL 2C9C	; ทำการรับผลและทดสอบ
2D02 2AC84F	LHLD 4FC8	; เอาค่า POINTER ซึ่ผลลัพธ์ไว้ที่ HL
2D05 36EE	MVI M,EE	; SET ค่า EE บอกรับ CONDITION สุกท้ายแล้ว
2D07 E1	POP H	;
2D08 CD6E23	CALL 236E	; สรุปผลการทดสอบทั้งหมด
2D0B C9	RET	;

2D0C 210009	LXI H,0900	; POINTER ซึ่ข้อมูลทั้งหมดของ IC ที่จะนำมาทดสอบ ; เบนานัน
2D0F CD452C	CALL 2C45	; ทดสอบ IC ได้
2D12 C30C2D	JMP 2D0C	;

2D15 00	NOP	;
2D16 00	NOP	;
2D17 00	NOP	;
2D18 00	NOP	;
2D19 00	NOP	;
2D1A 00	NOP	;
2D1B 00	NOP	;
2D1C 00	NOP	;
2D1D 00	NOP	;
2D1E 00	NOP	;
2D1F 00	NOP	;
2D20 00	NOP	;

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2D21 E5           PUSH H           ; SAVE HL  
2D22 CD0028       CALL 2800         ; รับข้อมูลจาก KEYBOARD  
2D25 00           NOP               ;  
2D26 00           NOP               ;  
2D27 FE16         CPI 16           ; CLEAR หรือไม่  
                  ถ้าใส่ CLEAR DISPLAY และ CLEAR MEMORY  
2D29 CA8B2D       JZ 2D3B          ; 4E00-4E07 แล้วสามารถใส่เลขข้อมูลใหม่ได้  
2D2C FE00         CPI 00           ; ตรวจสอบว่าเลข 0 เข้ามาหรือไม่  
                  LOAD ค่าเลข 0 ลงใน MEMORY แล้ว DISPLAY  
2D2E CA3B2D       JZ 2D3B          ; ออก 7-SEGMENT  
2D31 FE01         CPI 01           ; ตรวจสอบว่าเลข 1 เข้ามาหรือไม่  
                  LOAD ค่าเลข 1 ลงใน MEMORY แล้ว DISPLAY  
2D33 CA402D       JZ 2D40          ; ออก 7-SEGMENT  
2D36 D310         OUT 10           ; ส่งเสียง ALARM  
2D38 C3222D       JMP 2D22         ; กลับไปตรวจ KEY ใหม่

2D3B 4F           MOV C,A          ; SAVE เลข 0 ไว้ที่ C  
2D3C 3E3F         MVI A,3F         ; 3F เป็นค่า = เลข 0 ออก 7-SEGMENT  
2D3E E1           POP H             ;  
2D3F C9           RET               ;

2D40 4F           MOV C,A          ; SAVE เลข 1 ไว้ที่ C  
2D41 3E06         MVI A,06         ; 06 เป็นค่า = เลข 1 ออก 7-SEGMENT  
2D43 E1           POP H             ;  
2D44 C9           RET               ;

โปรแกรมย่อย P149

รับข้อมูลจาก KEYBOARD แล้วแสดงออก 7 - SEGMENT

2D45	F5	PUSH	PSW	;	
2D46	C5	PUSH	B	;	
2D47	D5	PUSH	D	;	SAVE REG, ทั้งหมด
2D48	E5	PUSH	H	;	
2D49	21004E	LXI	H, 4E00	;	POINTER ชี้ที่เก็บ DATA เมื่อ KEY เบอว IC เข้ามา รอการก KEY รับผลจาก MEMORY
2D4C	CD992D	CALL	2D99	;	ADDR 4E00
2D4F	D370	OUT	70	;	แสดงผลทาง TSER. DIGIT ที่ 1
2D51	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E01
2D54	D371	OUT	71	;	แสดงผลทาง 7 - SEG DIGIT 2
2D56	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E02
2D59	D372	OUT	72	;	แสดงผลทาง 7 - SEGMENT DIGIT ที่ 3
2D5B	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E03
2D5E	D373	OUT	73	;	แสดงผลทาง 7 - SEGMENT DIGIT ที่ 4
2D60	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E04
2D63	D374	OUT	74	;	แสดงผลทาง 7 - SEG, DIGIT ที่ 5
2D65	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E05
2D68	D375	OUT	75	;	แสดงผลทาง 7 - SEG DIGIT ที่ 6
2D6A	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E06
2D6D	D376	OUT	76	;	แสดงผลทาง 7 - SEG, DIGIT ที่ 7
2D6F	CD992D	CALL	2D99	;	รอการก KEY รับผลจากการ KEY เก็บใน MEMORY ADDR 4E07
2D72	D377	OUT	77	;	แสดงผลทาง 7 - SEG, DIGIT ที่ 8
2D74	CD0028	CALL	2800	;	รับข้อมูลจาก KEY
2D77	FE14	CPI	14	;	ตรวจว่ากดปุ่ม ENTER หรือไม่
2D79	CA7F2E	JZ	2E7F	;	ตัวก RETURN
2D7C	FE16	CPI	16	;	ตรวจว่ากดปุ่ม CLEAR หรือไม่
2D7E	CA882E	JZ	2E88	;	CLEAR เริ่มรับข้อมูลใหม่
2D81	D310	OUT	10	;	ALARM
2D83	C3742D	JMP	2D74	;	กลับไปตรวจว่ากด ENTER หรือ CLEAR หรือไม่

```
2D86 E1      POP  H      ;  
2D87 D1      POP  D      ; คิวของเกาท์ SAVE ไว้  
2D88 C1      POP  B      ;  
2D89 F1      POP  PSW   ;  
2D8A C9      RET                ;  
  
2D8E 00      NOP                ;  
2D8C CD2B23  CALL 232B   ; CLEAR DISPLAY ทั้ง8DIGIT และSET  
2D8F C3452D  JMP  2D45   ; MEMORY ทั้งหมด FF ทุกที
```

โปรแกรมทดสอบ P150

รับข้อมูลจาก KEYBOARD และแปลงรหัสเรียบร้อย

```
2D92 CD452D  CALL 2D45   ; รับข้อมูล SAVE ไว้ใน  
2D95 CBC42D  CALL 2DC4   ; เลขข้อมูลที่ใดใน MEMORY แปลงเป็น  
2D98 C9      RET                ; 1 BYTE
```

```
2D99 CD212D  CALL 2D21   ;  
2D9C 71      MOV  M,C    ;  
2D9D 23      INX  H      ;  
2D9E C9      RET                ;
```

ศูนย์วิทยุทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมย่อย P (5)

	รวมข้อมูลจาก MEMORY	ลงเหลือ 1 BYTE	เลื่อนไทยุ
2D9F 7E	MOV A,M	; LOAD ข้อมูลจาก MEMORY	ในท BIT 7
2DA0 0F	RRC		
2DA1 77	MOV M,A		SAVE ไท้เติม
2DA2 23	INX H		
2DA3 7E	MOV A,M		LOAD ข้อมูลจาก MEMORY
2DA4 0F	RRC		เลื่อนไทยุ BIT 6
2DA5 0F	RRC		
2DA6 77	MOV M,A		SAVE ไท้เติม
2DA7 23	INX H		
2DA8 7E	MOV A,M		LOAD ข้อมูลจาก MEMORY
2DA9 0F	RRC		
2DAA 0F	RRC		เลื่อนไทยุ BIT 5
2DAB 0F	RRC		
2DAC 77	MOV M,A		SAVE ไท้เติม
2DAD 23	INX H		
2DAE 7E	MOV A,M		LOAD ข้อมูลจาก MEMORY
2DAF 0F	RRC		
2DB0 0F	RRC		เลื่อนไทยุ BIT 4
2DB1 0F	RRC		
2DB2 0F	RRC		
2DB3 77	MOV M,A		SAVE ไท้เติม
2DB4 23	INX H		
2DB5 7E	MOV A,M		LOAD ข้อมูลจาก MEMORY
2DB6 07	RLC		
2DB7 07	RLC		





2DB8 07	RLC	;	
2DB9 77	MOV M,A	;	SAVE ไท้เดิม
2DBA 23	INX H	;	
2DBB 7E	MOV A,M	;	LOAD ข้อมูลจาก MEMORY
2DBC 07	RLC	;	เลื่อนไต่อยู่ที่ BIT 2
2DBD 07	RLC	;	
2DBE 77	MOV M,A	;	SAVE ไท้เดิม
2DBF 23	INX H	;	
2DC0 7E	MOV A,M	;	LOAD ข้อมูลจาก MEMORY
2DC1 07	RLC	;	เลื่อนไต่อยู่ที่ BIT 1
2DC2 77	MOV M,A	;	SAVE ไท้เดิม
2DC3 C9	RET	;	

โปรแกรมย่อย P152

รวมข้อมูลใน MEMORY ที่ ROTAE จาก 8 LOCATION เป็น 1 BYTE

2DC4 E5	PUSH H	;	SAVE HL, BC
2DC5 C5	PUSH B	;	
2DC6 21004E	LXI H,4E00	;	POINTERชี้ที่ 4E00
2DC9 CD9F2D	CALL 2D9F	;	เลื่อน BIT ไต่ตรงกับความเป็นจริง
2DCC 21004E	LXI H,4E00	;	POINTERชี้ที่ 4E00
2DCF 0E07	MVI C,07	;	มี 8 จำนวน
2DD1 CDD72D	CALL 2DD7	;	OR ทั้ง 8 LOCATION
2DD4 C1	POP B	;	คือ BC, และ HL
2DD5 E1	POP H	;	
2DD6 C9	RET	;	

```
2DD7 7E      MOV  A,M      ;
2DD8 23      INX  H        ;
2DD9 46      MOV  B,M      ;
2DDA B0      ORA  B        ;
2ddb 0D      DCR  C        ;
2DDC C2D82D  JNZ  2DD8     ;
2DDF C9      RET          ;
```

โปรแกรมย่อย P153

ทดสอบแบบ MANUAL TEST      ช่วงรับข้อมูล

```
2DE0 CD292E  CALL 2E29     ; DISPLAY "SOCKET"
2DE3 CD922D  CALL 2D92     ; รับ ข้อมูลเข้าระบบ
2DE6 32C04F  STA  4FC0     ; STORGE SOCKET ที่เลือกใช้
2DE9 CD302E  CALL 2E30     ; DISPLAY "PIN CONTROL"
2DEC CD922D  CALL 2D92     ; รับข้อมูลเข้าระบบ
2DEF 32C14F  STA  4FC1     ; PA PIN CON
2DF2 CD922D  CALL 2D92     ; รับข้อมูลเข้ามา
2DF5 32C24F  STA  4FC2     ; PB PIN CON
2DF8 CD922D  CALL 2D92     ; รับข้อมูลเข้ามา
2DFB 32C34F  STA  4FC3     ; PC PIN CON
2DFE CD372E  CALL 2E37     ; DISPLAY "INPUT LOGIC"
2E01 210040  LXI  H,4000   ; POINTERที่เก็บ INPUT LOGIC
2E04 CD922D  CALL 2D92     ; รับข้อมูลเข้ามา
2E07 FEFF    CPI  FF       ; ตรวจสอบว่ารับข้อมูล INPUT LOGIC หรือยัง
2E09 CA112E  JZ   2E11     ; ถ้าเท่ากับ FFรับข้อมูล INPUT LOGIC
2E0C 77      MOV  M,A      ; ไม่เท่า SAVE ข้อมูล
2E0D 23      INX  H        ; เลื่อนไป ADDRESS ถัดไป
2E0E C3042E  JMP  2E04     ; กลับไปรับข้อมูลต่อ
```

```
2E11 77      MOV  M,A      ;
2E12 CD3E2E  CALL 2E3E    ; DISPLAY OUTPUT LOGIC
2E15 210048  LXI  H,4800  ; POINTER ชี้ที่เก็บ OUTPUT LOGIC
2E18 CD922D  CALL 2D92    ; รับข้อมูล
2E1B FEFF    CPI  FF      ; ตรวจสอบข้อมูลหรือยัง
2E1D CA252E  JZ   2E25    ;
2E20 77      MOV  M,A      ; ข้อมูลเก็บใน MEMORY
2E21 23      INX  H       ; เปลี่ยนค่า ADDRESS ถัดไป
2E22 C3182E  JMP  2E18    ; ไป PROGRAM ทดสอบ IC
```

```
2E25 77      MOV  M,A      ;
2E26 C3482C  JMP  2C48    ;
```

#### โปรแกรมทดสอบ P154

##### DISPLAY SOCKET

```
2E29 215D2E  LXI  H,2E5D  ; POINTER ชี้ข้อมูลแสดง "SOCKET"
2E2C CD752E  CALL 2E75    ; แสดงออก 7-SEGMENT
2E2F C9      RET
```

#### โปรแกรมย่อย P155

##### DISPLAY PIN CONTROL

```
2E30 21632E  LXI  H,2E63  ; POINTER ชี้ข้อมูลแสดง "PIN 6"
2E33 CD752E  CALL 2E75    ; แสดงออก 7-SEGMENT
2E36 C9      RET
```



โปรแกรมย่อย P156

DISPLAY INPUT

```

2E37 21692E LXI H,2E69 ; POINTER ชี้ข้อมูลแสดง "INPUT"
2E3A CD752E CALL 2E75 ; แสดงออก 7-SEGMENT
2E3D C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P157

DISPLAY OUTPUT

```

2E3E 216F2E LXI H,2E6F ; POINTER ชี้ข้อมูลแสดง "OUTPUT"
2E41 CD752E CALL 2E75 ; แสดงออก 7 - SEGMENT
2E44 C9 RET ;

```

โปรแกรมย่อย P158

DISPLAY ออก 7-SEGMENT, # 78 - 7D กลาง

```

2E45 7E MOV A,M ;
2E46 D378 OUT 78 ; DISPLAY 7-SEGMENT # 78
2E48 23 INX H ;
2E49 7E MOV A,M ;
2E4A D379 OUT 79 ; DISPLAY 7-SEGMENT # 79
2E4C 23 INX H ;
2E4D 7E MOV A,M ;
2E4E D37A OUT 7A ; DISPLAY 7-SEGMENT # 7A
2E50 23 INX H ;
2E51 7E MOV A,M ;
2E52 D37B OUT 7B ; DISPLAY 7-SEGMENT # 7B
2E54 23 INX H ;

```

```

2E55 7E      MOV  A,M      ;
2E56 D37C    OUT  7C      ; DISPLAY 7-SEGMENT # 7C
2E58 23      INX  H        ;
2E59 7E      MOV  A,M      ;
2E5A D37D    OUT  7D      ; DISPLAY 7-SEGMENT # 7D
2E5C C9      RET

```

ข้อมูลสำหรับตัวอักษรต่าง ๆ

```

2E5D 6D
2E5E 3F
2E5F 39
2E60 76
2E61 79
2E62 317306
2E65 37
2E66 00
2E67 00
2E68 39
2E69 0637
2E6B 73
2E6C 3E31
2E6E 00
2E6F 3F
2E70 3E31
2E72 73
2E73 3E31
2E75 CD2B23

```

'SOCKET'

'PIN C'

'INPUT'

'OUTPUT'

```

CALL 232B ; CLEAR 7-SEGMENT ถาวร

```

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

```
2E78 CD6628      CALL 2866      ; DELAY 10mS
2E7B CD452E      CALL 2E45      ; กลับไปรับข้อมูลใหม่
2E7E C9          RET           ;

2E7F CD2B23      CALL 232B      ; CLEAR 7-SEGMENT แลวน
2E82 CD6628      CALL 2866      ; DELAY 10mS
2E85 C3862D      JMP 2D86      ; กลับไปคืนของที่ SAVE ไว้แล้ว RETURN

2E88 CD2B23      CALL 232B      ; CLEAR 7-SEGMENT แลวน
2E8B C3492D      JMP 2D49      ; กลับไปรับข้อมูลใหม่
```

โปรแกรมทดสอบ

IC 2 I/P NAND GATE

400 CD1408 CALL 0814 ; โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น NAND GATE  
กลับไปที่โปรแกรมทดสอบ IC 2 I/P  
403 CDFB26 CALL 26F3 ; NAND GATE  
406 C9 RET ;

โปรแกรมย่อยทดสอบ

IC 2 I/P AND GATE

407 CD0A08 CALL 080A ; โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น AND GATE  
กลับไปที่โปรแกรมทดสอบ IC 2 I/P  
40A CDAA26 CALL 26AA ; AND GATE  
40D C9 RET ;

โปรแกรมทดสอบ

IC 2 I/P OR GATE

40E CD0F08 CALL 080F ; โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น OR GATE  
กลับไปที่โปรแกรมทดสอบ  
411 CDB626 CALL 26B6 ; IC OR GATE  
414 C9 RET ;

โปรแกรมทดสอบ

IC 2 I/P EXCLUSIVE OR GATE

415 CD2308 CALL 0823 ; โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น EXCLUSIVE  
OR GATE  
418 CDC226 CALL 26C2 ; กลับไปที่โปรแกรมทดสอบ IC EXCLUSIVE OR  
41B C9 RET ;

โปรแกรมทดสอบ

IC TRI STATE # 74125

41C CD1E08 CALL 081E ; ไขว้ DISPLAY แสดงว่าเป็น TRI-STATE  
41F CDCE26 CALL 26CE ; กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ  
422 C9 RET ; IC TRI-STATE # 74125

โปรแกรมทดสอบ

IC INVERTOR

423 CD0008 CALL 0800 ; ไขว้ DISPLAY แสดงว่าเป็น IC INVERTOR  
426 CDD625 CALL 25D6 ; กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ  
429 C9 RET ; IC INVERTOR

โปรแกรมทดสอบ

IC BUFFER

42A CD0508 CALL 0805 ; ไขว้ DISPLAY แสดงว่าเป็น IC BUFFER  
42D CDE525 CALL 25E5 ; กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ  
430 C9 RET ; IC BUFFER

โปรแกรมทดสอบ

IC 2 I/P NOR GATE

431 CD1908 CALL 0819 ; ไขว้ DISPLAY แสดงว่าเป็น IC NOR GATE  
434 CD3B27 CALL 273B ; กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ  
437 C9 RET ; IC 2 I/P NOR GATE



โปรแกรมทดสอบ

IC 2 I/P NAND GATE # 7401, 7439

438 CD1408	CALL 0814	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น IC NAND GATE
43B CD7328	CALL 2873	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC NAND GATE
43E C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

IC 3 I/P NAND GATE # 7410, 7412

43F CD1408	CALL 0814	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น IC NAND GATE
442 CD0929	CALL 2909	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC 3 I/P NAND GATE
445 C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

3 I/P AND GATE # 7411

446 CD0A08	CALL 080A	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น IC AND GATE
449 CD2729	CALL 2927	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC 3 I/P AND GATE
44C C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

3 I/P NOR GATE # 7427

44D CD1908	CALL 0919	;	โชว์ DISPLAY ว่าเป็น IC NOR GATE
450 CD1829	CALL 2918	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC 3 I/P NOR GATE
453 C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

IC 4 I/P NAND GATE # 7420, 7422, 7440, 7413

454 CD1408	CALL 0814	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น NAND GATE
457 CDAE29	CALL 29AE	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ 4 I/P NAND GATE
45A C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

IC TRI-STATE # 74126

45B CD1E08	CALL 081E	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น TRI-STATE
45E CDDA26	CALL 26DA	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC TRI-STATE
461 C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

IC AND GATE 4 INPUT # 7421

462 CD0A08	CALL 080A	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น AND GATE
465 CDBC29	CALL 29BC	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC AND GATE
468 C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ

IC NAND GATE # 7430

469 CD1408	CALL 0814	;	โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น NAND GATE
46C CD382A	CALL 2A38	;	กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC NAND GATE
46F C9	RET	;	

โปรแกรมทดสอบ  
IC SHIFT REGISTER

470 CD5008	CALL 0850	; โชว์ DISPLAY แสดงว่าเป็น SHIFT REGISTER
473 CDD02A	CALL 2AD0	; กลับไปทำโปรแกรมทดสอบ IC SHIFT REGISTER
476 C9	RET	;

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรแกรมทดสอบ

INVERTOR

```
0800 3E01      MVI  A,01      ; DISPLAY INVERTOR
0802 D390      OUT  90        ; LED สว่างแสดงผลว่าเป็น INVERTOR
0804 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

BUFFER

```
0805 3E02      MVI  A,02      ; DISPLAY BUFFER
0807 D390      OUT  90        ; LED สว่าง แสดงว่าเป็น BUFFER
0809 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

AND GATE

```
080A 3E04      MVI  A,04      ; DISPLAY AND GATE
080C D390      OUT  90        ; LED สว่างแสดงว่าเป็น AND GATE
080E C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

OR GATE

```
080F 3E08      MVI  A,08      ; DISPLAY OR GATE
0811 D390      OUT  90        ; LED สว่างแสดงว่าเป็น OR GATE
0813 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

NAND GATE

```
0814 3E10      MVI  A,10      ; DISPLAY NAND GATE
0816 D390      OUT  90        ; LED สว่าง แสดงว่าเป็น NAND GATE
0818 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

NOR GATE

```
0819 3E20      MVI  A,20      ; DISPLAY NOR GATE
081B D390      OUT  90        ; LED สว่าง แสดงว่าเป็น NOR GATE
081D C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

TRI - STATE

```
081E 3E40      MVI  A,40      ; DISPLAY TRI - STATE
0820 D390      OUT  90        ; LED สว่าง แสดงว่าเป็น TRI - STATE
0822 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

EX - OR GATE

```
0823 3E80      MVI  A,80      ; DISPLAY EX - OR GATE
0825 D390      OUT  90        ; LED สว่าง แสดงว่าเป็น EX - OR GATE
0827 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

RS - FLIP FLOP

```
0828 3E01 MVI A,01 ; DISPLAY RS-FLIP FLOP
082A D391 OUT 91 ; LED สว่างแสดงว่าเป็น RS-FLIP FLOP
082C C9 RET ;
```

โปรแกรมทดสอบ

D - FLIP FLOP

```
082D 3E02 MVI A,02 ; DISPLAY D-FLIP FLOP
082F D391 OUT 91 ; LED สว่างแสดงว่าเป็น D-FLIP FLOP
0831 C9 RET ;
```

โปรแกรมทดสอบ

JK FLIP FLOP

```
0832 3E04 MVI A,04 ; DISPLAY JK FLIP FLOP
0834 D391 OUT 91 ; LED สว่างแสดงว่าเป็น JK FLIP FLOP
0836 C9 RET ;
```

โปรแกรมทดสอบ

ENCODER

```
0837 3E08 MVI A,08 ; DISPLAY ENCODER
0839 D391 OUT 91 ; LED สว่างแสดงว่าเป็น ENCODER
083B C9 RET ;
```

โปรแกรมทดสอบ

DECODER

```
083C 3E10      MVI  A,10      ; DISPLAY DECODER
083E D391      OUT  91        ; LED สว่างแสดงว่าเป็น DECODER
0840 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

MULTIPLEXER

```
0841 3E20      MVI  A,20      ; DISPLAY MULTIPLEXER
0843 D391      OUT  91        ; LED สว่างแสดงว่าเป็น MULTIPLEXER
0845 C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

DEMULTIPLEXER

```
0846 3E40      MVI  A,40      ; DISPLAY DEMULTIPLEXER
0848 D391      OUT  91        ; LED สว่างแสดงว่าเป็น DEMULTIPLEXER
084A C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ

COUNTER

```
084B 3E80      MVI  A,80      ; DISPLAY COUNTER
084D D391      OUT  91        ; LED สว่างแสดงว่าเป็น COUNTER
084F C9        RET                ;
```

โปรแกรมทดสอบ  
SHIFT REGISTER

```
0850 3E01      MVI  A,01      ; DISPLAY SHIFT REGISTER
0852 D392      OUT   92       ; LED สว่างแสดงว่าเป็น SHIFT REGISTER
0854 C9        RET                               ;
```

โปรแกรมทดสอบ  
COMPARATOR

```
0855 3E02      MVI  A,02      ; DISPLAY COMPARATOR
0857 D392      OUT   92       ; LED สว่างแสดงว่าเป็น COMPARATOR
0859 C9        RET                               ;
```

โปรแกรมทดสอบ  
OTHER IC

```
085A 3E80      MVI  A,80      ; DISPLAY OTHER IC
085C D392      OUT   92       ; LED สว่างแสดงว่าเป็น OTHER IC
085E C9        RET                               ;
```

```
085F 3E00      MVI  A,00      ;
0861 D390      OUT   90       ; RESET PORT A
0863 D391      OUT   91       ; RESET PORT B
0865 D392      OUT   92       ; RESET PORT C
0867 C9        RET                               ;
```



```

000 31FF1F      LXI  SP,1FFF ; TOP OF STACK
003 3E80       MVI  A,80   ;
005 D393       OUT  93     ;
007 3E16       MVI  A,16   ;
009 D380       OUT  80     ;
00B 3E01       MVI  A,01   ;
00D D381       OUT  81     ;
00F FB        EI      ;
010 C30020     JMP  2000   ;ไปทำโปรแกรมทดสอบ IC

100 C30002     JMP  0200   ; INTERRUPT IC SHORT CCT.

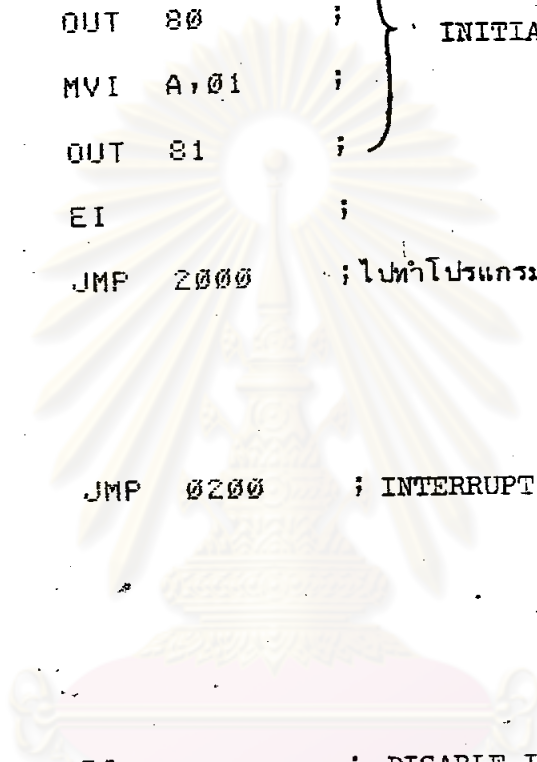
200 F3        DI      ; DISABLE INTERRUPT
201 3E80       MVI  A,80   ;
203 32D74F     STA  4FD7   ;
206 CD0003     CALL 0300   ;
209 D330       OUT  30     ; ส่งเสียง ALARM
20B CD4A27     CALL 274A   ;
20E CD4A27     CALL 274A   ;
211 D340       OUT  40     ; RESET ALARM
213 3E20       MVI  A,20   ; RESET INTERRUPT SERVICE
215 D380       OUT  80     ; ROUTINE
217 FB        EI      ; ENABLE INTRRUPT
218 C9        RET      ;

```

} INITIALIZE 8259

} DISPLAY IC SHORT CCT.

} DELAY 2 SEC



โปรแกรม DISPLAY GOOD/BAD/IC SHORT CCT

```
0300 E5      PUSH H      ;
0301 C5      PUSH B      ;
0302 21D04F  LXI H,4FD0  ;
0305 0E07    MVI C,07    ;
0307 CDD72D  CALL 2DD7    ;
030A C1      POP B      ;
030B E1      POP H      ;
030C C9      RET       ;
```



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเบอร์ IC และ POINTER ของ PROGRAM

0B00	00	AF	03	AF	26	AF	37	AF	38	AF	13	2A	08	AF	09	AF
0B10	32	AF	86	AF	12	5A	12	6A	04	AF	05	AF	06	AF	14	AF
0B20	16	AF	07	AF	17	AF	02	AF	28	AF	33	AF	01	AF	39	AF
0B30	10	AF	11	AF	12	AF	27	AF	20	AF	22	AF	40	AF	13	AF
0B40	21	AF	30	AF	16	4A	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B50	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B60	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0B70	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	07	04	07
0B80	04	0E	04	15	04	1C	04	5B	04	23	04	23	04	23	04	23
0B90	04	23	04	2A	04	2A	04	31	04	31	04	31	04	38	04	38
0BA0	04	3F	04	46	04	3F	04	4D	04	54	04	54	04	54	04	54
0BB0	04	62	04	69	04	70	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
0C00	00	AF	01	AF	08	AF	04	AF	05	AF	10	AF	11	AF	15	AF
0C10	20	AF	22	AF	40	AF	21	AF	30	AF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0C20	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0C30	00	AF	03	AF	13	2A	08	AF	09	AF	32	AF	86	AF	04	AF
0C40	05	AF	02	AF	10	AF	11	AF	15	AF	20	AF	22	AF	40	AF
0C50	14	0A	30	AF	B0	26	F3	26	F3	26	F3	26	AA	26	AA	26
0C60	B6	26	C2	25	D6	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0C70	04	00	04	00	04	07	04	23	04	23	04	3F	04	46	04	46
0C80	04	54	04	54	04	54	04	62	04	69	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0C90	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0CA0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0CB0	04	00	04	00	04	00	04	07	04	07	04	0E	04	15	04	23
0CC0	04	23	04	31	04	3F	04	46	04	46	04	54	04	54	04	54
0CD0	04	54	04	69	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0CE0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0CF0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0D00	00	AF	03	AF	26	AF	08	AF	09	AF	32	AF	04	AF	05	AF
0D10	02	AF	10	AF	11	AF	20	AF	30	AF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0D20	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0D30	04	00	04	00	04	00	04	07	04	07	04	0E	04	23	04	23
0D40	04	31	04	3F	04	46	04	54	04	69	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0D50	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0D60	00	AF	03	AF	26	AF	37	AF	38	AF	13	2A	08	AF	09	AF
0D70	31	AF	86	AF	13	6A	12	5A	12	6A	04	AF	05	AF	14	AF
0D80	02	AF	28	AF	33	AF	01	AF	10	AF	11	AF	1A	F1	5A	F2
0D90	7A	F2	0A	F2	2A	F4	0A	F1	3A	F2	1A	F0	26	6A	30	AF
0DA0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0DB0	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0DC0	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	00	04	07	04	07
0DD0	04	0E	04	15	04	15	04	1C	04	5B	04	23	04	23	04	23
0DE0	04	31	04	31	04	31	04	38	04	3F	04	46	04	3F	04	46
0DF0	04	4D	04	54	04	54	04	54	04	54	04	62	04	15	04	69
0E20	00	AF	08	AF	32	AF	04	AF	14	AF	02	AF	10	AF	20	AF
0E30	86	AF	30	AF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0E70	04	00	04	07	04	0E	04	23	04	23	04	31	04	3F	04	54
0E80	04	15	04	69	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0F00	3F	06	5B	4F	66	6D	7D	07	7F	6F	77	7C	39	5E	79	71
0F10	76	38	ED	1E	52	3E	16	17	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF	FF
0F20	04	04	04	00	01	00	00	01	00	00	00	04	00	04	04	04
0F30	00	04	04	00	00	04	04	04	04	00	04	04	04	00	00	00
0F40	04	04	04	04	04	04	04	00	04	00	00	00	00	00	00	00
0F50	00	00	00	00	00	00	00	04	00	00	00	00	FF	FF	FF	FF

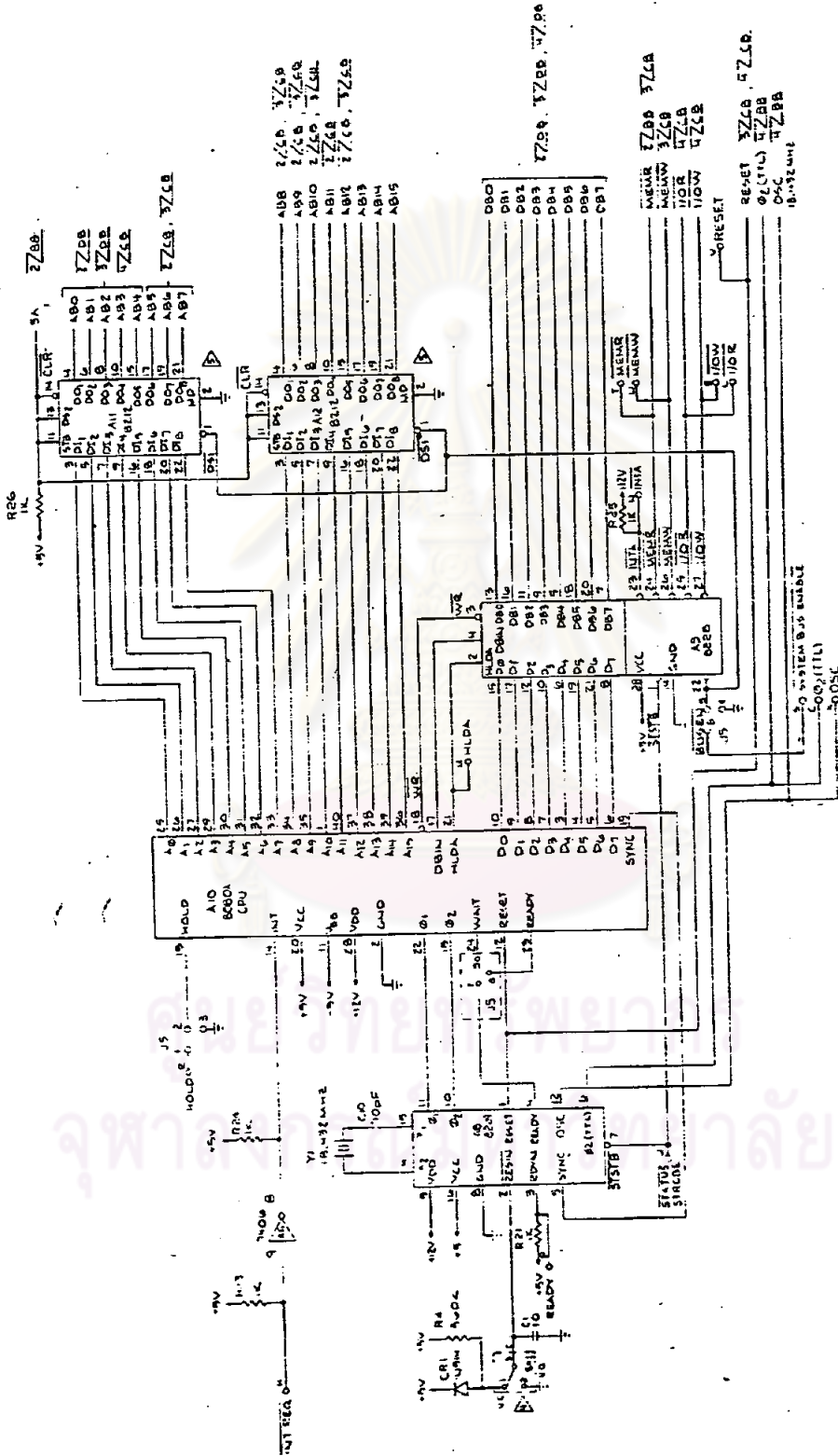


ภาคผนวก ค

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

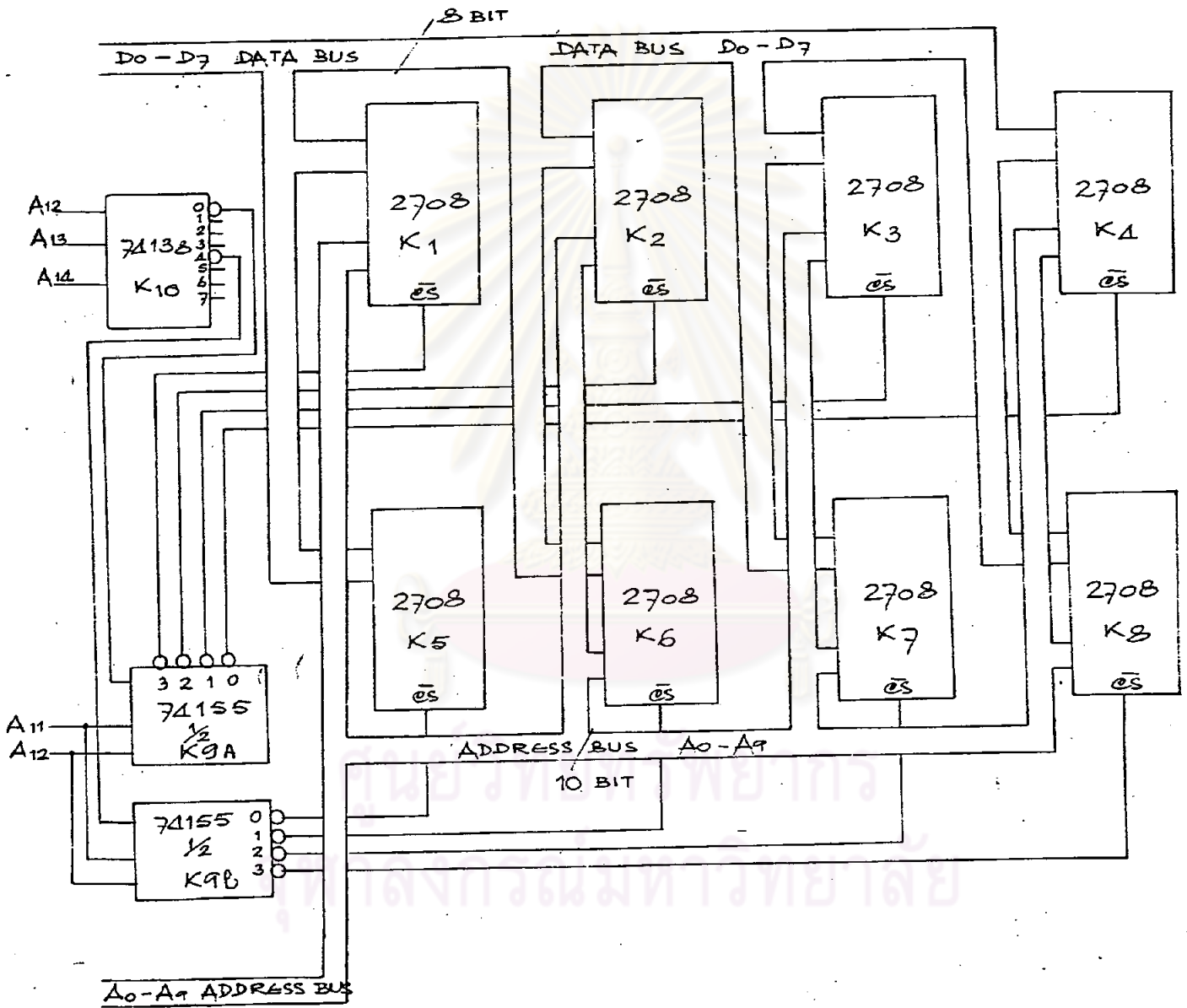
ภาคผนวกนี้เป็นการแสดงองค์ประกอบของ MICROPROCESSOR ที่นำมาใช้กับเครื่องทดสอบ  
วงจรประมวลเชิงเลข จากรูปที่ ค.๑

ก) แสดงวงจร CPU ใช้ PROCOPROCESSOR เบอร์ 8080 จากรูปที่ ค.๑



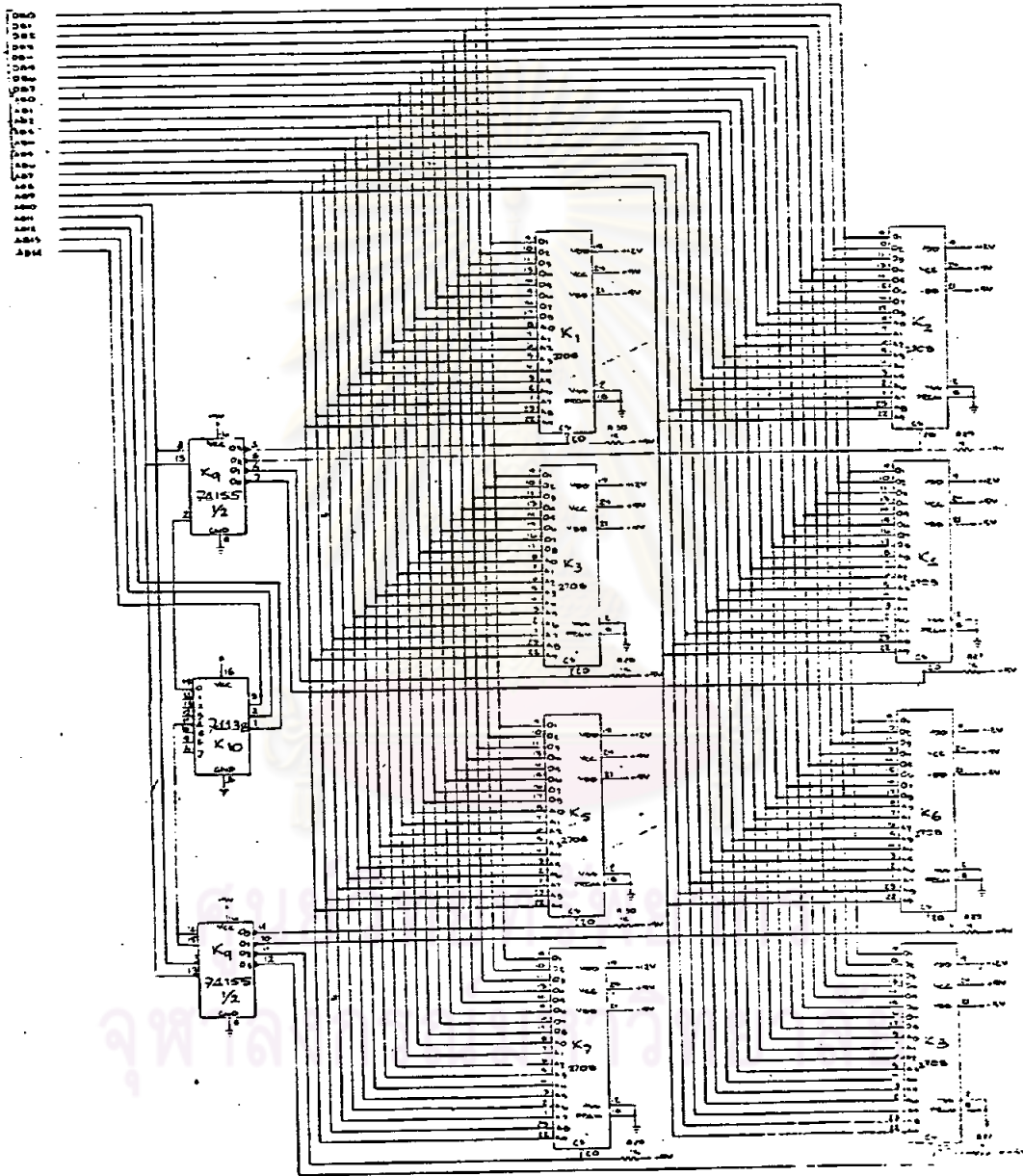
รูปที่ ค.๑ วงจร MPU ที่ประกอบขึ้นอย่างสมบูรณ์ที่ใช้กับเครื่องทดสอบนี้

ข) หน่วยความจำที่เป็น FIXED PROGRAM จะมี ลักษณะ BLOCK DIAGRAM ของวงจร MEMORY ที่เป็น EPROM ขนาด 8K BYTE ใช้เบอร์ IC 2708 จำนวน ๘ ตัว ดังรูปที่ ข.๒ และวงจรจริงในรูปที่ ค.๓



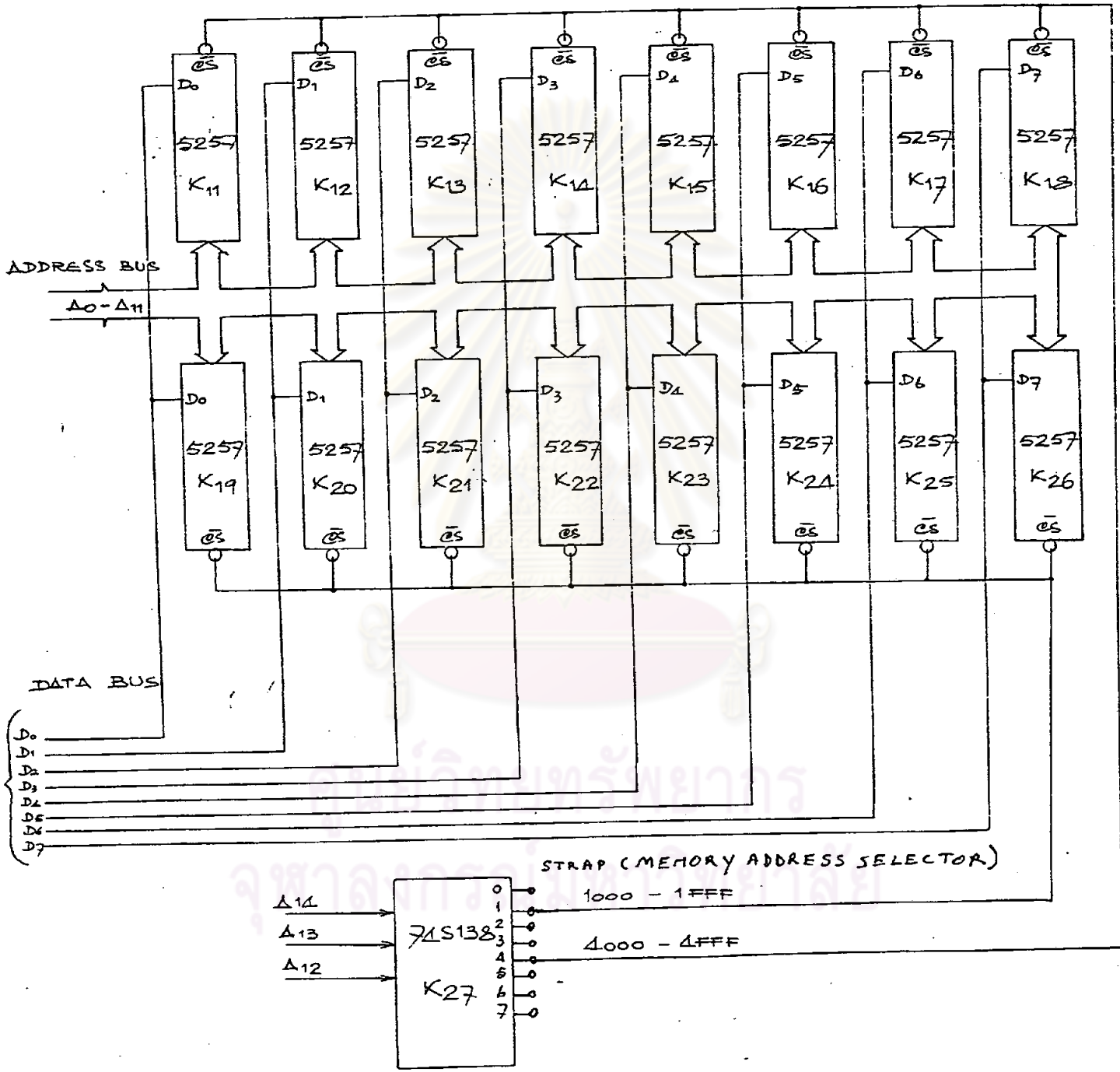
รูปที่ ค.๒ แสดง BLOCK DIAGRAM MEMORY ที่เป็นประเภทถาวร EPROM

ขนาด 8k BYTE



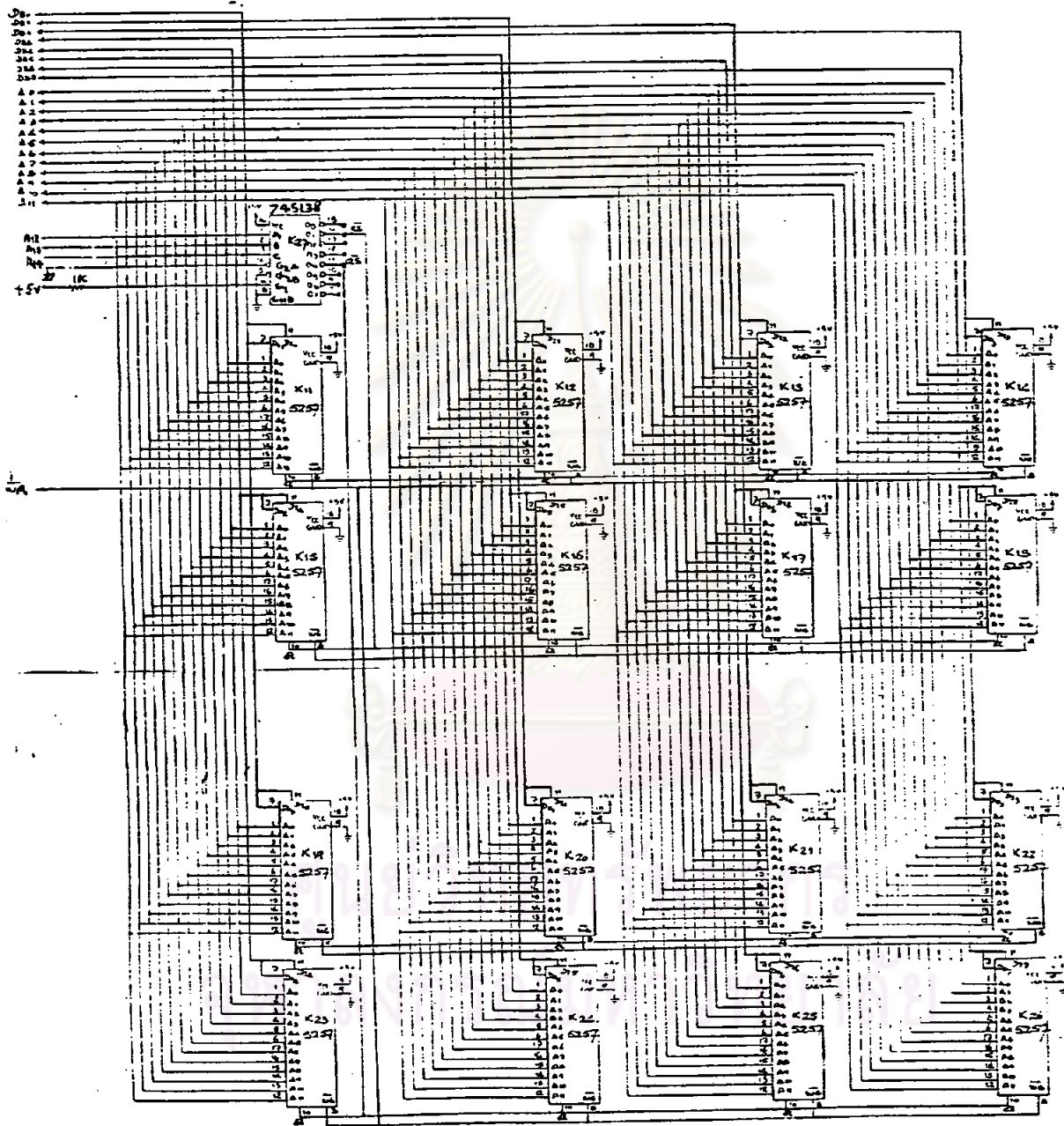
รูปที่ ๓.๓ วงจร EPROM 8K BYTE

ค) หน่วยความจำที่ทำหน้าที่เป็นตัวเก็บข้อมูลชั่วคราวที่ใช้กับเครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลข  
ขนาด 8K RAM รูป BLOCK DIAGRAM ในรูปที่ ค.๔ และวงจรจริงในรูปที่ ค.๕



รูปที่ ค.๔ BLOCK DIAGRAM วงจร RAM ขนาด 8KBYTE





รูปที่ ๓.๔ วงจร RAM 8K BYTE



ภาคผนวก ง

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



## TTL CHARACTERISTICS

### GLOSSARY

**Currents** — Positive current is defined as conventional current flow into a device. Negative current is defined as conventional current flow out of a device. All current limits are specified as absolute values.

- I<sub>CC</sub>**      **Supply Current** — The current flowing into the V<sub>CC</sub> supply terminal of a circuit with the specified input conditions and the outputs open. When not specified, input conditions are chosen to guarantee worst case operation.
- I<sub>IH</sub>**      **Input HIGH Current** — The current flowing into an input when a specified HIGH voltage is applied.
- I<sub>IL</sub>**      **Input LOW Current** — The current flowing out of an input when a specified LOW voltage is applied.
- I<sub>OH</sub>**      **Output HIGH Current** — The leakage current flowing into a turned off open-collector output with a specified HIGH output voltage applied. For an output with an internal pull-up circuit, the I<sub>OH</sub> is the current flowing out of the output when it is in the HIGH state.
- I<sub>OL</sub>**      **Output LOW Current** — The current flowing into an output when it is in the LOW state.
- I<sub>OS</sub>**      **Output Short Circuit Current** — The current flowing out of a HIGH-state output when that output is short circuited to ground (or other specified potential).
- I<sub>OZH</sub>**      **Output OFF Current HIGH** — The current flowing into a disabled 3-state output with a specified HIGH output voltage applied.
- I<sub>OZL</sub>**      **Output OFF Current LOW** — The current flowing out of a disabled 3-state output with a specified LOW output voltage applied.

**Voltages** — All voltages are referenced to the ground pin. Negative voltage limits are specified as absolute values (i.e., -10 V is greater than -1.0 V).

- V<sub>CC</sub>**      **Supply Voltage** — The range of power supply voltage over which the device is guaranteed to operate within the specified limits.
- V<sub>CD(Max)</sub>**      **Input Clamp Diode Voltage** — The most negative voltage at an input when a specified current is forced out of that input terminal. This parameter guarantees the integrity of the input diode, intended to clamp negative ringing at the input terminal.
- V<sub>IH</sub>**      **Input HIGH Voltage** — The range of input voltages that represents a logic HIGH in the system.
- V<sub>IH(Min)</sub>**      **Minimum Input HIGH Voltage** — The minimum allowed input HIGH in a logic system. This value represents the guaranteed input HIGH threshold for the device.
- V<sub>IL</sub>**      **Input LOW Voltage** — The range of input voltages that represents a logic LOW in the system.
- V<sub>IL(Max)</sub>**      **Maximum input LOW Voltage** — The maximum allowed input LOW in a system. This value represents the guaranteed input LOW threshold for the device.

## GLOSSARY (Cont'd)

- $V_{OH(Min)}$**  Output HIGH Voltage — The minimum voltage at an output terminal for the specified output current  $I_{OH}$  and at the minimum value of  $V_{CC}$ .
- $V_{OL(Max)}$**  Output LOW Voltage — The maximum voltage at an output terminal sinking the maximum specified load current  $I_{OL}$ .
- $V_{T+}$**  Positive-Going Threshold Voltage — The input voltage of a variable threshold device (i.e., Schmitt Trigger) that is interpreted as a  $V_{IH}$  as the input transition rises from below  $V_{T-(Min)}$ .
- $V_{T-}$**  Negative-Going Threshold Voltage — The input voltage of a variable threshold device (i.e., Schmitt Trigger) that is interpreted as a  $V_{IL}$  as the input transition falls from above  $V_{T+(Max)}$ .

## AC Switching Parameters

- $f_{max}$**  Toggle Frequency/Operating Frequency — The maximum rate at which clock pulses may be applied to a sequential circuit. Above this frequency the device may cease to function.
- $t_{PLH}$**  Propagation Delay Time — The time between the specified reference points, normally 1.5 V (1.3 V for LS) on the input and output voltage waveforms, with the output changing from the defined LOW level to the defined HIGH level.
- $t_{PHL}$**  Propagation Delay Time — The time between the specified reference points, normally 1.5 V (1.3 V for LS) on the input and output voltage waveforms, with the output changing from the defined HIGH level to the defined LOW level.
- $t_w$**  Pulse Width — The time between 1.5 V (1.3 V for LS) amplitude points on the leading and trailing edges of a pulse.
- $t_h$**  Hold Time — The interval immediately following the active transition of the timing pulse (usually the clock pulse) or following the transition of the control input to its latching level, during which interval the data to be recognized must be maintained at the input to ensure its continued recognition. A negative hold time indicates that the correct logic level may be released prior to the active transition of the timing pulse and still be recognized.
- $t_s$**  Setup Time — The interval immediately preceding the active transition of the timing pulse (usually the clock pulse) or preceding the transition of the control input to its latching level, during which interval the data to be recognized must be maintained at the input to ensure its recognition. A negative setup time indicates that the correct logic level may be initiated sometime after the active transition of the timing pulse and still be recognized.
- $t_{PHZ}$**  Output Disable Time (of a 3-State Output) from HIGH Level — The time between the 1.5 V (1.3 V for LS) level on the input and a voltage 0.5 V below the steady state output HIGH level with the 3-state output changing from the defined HIGH level to a high impedance (off) state.
- $t_{PLZ}$**  Output Disable Time (of a 3-State Output) from LOW Level — The time between the 1.5 V (1.3 V for LS) level on the input and a voltage 0.5 V above the steady state output LOW level with the 3-state output changing from the defined LOW level to a high impedance (off) state.
- $t_{PZH}$**  Output Enable Time (of a 3-State Output) to a HIGH Level — The time between the 1.5 V (1.3 V for LS) levels of the input and output voltage waveforms with the 3-state output changing from a high impedance (off) state to a HIGH level.

**GLOSSARY (Cont'd)**

**t<sub>PZL</sub>**      **Output Enable Time (of a 3-State Output) to a LOW Level** — The time between the 1.5 V (1.3 V for LS) levels of the input and output voltage waveforms with the 3-state output changing from a high impedance (off) state to a LOW level.

**t<sub>rec</sub>**      **Recovery Time** — The time between the 1.5 V (1.3 V for LS) level on the trailing edge of an asynchronous input control pulse and the same level on a synchronous input (clock) pulse such that the device will respond to the synchronous input.

**Miscellaneous**

**C**      Marking code letter indicating that the device is guaranteed to meet the specifications for the Commercial temperature range.

**D**      Package code letter for ceramic Dual In-line Packages.

**F**      Package code letter for ceramic flatpaks.

**M**      Marking code letter indicating that the device is guaranteed to meet the specifications for the Military temperature range.

**P**      Package code letter for plastic Dual In-line Packages.

**QB**      Marking code indicating in-house 38510, level B reliability screening (military grade only).

**QM, OR**      Marking code indicating Matrix VI commercial/Industrial reliability screening.

**XC, XM**      Shorthand for the commercial or military temperature range specifications or devices; the letter X stands for the code letter of any package in which the device is available.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## DEFINITION OF SYMBOLS AND TERMS — CMOS

**CURRENTS** — Positive current is defined as conventional current flow into a device. Negative current is defined as conventional current flow out of a device.

$I_{IN}$  — (Input Current) — The current flowing into a device at specified input voltage and  $V_{DD}$ .

$I_{OH}$  — (Output HIGH Current) — The drive current flowing out of the device at specified HIGH output voltage and  $V_{DD}$ .

$I_{OL}$  — (Output LOW Current) — The drive current flowing into the device at specified LOW output voltage and  $V_{DD}$ .

$I_{DD}$  — (Quiescent Power Supply Current) — The current flowing into the  $V_{DD}$  lead at specified input and  $V_{DD}$  conditions.

$I_{OZH}$  — (Output OFF Current HIGH) — The leakage current flowing into the output of a 3-state device in the "OFF" state at a specified HIGH output voltage and  $V_{DD}$ .

$I_{OZL}$  — (Output OFF Current LOW) — The leakage current flowing out of a 3-state device in the "OFF" state at a specified HIGH output voltage and  $V_{DD}$ .

$I_{IL}$  — (Input Current LOW) — The current flowing into a device at a specified LOW level input voltage and a specified  $V_{DD}$ .

$I_{IH}$  — (Input Current HIGH) — The current flowing into a device at a specified HIGH level input voltage and a specified  $V_{DD}$ .

$I_{DDL}$  — (Quiescent Power Supply Current LOW) — The current flowing into the  $V_{DD}$  lead with a specified LOW level input voltage on all inputs and specified  $V_{DD}$  conditions.

$I_{DDH}$  — (Quiescent Power Supply Current HIGH) — The current flowing into the  $V_{DD}$  lead with a specified HIGH level input voltage on all inputs and specified  $V_{DD}$  conditions.

$I_Z$  — (OFF State Leakage Current) — The leakage current flowing into the output of a 3-state device in the "OFF" state at a specified output voltage and  $V_{DD}$ .

**VOLTAGES** — All voltages are referenced to  $V_{SS}$  (or  $V_{EE}$ ) which is the most negative potential applied to the device.

$V_{DD}$  — (Drain Voltage) — The most positive potential on the device.

$V_{IH}$  — (Input HIGH Voltage) — The range of input voltages that represents a logic HIGH level in the system.

$V_{IL}$  — (Input LOW Voltage) — The range of input voltages that represents a logic LOW level in the system.

$V_{IH}(\min)$  — (Minimum Input HIGH Voltage) — The minimum allowed input HIGH level in a logic system.

$V_{IL}(\max)$  — (Maximum Input LOW Voltage) — The maximum allowed input LOW level in a system.

$V_{OH}$  — (Output HIGH Voltage) — The range of voltages at an output terminal with specified output loading and supply voltage. Device inputs are conditioned to establish a HIGH level at the output.

$V_{OL}$  — (Output LOW Voltage) — The range of voltages at an output terminal with specified output loading and supply voltage. Device inputs are conditioned to establish a LOW level at the output.

$V_{SS}$  — (Source Voltage) — For a device with a single negative power supply, the most negative power supply, used as the reference level for other voltages. Typically ground.

$V_{EE}$  — (Source Voltage) — One of two ( $V_{SS}$  and  $V_{EE}$ ) negative power supplies. For a device with dual negative power supplies, the most negative power supply used as a reference level for other voltages.

### ANALOG TERMS

$R_{ON}$  — (ON Resistance) — The effective "ON" state resistance of an analog transmission gate, at specified input voltage, output load and  $V_{DD}$ .

$\Delta R_{ON}$  — ("Δ" ON Resistance) — The difference in effective "ON" resistance between any two transmission gates of an analog device at specified input voltage, output load and  $V_{DD}$ .

**AC SWITCHING PARAMETERS**

**$t_{MAX}$**  — (Toggle Frequency/Operating Frequency) — The maximum rate at which clock pulses may be applied to a sequential circuit with the output of the circuit changing between 10% of  $V_{DD}$  and 90% of  $V_{DD}$ . Above this frequency the device may cease to function. See Figure 7-15.

**$t_{PLH}$**  — (Propagation Delay Time) — The time between the specified reference points, normally 50% points on the input and output voltage waveforms, with the output changing from the defined LOW level to the defined HIGH level. See Figure 7-14.

**$t_{PHL}$**  — (Propagation Delay Time) — The time between the specified reference points, normally 50% points on the input and output voltage waveforms, with the output changing from the defined HIGH level to the defined LOW level. See Figure 7-14.

**$t_{TLH}$**  — (Transition Time, LOW to HIGH) — The time between two specified reference points on a waveform, normally 10% to 90% of  $V_{DD}$ , which is changing from LOW to HIGH. See Figure 7-14.

**$t_{THL}$**  — (Transition Time, HIGH to LOW) — The time between two specified reference points on a waveform, normally 90% to 10% of  $V_{DD}$ , which is changing from HIGH to LOW. See Figure 7-14.

**$t_w$**  — (Pulse Width) — The time between 50% amplitude points on the leading and trailing edges of pulse.

**$t_h$**  — (Hold Time) — The interval immediately following the active transition of the timing pulse (usually the clock pulse) or following the transition of the control input to its latching level, during which interval the data to be recognized must be maintained at the input to ensure its continued recognition. A negative hold time indicates that the correct logic level may be released prior to the active transition of the timing pulse and still be recognized.

**$t_s$**  — (Set-up Time) — The interval immediately preceding the active transition of the timing pulse (usually the clock pulse) or preceding the transition of the control input to its latching level, during which interval the data to be recognized must be maintained at the input to ensure its recognition. A negative set-up time indicates that the correct logic level may be initiated sometime after the active transition of the timing pulse and still be recognized.

**$t_{PHZ}$**  — (3-State Output Disable Time, HIGH to Z) — The time between the specified reference points, normally the 50% point on the Output Enable input voltage waveform and a point representing a 0.1  $V_{DD}$  drop on the Output voltage waveform of a 3-state device, with the output changing from the defined HIGH level to a high impedance OFF state.

**$t_{PLZ}$**  — (3-State Output Disable Time, LOW to Z) — The time between the specified reference points, normally the 50% point on the Output Enable input voltage waveform and a point representing a 0.1  $V_{DD}$  rise on the Output voltage waveform of a 3-state device, with the output changing from the defined LOW level to a high impedance OFF state.

**$t_{PZH}$**  — (3-State Output Enable Time, Z to HIGH) — The time between the specified reference points, normally the 50% point on the Output Enable input voltage waveform and a point representing 0.5  $V_{DD}$  on the Output voltage waveform of a 3-state device, with the output changing from a high impedance OFF state to the defined HIGH level.

**$t_{PZL}$**  — (3-State Output Enable Time, Z to LOW) — The time between the specified reference points, normally the 50% point on the Output Enable input voltage waveform and a point representing 0.5  $V_{DD}$  on the Output voltage waveform of a 3-state device, with the output changing from a high impedance OFF state to the defined LOW level.

**$t_{rec}$**  — (Recovery Time) — The time between the end of an overriding asynchronous input, typically a Clear or Reset input, and the earliest allowable beginning of a synchronous control input, typically a Clock input, normally measured at 50% points on both input voltage waveforms.

**$t_{CW}$**  (Clock Period) — The time between 50% amplitude points on the leading edges of a clock pulse.

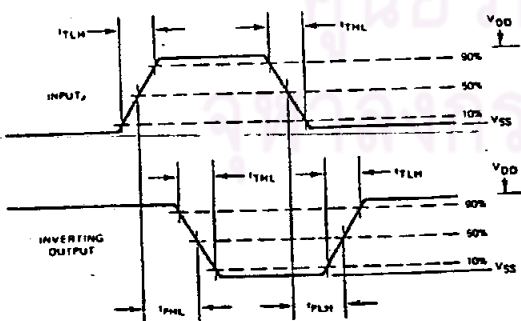


Fig. 7-14. Propagation Delay, Transition Time

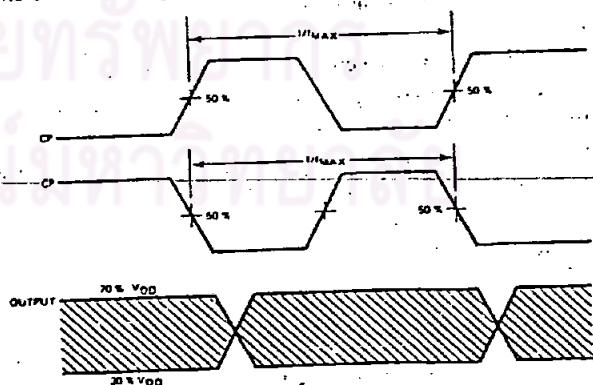


Fig. 7-15. Maximum Operating Frequency

ประวัติ

นายสุนทร วาสนา เกิดวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๔ เกิดที่ ๔/๑ ถนนพิชัย  
อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร จบการศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี จาก  
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ปี ๒๕๒๐

ขณะนี้ทำงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย กองเทเล็กซ์ แผนกวางแผน  
ตำแหน่ง นายช่างโทรคมนาคม ระดับ ๔



ศูนย์วิทยบริการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย